

## บทที่ 4

### ผลการทดลองและการอภิปรายผลการทดลอง

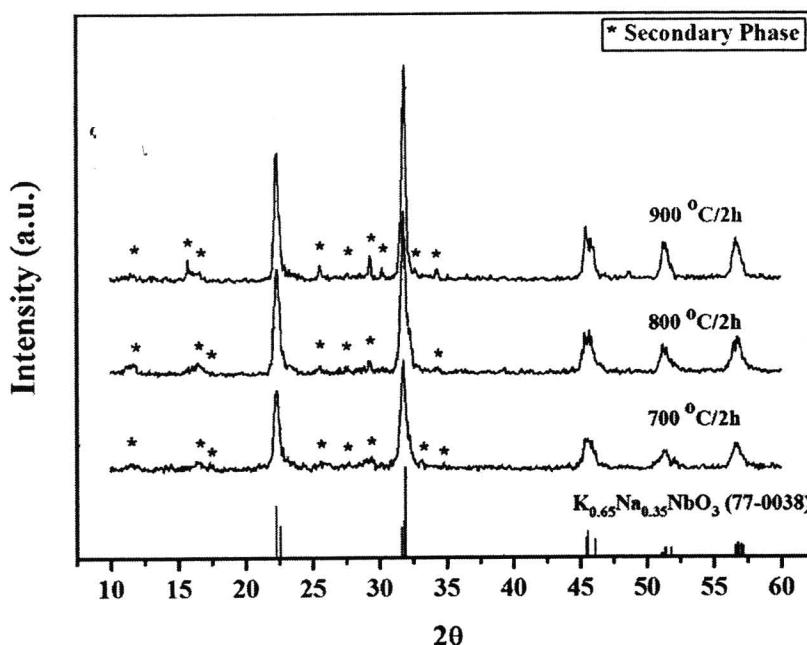
สำหรับในงานวิจัยนี้ได้แสดงผลการทดลองเป็นสามส่วนใหญ่ๆ คือ การเตรียมสารตั้งต้น โพแทสเซียม โซเดียม ในโอบเด็ดด้วยวิธีการผสมออกไซด์แบบดั้งเดิม (conventional mixed oxide method) การเตรียมแก้ว โพแทสเซียม โซเดียม ในโอบเด็ดในระบบซิลิกเกตด้วยวิธีการอินคอร์ปอเรชัน (incorporation) และการปลูกหลักของแก้วเซรามิก โพแทสเซียม โซเดียม ในโอบเด็ด โดยกระบวนการหุงความร้อน (heat treatment) จากนั้นจึงนำขึ้นงานไปวิเคราะห์องค์ประกอบเฟส วิเคราะห์สมบัติ หุงความร้อน สมบัติทั่วไปของภาพ สมบัติทางสเปกตรอสโคปี โครงสร้างทางจุลภาค ตลอดจนศึกษา สมบัติทางไฟฟ้า อาทิเช่น สมบัติทางไอดิเอล็กทริก และสมบัติเฟอร์โรอิเล็กทริก เป็นต้น

#### 4.1 การเตรียมสารตั้งต้นโพแทสเซียม โซเดียม ในโอบเด็ด

การเตรียมสาร โพแทสเซียม โซเดียม ในโอบเด็ดหรือ KNN ทำได้โดยกระบวนการผสมแบบ ออกไซด์แบบดั้งเดิม (conventional mixed oxide method) โดยการเลือกใช้สารตั้งต้นดังต่อไปนี้คือ โซเดียมคาร์บอนเนตหรือ  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  (Riedel-de Haen, 99.9%) โพแทสเซียมคาร์บอนเนตหรือ  $\text{K}_2\text{CO}_3$  (Sigma-Aldrich, 99.9%) และในโอบเด็ดออกไซด์หรือ  $\text{Nb}_2\text{O}_5$  (Sigma-Aldrich, 99.9%) มาผสม กันเป็นสัดส่วนที่ได้คำนวณไว้ในบทที่ 3 จากนั้นจึงนำผงของสารตั้งต้นที่ซึ่งผสมกันด้วยเทคนิคการบดเปียกด้วยลูกบดเซอร์โคลนี่ย (ball milling) เป็นระยะเวลา 24 ชั่วโมง ในสารละลายน้ำอะซีโตน โดยใช้พานะบรรจุคือขวด โพลีเอทธิลีน หมุนนานเป็นระยะเวลา 24 ชั่วโมง ด้วยการคนด้วยแท่งแม่เหล็ก (magnetic bar) พร้อมให้ความร้อน เพื่อกำจัดสารละลายน้ำอะซีโตนออก แล้วจึงนำมาอบให้แห้งเป็นระยะเวลา 24 ชั่วโมง นำผงที่แห้งดีแล้วมาบดด้วยโกร่งบดสาร โดยระนัดระวังเรื่องของความชื้นเป็นพิเศษ จากนั้นจึงนำไปเคลือบโซเดียมที่อุณหภูมิ 600 - 900 องศาเซลเซียสเป็นเวลานาน 2 และ 4 ชั่วโมง ด้วยอัตราการเพิ่มและลดของอุณหภูมิเท่ากับ 100 และ 300 องศาเซลเซียสต่อชั่วโมง ตามลำดับ แล้วจึงนำไปตรวจสอบองค์ประกอบของเฟสด้วยเทคนิคการกระจายของรังสีเอกซ์ (X-ray diffraction, XRD) และโครงสร้างทางจุลภาคด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่อง粒ด ชนิดที่อาศัยการปลดปล่อยอิเล็กตรอนเนื่องจากสนาม (Field emission scanning electron microscope, FESEM) โดยจะได้กล่าวรายละเอียดในส่วนถัดไป

#### 4.1.1. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเฟสด้วยเทคนิค XRD

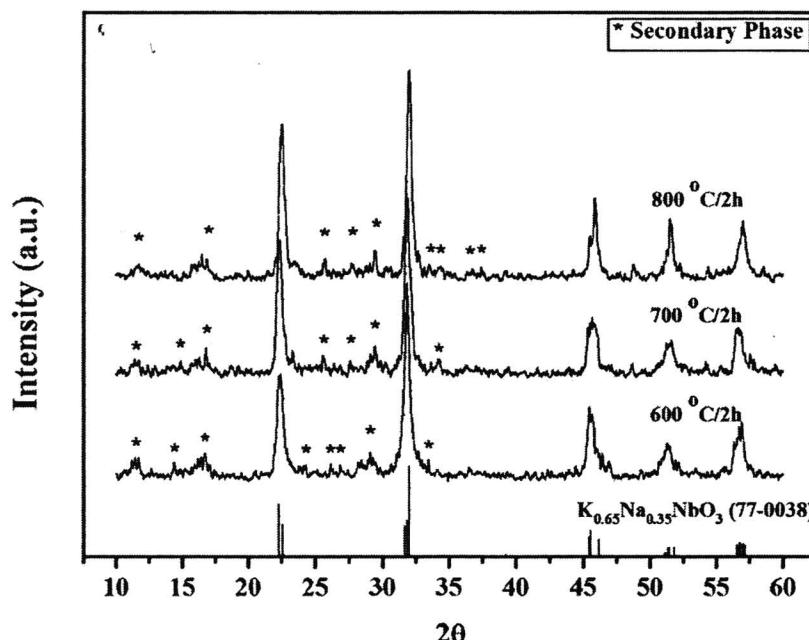
จากการวิเคราะห์องค์ประกอบที่เตรียมได้ด้วยเทคนิคการเลือยวาเบนของรังสีเอกซ์ (X-ray diffractometer, XRD) ทำให้ทราบว่าการควบคุมความชื้นและอัตราส่วนของสารจะส่งผลอย่างมากต่อความบริสุทธิ์ของสารที่ได้ ในช่วงแรกของการทดลองนั้นการเตรียมผงโพแทสเซียมโซเดียมในโอเบตหรือ KNN มักจะเกิดเฟสที่ไม่ต้องการแทรกในโครงสร้างค่อนข้างมาก ผลการทดลองที่ได้เป็นดังรูปที่ 4.1



รูปที่ 4.1 กราฟแสดงรูปแบบการเลือยวาเบนของรังสีเอกซ์ของสารโซเดียมโพแทสเซียมในโอเบตที่ผ่านการเผาแคลไชน์ที่อุณหภูมิแตกต่างกัน (\*) แสดงเฟสลำดับที่สอง

กราฟที่ได้จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเฟสด้วยเทคนิค XRD ของผงโพแทสเซียมโซเดียมในโอเบตที่เตรียมได้เปรียบเทียบกับมาตรฐาน JCPDF หมายเลข 77-0038 ซึ่งเป็นเฟสองค์ประกอบของ K<sub>0.65</sub>Na<sub>0.35</sub>NbO<sub>3</sub> พบว่าสารตั้งต้นที่เตรียมได้นั้นเกิดเฟสหลักคือเฟสของ K<sub>0.65</sub>Na<sub>0.35</sub>NbO<sub>3</sub> แทรกกับเฟสลำดับที่สอง (เฟสปนเปื้อน) อยู่ ทั้งนี้การเกิดเฟสลำดับที่สองหรือลักษณะที่ไม่เป็นปริมาณสัมพันธ์ (non-stoichiometry) ในขณะทำการเผาแคลไชน์มีสาเหตุเนื่องมาจากการสูญเสียของโซเดียมหรือโพแทสเซียมที่ทำปฏิกิริยากับความชื้นได้ง่ายในขณะเตรียม นอกจากนี้ยังพบว่าความเป็นผลลัพธ์และเฟสปนเปื้อนเหล่านี้จะชัดเจนขึ้นเมื่ออุณหภูมิที่ใช้ในการเผาแคลไชน์เพิ่มสูงขึ้น ดังเช่นชั้นงานที่เคลไชน์อุณหภูมิ 900 องศาเซลเซียส ในรูป 4.1 เป็นต้น

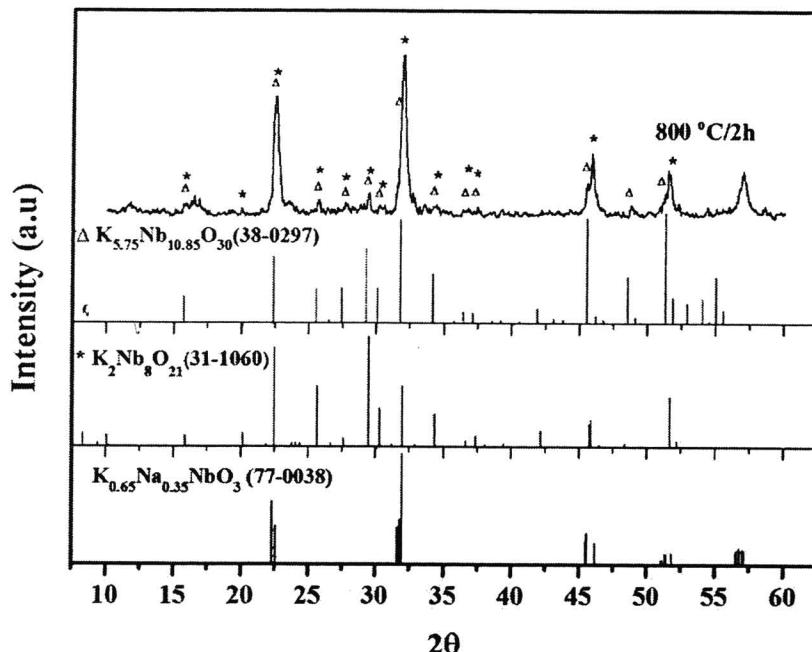
จากนั้นจึงทำการเตรียมสารโพแทสเซียมโซเดียมในโอบตใหม่ ซึ่งเพิ่มความรอนคอบในกระบวนการเตรียมสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการระมัดระวังเรื่องการควบคุมความชื้นในสาร และเนื่องจากผลที่ได้จากการศึกษาของคู่ประกอบเฟสด้วยเทคนิค XRD ดังในรูปที่ 4.1 พบว่าที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียสสามารถเกิดโครงสร้างของเฟสโพแทสเซียมโซเดียมในโอบตได้ จึงทำการทดลองต่อมาเลือกที่จะใช้ช่วงของอุณหภูมิการเผาแคลไชน์ที่ต่ำลง ได้ ซึ่งช่วงอุณหภูมิที่จะเลือกทำการศึกษาต่อไปคือ 600 700 และ 800 องศาเซลเซียส อันเป็นช่วงอุณหภูมิที่มีความน่าจะเป็นของการเกิดสารโพแทสเซียมโซเดียมในโอบตมากที่สุด และผล XRD ที่ได้จากการเผาแคลไชน์สารโพแทสเซียมโซเดียมในโอบตที่ทำการเตรียมใหม่นี้เป็นไปดังรูปที่ 4.2



รูปที่ 4.2 กราฟแสดงรูปแบบการเติบโตของรังสีเอกซ์ของสารโพแทสเซียมโซเดียมในโอบตที่ผ่านการเผาแคลไชน์ที่อุณหภูมิ 600 700 และ 800 องศาเซลเซียส ตามลำดับ (\*) แสดงเฟสลำดับที่สองเทียบกับ JCPDF หมายเลข 77-0038 ซึ่งเป็นเฟสของคู่ประกอบของ  $K_{0.65}Na_{0.35}NbO_3$

จากรูปที่ 4.2 จะเห็นได้ว่าพิกต์ที่ได้ขึ้นคงมีลักษณะคล้ายกับพิกต์ของรูปที่ 1 คือเกิดเฟสแปลกกลอมอยู่และอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นก็ทำให้ความเป็นผลึกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเข่นกัน ทำให้ทราบว่าความชื้นของสารตั้งต้นที่ทำให้การซึ้งสารไม่ตรงกับผลคำนวณปริมาณสารจากสมการ (non-stoichiometry) ไม่ได้เป็นสาเหตุหลักของการเกิดเฟสลำดับที่สอง จากการเปรียบเทียบกับมาตรฐาน

JCPDF ทำให้ทราบว่าเฟสลำดับที่สองที่เกิดขึ้นเป็นเฟสของ โพแทสเซียม ในโอเบต คือ  $K_{5.75}Nb_{10.85}O_{30}$ ,  $K_2Nb_8O_{21}$  และ  $K_{0.65}Na_{0.35}NbO_3$  ที่เกิดขึ้นพร้อมกับเฟสของ โพแทสเซียม โซเดียม-ในโอเบต ดังที่ปรากฏในรูปที่ 4.3



รูปที่ 4.3 กราฟแสดงรูปแบบการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ของ โพแทสเซียม โซเดียม ในโอเบต ( $K_{0.65}Na_{0.35}NbO_3$ ) ที่ผ่านการเผาแคลไชน์ที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส เปรียบเทียบกับ  $K_{5.75}Nb_{10.85}O_{30}$ ,  $K_2Nb_8O_{21}$  และ  $K_{0.65}Na_{0.35}NbO_3$

จากปัญหาที่เกิดจึงทำให้มีความพยายามทำการศึกษาเพิ่มเติมจากการรายงานต่างๆ [42,43] ทำให้ทราบว่าจากความคลาดเคลื่อนทางด้านปริมาณสารสัมพันธ์ (non-stoichiometry) เพียงเล็กน้อย ก็สามารถทำให้เกิดเฟสลำดับที่สอง ได้ง่าย เฟสลำดับที่สองนี้ได้แก่ เฟสของ โพแทสเซียม ในโอเบต ( $KNbO_3$ ) ที่เกิด ได้ง่ายกว่า เฟสของ โพแทสเซียม โซเดียม ในโอเบต เนื่องจากเฟสนี้มีความเสถียรกว่า และสามารถเกิดได้หลายอัตราส่วน การสรุปสาเหตุของการคลาดเคลื่อนทางด้านปริมาณสาร สัมพันธ์ ที่ทำให้ โพแทสเซียม โซเดียม ในโอเบต ไม่เป็นปริมาณสารสัมพันธ์มีดังนี้

- สารตั้งต้นที่เป็นสารประคอนอัลคาไลน์คาร์บอนเนต ได้แก่  $K_2CO_3$  และ  $Na_2CO_3$  เป็นสาร ที่มีความไวต่อความชื้นในอากาศสูงทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนของปริมาณสาร สัมพันธ์ (stoichiometry)

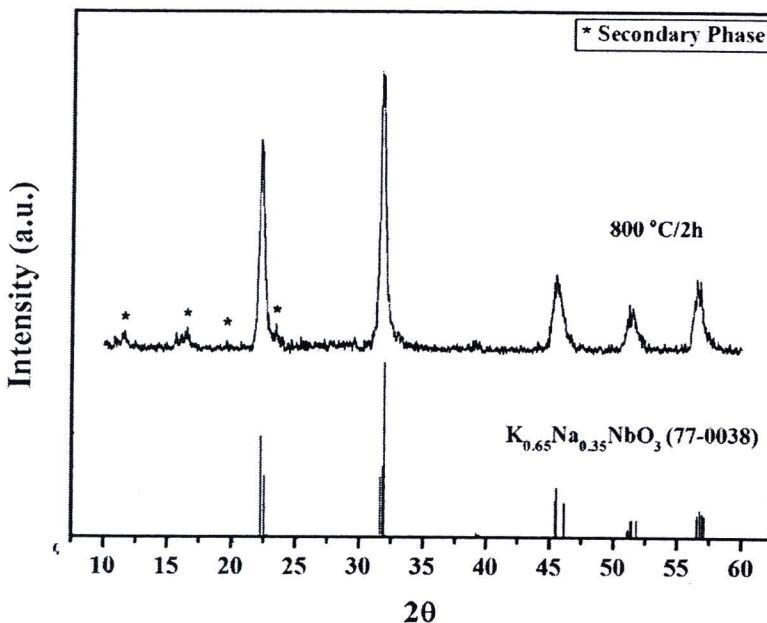
2. การระเบยของสารประกอบอัลคาไลน์คาร์บอนเนตในกระบวนการเผาแคลไซซ์นที่อุณหภูมิสูงเพื่อให้เกิดปฏิกิริยาสถานะของแข็งทำให้เกิดความคงคลาดเคลื่อนของปริมาณสารสัมพันธ์ได้ เช่นกัน

จากทั้งสองสาเหตุทำให้การเตรียมสารประกอบออกไซด์โพแทสเซียมโซเดียมในโอเบตด้วยกรรมวิธีการเผาแบบปฏิกิริยาสถานะของแข็งแบบดั้งเดิมหรือแคลไซซ์นไม่มีความบริสุทธิ์สูงนั้นทำได้ยาก อย่างไรก็ตามยังมีรายงานหลายรายงานที่เลือกทำการเติมสารประกอบอัลคาไลน์คาร์บอนเนตเกิน (excess) ในสัดส่วนร้อยละ 0.1 – 5 โดยโนล ก่อนการเผาแคลไซซ์น ก็สามารถเตรียมโพแทสเซียมโซเดียมในโอเบตที่มีความบริสุทธิ์ได้ดังที่ได้รายงานไว้ใน Egerton และคณะ [15] กับ Bomlai และคณะ [42]

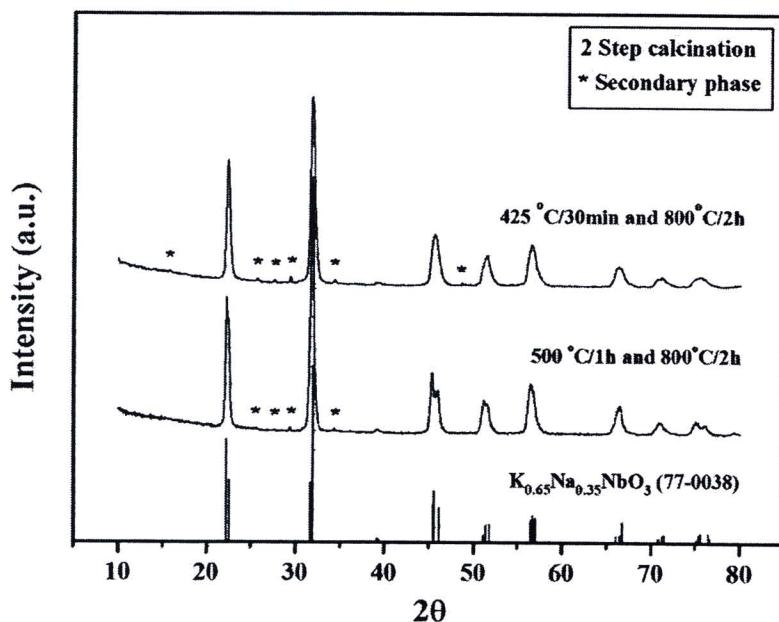
จากรายงานของ ภาคภูมิ และคณะ [6] ได้ศึกษาการเตรียมสารประกอบออกไซด์โพแทสเซียมโซเดียมในโอเบตด้วยเผาแคลไซซ์น พบว่าสามารถเตรียมสารที่มีความบริสุทธิ์ได้ เช่นกันโดยที่ไม่ต้องทำการเติมสารประกอบอัลคาไลน์คาร์บอนเนตเกิน อย่างไรก็ตาม จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการควบคุมเรื่องความชื้นในทุกขั้นตอนของการเตรียม และอุณหภูมิที่ใช้เผาแคลไซซ์นกีวีคือ 700-800 องศาเซลเซียส จากข้อมูลดังกล่าวจึงได้พิจารณาเตรียมสารประกอบออกไซด์โพแทสเซียม-โซเดียมในโอเบตอีกรึ่ง โดยในครั้งนี้การเตรียมสารตั้งต้นทั้งในขั้นตอนก่อนการซั่งและก่อนการเผาแคลไซซ์นจะผ่านการอบในตู้อบเพื่อกำจัดความชื้นทุกครั้ง จากการเตรียมพบว่าสารประกอบออกไซด์โพแทสเซียมโซเดียมในโอเบตที่เตรียมได้นั้นมีความบริสุทธิ์เพิ่มสูงขึ้น แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ก็ยังเกิดเฟสลำดับสองอยู่เล็กน้อย ดังภาพในรูปที่ 4.4

สำหรับการเผาแคลไซซ์นแบบสองขั้นตอน ได้เลือกเผาที่อุณหภูมิที่ 425 และ 500 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 30 นาที และ 1 ชั่วโมงตามลำดับ อุณหภูมิสุดท้ายที่เลือกใช้คือ 800 องศาเซลเซียสแข่นาน 2 ชั่วโมง ผลที่ปรากฏคือกราฟที่ได้มีความเรียบขึ้น และเกิดลักษณะขององค์ประกอบโพแทสเซียมโซเดียมในโอเบต ดังรูป 4.5 อย่างไรก็ตาม ยังพบพิคแทรกของเฟสโพแทสเซียมในโอเบตแทรกอยู่ แต่มีปริมาณที่ลดน้อยลง

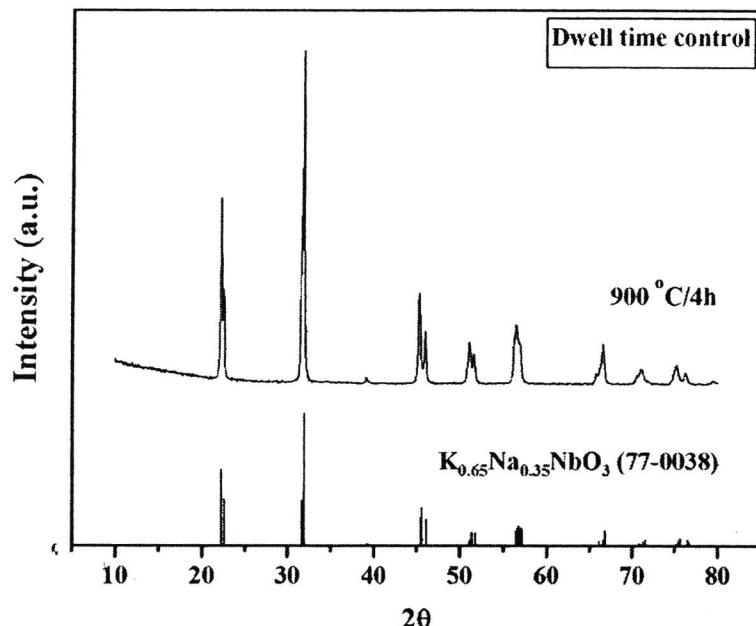
ผลของการเพิ่มระยะเวลาในการเผาโพแทสเซียมโซเดียมในโอเบตนั้น เป็นที่น่าพอใจ โดยการเลือกใช้อุณหภูมิ 900 องศาเซลเซียสแข่นาน 4 ชั่วโมง จะให้กราฟของโพแทสเซียมโซเดียมในโอเบตที่มีความบริสุทธิ์และมีความเป็นผลึกสูง ผลที่ได้แสดงได้ดังรูป 4.6



รูปที่ 4.4 แสดงรูปแบบการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ของสารประกอบออกไซด์โพแทสเซียมโซเดียม-ไนโตรบัตที่ผ่านการเผาแคลไชน์ที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส เทียบกับ JCPDF หมายเลข 77-0038 ซึ่งเป็นเฟสสองค์ประกอบของ  $\text{K}_{0.65}\text{Na}_{0.35}\text{NbO}_3$



รูปที่ 4.5 แสดงรูปแบบการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ของสารประกอบออกไซด์โพแทสเซียมโซเดียม-ไนโตรบัตที่ผ่านการเผาแคลไชน์ที่อุณหภูมิ 425 และ 500 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 30 นาที และ 1 ชั่วโมงตามลำดับ และ อุณหภูมิสุดท้ายที่เลือกใช้คือ 800 องศาเซลเซียสแซ่นาน 2 ชั่วโมงเทียบกับ JCPDF หมายเลข 77-0038 หรือเฟสสองค์ประกอบของ  $\text{K}_{0.65}\text{Na}_{0.35}\text{NbO}_3$

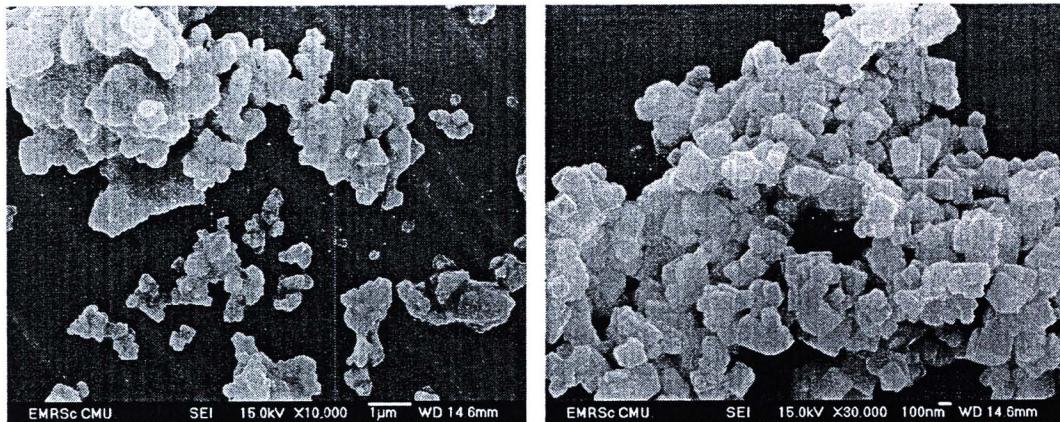


รูปที่ 4.6 แสดงรูปแบบการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ของสารประกอบออกไซด์โพแทสเซียมโซเดียม ในโอเบตที่ผ่านการเผาแคลไชน์ที่อุณหภูมิ 900 องศาเซลเซียสแซ่นาน 4 ชั่วโมง

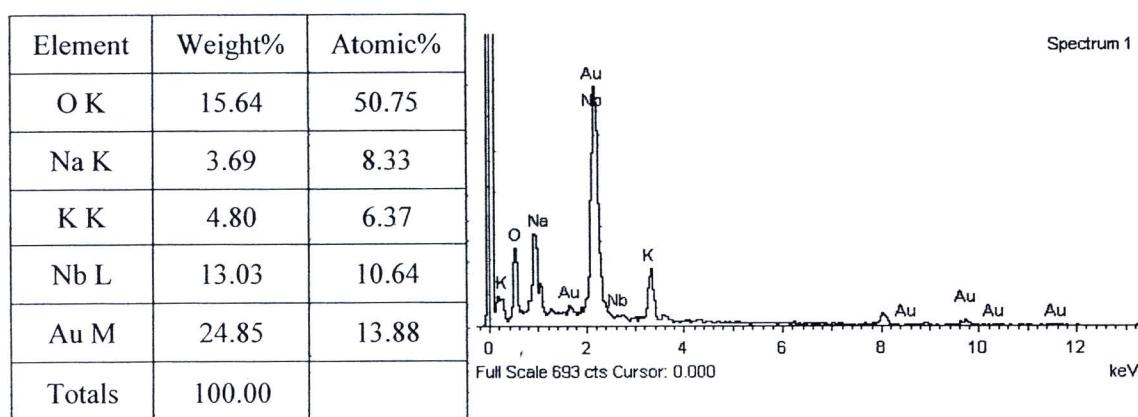
ผลจากภาพจะพบว่ากราฟของ โพแทสเซียมโซเดียม ในโอเบตที่ได้มีความบริสุทธิ์ และจะเกิดขึ้นได้ดีหากมีการควบคุมระยะเวลาในการเผา เช่น อุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการเตรียม โพแทสเซียมโซเดียม ในโอเบตที่จะเลือกใช้ในการเตรียมแก้วเซรามิกในรายงานนี้คือการแคลไชน์ที่ อุณหภูมิ 900 องศาเซลเซียสแซ่นเป็นระยะเวลานาน 4 ชั่วโมง ผลการทดลองที่ได้นี้สอดคล้องกับ งานวิจัยของ Hongliang Du (2006) [49] ที่ได้เลือกศึกษาการเตรียม โพแทสเซียมโซเดียม ใน- โอเบต โดยควบคุมอุณหภูมิและความดันในการเผาจนกว่าที่มีต่อสมบัติทางเพิยโซอิเล็กทริก บางส่วน ของการทดลองกล่าวว่า สามารถเตรียม โพแทสเซียมโซเดียม ในโอเบตที่มีความบริสุทธิ์ได้ด้วยการเผาที่ อุณหภูมิ 900 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 5 ชั่วโมง ซึ่งจากการทดลองที่ได้เพิ่มอุณหภูมิและ ระยะเวลาในการแคลไชน์ พบว่าสามารถเตรียม โพแทสเซียมโซเดียม ในโอเบตที่มีความบริสุทธิ์ได้ โดยอุณหภูมิที่ 900 องศาเซลเซียสนานระยะเวลา 4 ชั่วโมงก็สามารถเตรียม โพแทสเซียมโซเดียม- ในโอเบตที่มีความบริสุทธิ์ได้เช่นกัน

สำหรับการนำผงดังกล่าวไปใช้ในการเตรียมแก้วเซรามิก โพแทสเซียมโซเดียม ในโอเบต นอกจากจะทำการศึกษาผงที่มีความบริสุทธิ์แล้ว ก็ยังได้เลือกชุดผงที่ไม่บริสุทธิ์ไปใช้ในการศึกษา เบรเยินเทียนผลกัน เพื่อตรวจสอบว่าชุดแก้วที่มีความแตกต่างกันดังกล่าวจะให้คุณสมบัติที่แตกต่าง กันอย่างไร

#### 4.1.2 ผลการศึกษาสัมฐานวิทยาของผงโพแทสเซียมโซเดียมในโอเบต ที่ได้จากการเผาเคลือบในอุณหภูมิ $900^{\circ}\text{C}$ นาน 4 ชั่วโมง โดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด ในรูปที่ 4.7 พบว่าอนุภาคของโพแทสเซียมโซเดียมในโอเบตมีลักษณะเป็นสีเหลือง มีขนาดของผงอยู่ในระดับ 0.5 ไมโครเมตรเล็กไปจนถึงระดับ 200 นาโนเมตร และจากการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค EDS สามารถตรวจพบธาตุองค์ประกอบของผงโพแทสเซียมโซเดียมในโอเบต คือธาตุ K, Na, Nb และ O ในปริมาณร้อยละ 4.8, 3.69, 13.03 และ 50.75 โดยนำหนักตามลำดับ ดังที่แสดงในรูป 4.8



รูปที่ 4.7 รูปแสดงสัมฐานวิทยาของผงโพแทสเซียมโซเดียมในโอเบต ที่ได้จากการเผาเคลือบในอุณหภูมิ  $900^{\circ}\text{C}$  นาน 4 ชั่วโมง



รูปที่ 4.8 ข้อมูลการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค EDS ในผงโพแทสเซียมโซเดียมในโอเบต ที่ได้จากการเผาเคลือบในอุณหภูมิ  $900^{\circ}\text{C}$  นาน 4 ชั่วโมง

## 4.2 ผลการศึกษาเตรียมแก้วโพแทสเซียมโซเดียมในโอเบต

ในการเตรียมแก้วเซรามิกนั้น ทำได้โดยการนำผงโพแทสเซียมโซเดียมในโอเบตที่มีความบริสุทธิ์และไม่บริสุทธิ์มาใช้ในการสร้างแก้วฐาน โดยผงที่ได้จะถูกนำไปผสมกับซิลิกาในอัตราส่วนร้อยละ 75 โดยโมลของโพแทสเซียมโซเดียมในโอเบตต่อร้อยละ 25 โดยโมลของซิลิกา และอัตราส่วนร้อยละ 80 โดยโมลของโพแทสเซียมโซเดียมในโอเบตต่อร้อยละ 20 โดยโมลของซิลิกา สัดส่วนของการเตรียมแสดงให้เห็นดังตารางที่ 4.1 จากนั้นนำไปหลอมเหลวที่อุณหภูมิ 1300 องศาเซลเซียสเป็นระยะเวลานาน 15 นาที ด้วยอัตราเขี้นของอุณหภูมิคือ 10 องศาเซลเซียสต่อนาที ในเบ้าหลอมทองคำขาวหรือถ้วยแพลตินัม (platinum crucible) และทำให้เย็นตัวลงอย่างรวดเร็ว ด้วยการเทลงบนแม่พิมพ์โลหะแต่นเลสและทับทันที่ที่อุณหภูมิห้อง จากนั้นเมื่อได้ชิ้นงานแก้วเซรามิกที่ต้องการแล้วจึงนำไปบดเป็นผงเพื่อนำไป วิเคราะห์เฟสองค์ประกอบด้วย XRD หากว่าหนาแน่นของชิ้นงานด้วยหลักการแทนที่นำของอาร์คิมีดีส การตรวจสอบสมบัติทางสเปกโตรสโคปีด้วยครึ่งวิเคราะห์รaman (Raman spectroscopy) เพื่อหาเงื่อนไขที่เหมาะสมในการเตรียมแก้วเซรามิก  $\text{Na}_{0.5}\text{K}_{0.5}\text{NbO}_3$  ต่อไป

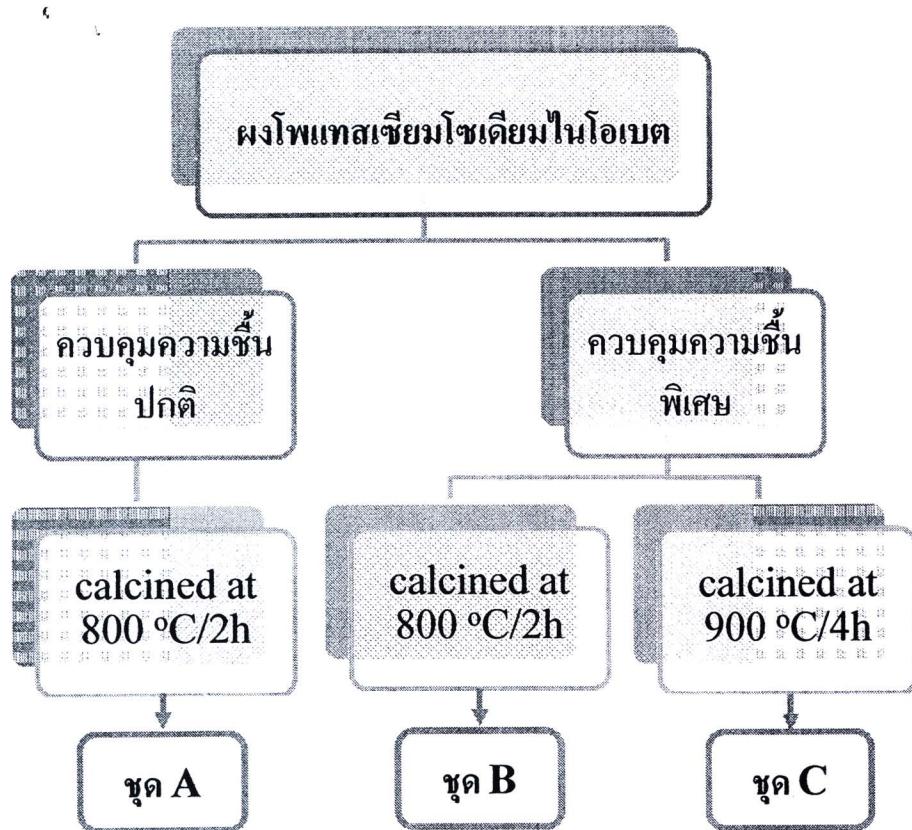
ตารางที่ 4.1 ปริมาณอัตราส่วนระหว่าง KNN และ  $\text{SiO}_2$  ที่ใช้ในการเตรียมแก้วแต่ละชุด

อัตราส่วนระหว่าง KNN : $\text{SiO}_2$ (mole%) จำนวน 15 กรัม	75 : 25	80 : 20
KNN	13.4355	13.7955
$\text{SiO}_2$	1.5645	1.2045
รวม	15	15

### 4.2.1 ผลการตรวจสอบลักษณะทางกายภาพ

สำหรับชุดของแก้วที่เลือกศึกษาสามารถแบ่งได้เป็น 3 ชุดเงื่อนไขหลักแบ่งตามการเตรียมผงโพแทสเซียมโซเดียมในโอเบต โดยชุดที่ 1 (A) คือชุดแก้วที่ได้จากการเตรียมในโอเบตที่มีความไม่บริสุทธิ์สูง ชุดที่ 2 (B) คือชุดแก้วที่ได้จากการเตรียมในโอเบตที่มีสิ่งเจือปนเพียงเล็กน้อย และชุดที่ 3 (C) คือชุดแก้วที่ได้จากการเตรียมในโอเบตที่มีความบริสุทธิ์สูง แสดงคงทนภาพในรูป 4.9 จากภาพชุดการทดลองทั้งสามที่แตกต่างกันในเรื่องของการเตรียมสารตั้งต้นและกระบวนการทางความร้อน จะให้ระบบแก้วที่มีความแตกต่างกันนั้น

คือ ชุด A ชุด B และชุด C อย่างไรก็ตาม ในการเตรียมแก้วแต่ละครั้งนอกจากจะเกิดไฟฟ้าที่แตกต่างกันเนื่องจากความบริสุทธิ์ที่แตกต่างกันแล้ว การหลอมเหลวในแต่ละครั้งก็มีความแตกต่างกัน แม้สารตั้งต้นจะมาจากชุดเดียวกัน การเตรียมแก้วจึงได้ทดลองเตรียมแก้วหลายครั้งโดยทำให้ได้แก้วที่มีความแตกต่างกัน เช่น แก้วที่มีองค์ประกอบของ  $75\text{KNN}:25\text{SiO}_2$  จะให้แก้วแตกต่างกันดังรูปที่ 4.10 พนว่าการที่แก้วที่ได้มีความใสหรืออ่อนแตกต่างกัน นอกเหนือจากจะมีปัจจัยของสภาพแวดล้อม เช่น ความชื้นหรือระยะเวลาในการทำให้แก้วเย็นตัวลงอย่างรวดเร็ว เข้ามาเกี่ยวข้องแล้ว ก็ยังอาจจะมีสาเหตุมาจากการน้ำยาหลอมมีความเสถียรต่ำทำให้ควบคุมลักษณะแก้วที่ต้องการได้ยาก ดังนั้นในการเตรียมแก้วแต่ละครั้งจึงต้องทำการด้วยความรวดเร็วทั้งส่วนของการเทน้ำแก้วและทับน้ำแก้ว และไม่เลือกหลอมแก้วในช่วงที่มีความชื้นสูง



รูปที่ 4.9 แสดงแผนภาพชุดของผงโพแทสเซียมโซเดียมในโอบเดกที่ใช้ในการเตรียมแก้ว



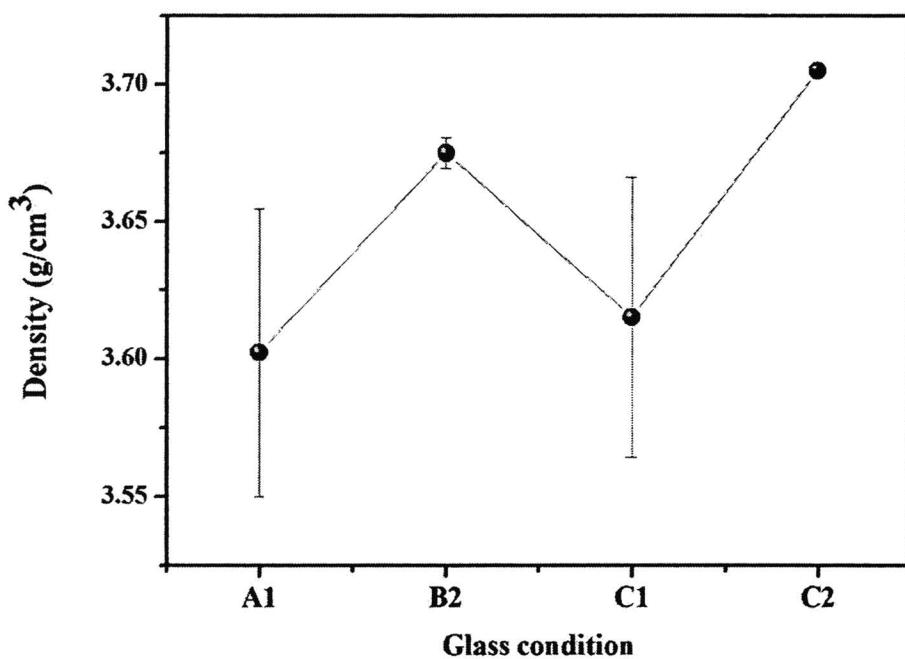
**รูปที่ 4.10** แสดงลักษณะชิ้นงานแก้วที่ได้จากการทดลองหลอม เพื่อหาช่วงเวลาการเทแก้วที่เหมาะสมสำหรับการสร้างแก้วที่มีความโปร่งใส โดยเลือกศึกษาที่องค์ประกอบของโพแทสเซียมโซเดียมในโอดเบดต์อัลิกาคือร้อยละ 75:25 โดยโนล

ลักษณะของแก้วที่แตกต่างกันโดยปกตินั้นเป็นผลมาจากการระยะเวลาที่ใช้ในการทำให้เย็นตัวของน้ำแก้วหลอมและความชื้นของบรรยากาศ ซึ่งจะส่งผลต่อการเกิดผลึกภายในเนื้อแก้ว และส่งผลต่อคุณสมบัติแสง เช่นความใสของชิ้นงาน เนื่องจากว่าผลึกภายในเนื้อแก้วจะทำให้แสงที่ส่องผ่านเข้ามานำเกิดการกระเจิงออกทุกทิศทาง แก้วจึงมีลักษณะโปร่งแสงหรือทึบแสงนั้นเอง

สำหรับการเลือกศึกษาชิ้นงานแก้ว จะใช้แก้วตัวอย่างที่มีความโปร่งใส และแตกต่างกันในเรื่องขององค์ประกอบและเงื่อนไขของการเตรียมผงโพแทสเซียมโซเดียม ในโอดเบดที่ต่างกันเป็นจำนวน 5 ชิ้นงานตัวอย่าง ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.2 และรูปที่ 4.11 การวิเคราะห์ความหนาแน่นของชิ้นงานพบว่าไม่แตกต่างกันมากนักในชิ้นงานแก้วแต่ละชุด

ตารางที่ 4.2 แสดงลักษณะที่แตกต่างกันของชิ้นงานแต่ละชนิด

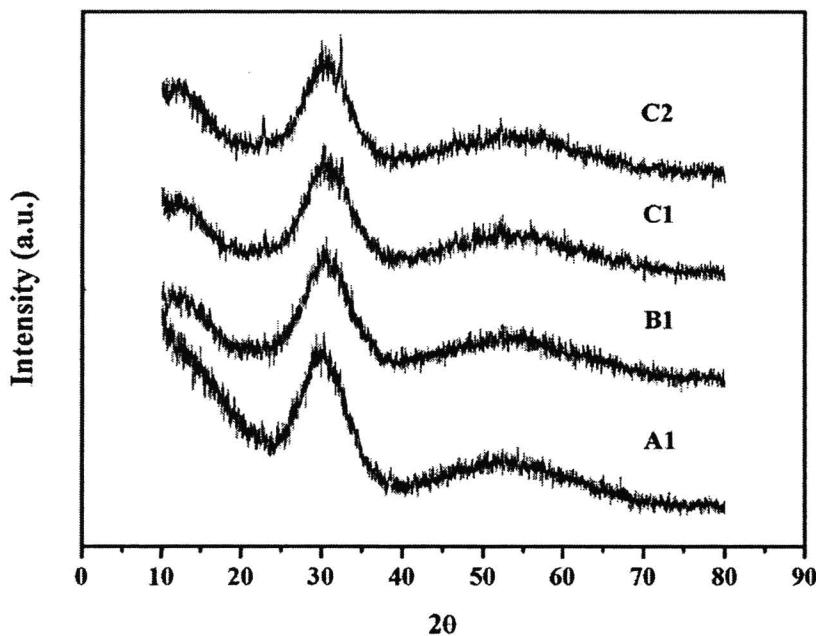
องค์ประกอบ	เงื่อนไขการเผา (อุณหภูมิ/ระยะเวลา)	สัญลักษณ์	ความหนาแน่น (g/cm <sup>3</sup> )
ผงโพแทสเซียมโซเดียม ในโอเบตที่มีความไม่บริสุทธิ์สูง (A)			
75KNN : 25SiO <sub>2</sub>	800°C/ 2h	A1	3.6021
ผงโพแทสเซียมโซเดียม ในโอเบตที่มีสิ่งเจือปนเพียงเล็กน้อย (B)			
75KNN : 25SiO <sub>2</sub>	800°C/ 2h	B1	-
75KNN : 25SiO <sub>2</sub>	800°C/ 2h	B2	3.6748
ผงโพแทสเซียมโซเดียม ในโอเบตที่มีความบริสุทธิ์สูง (C)			
75KNN : 25SiO <sub>2</sub>	900°C/ 4h	C1	3.6151
80KNN : 20SiO <sub>2</sub>	900°C/ 4h	C2	3.7047



รูปที่ 4.11 กราฟแสดงความหนาแน่นของชิ้นงานแก้ว

#### 4.2.2 ผลการตรวจสอบเฟสของตัวอย่างโดยเทคนิค XRD

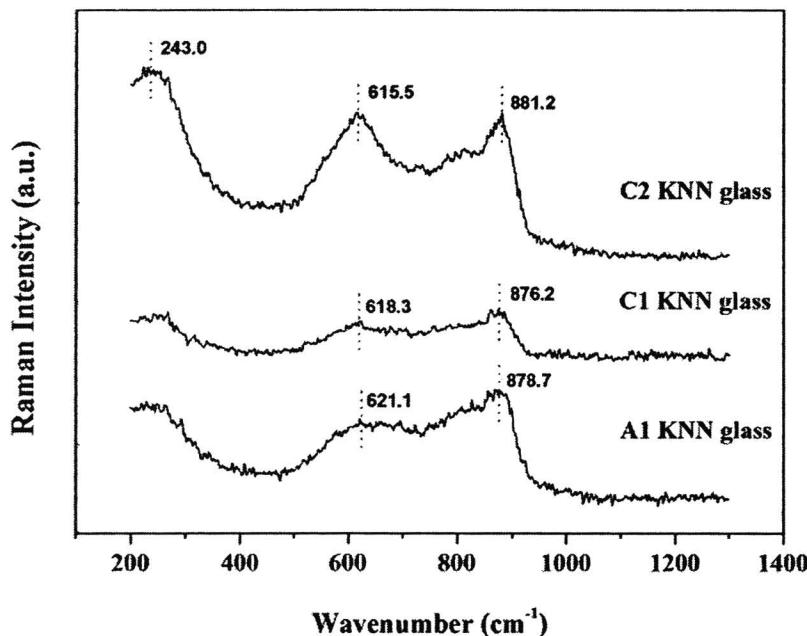
จากการศึกษาพบว่าแก้วโพแทสเซียมโซเดียมในโอบอตจะมีลักษณะที่เป็นอัมอร์ฟาน (amorphous) คือเป็นพิกค์กว้าง (board) แต่จะเกิดกราฟที่มีพิกค์ให้เห็นบ้างเล็กน้อยที่ประมาณ 32 องศา โดยพิกค์ที่ได้มีความเข้มแสลง (intensity) ที่ไม่สูงมากเมื่อเทียบกับผงโพแทสเซียมโซเดียมใน-โอบอตที่อยู่ในกลุ่มเซรามิก พิกค์ของแก้วโพแทสเซียมโซเดียมในโอบอตอีกหลายๆ เส้น ใจที่มีลักษณะที่คล้ายกันดังในรูปที่ 4.12 อย่างไรก็ตามยังไม่พบผลึกเกิดขึ้นชัดเจนในแก้วที่ยังไม่ผ่านกระบวนการทางความร้อน ในแก้วที่ใช้สารตั้งต้นที่บริสุทธิ์โดยมีอัตราส่วนของ KNN : SiO<sub>2</sub> คือ ร้อยละ 75 : 25 โดยโมล (C1) และร้อยละ 80 : 20 โดยโมล (C2) จะพบว่าเกิดพิกค์ที่ 2θ เท่ากับ 23 และ 32 ขึ้น จากการนำไปตรวจสอบเฟสของตัวอย่างโดยใช้เครื่องมือ JCPDS พบว่า เฟสที่เกิดขึ้นมีความสอดคล้องกับเฟสของโพแทสเซียมโซเดียมในโอบอต ( $K_{0.65}Na_{0.35}NbO_3$ ) หรือ หมายเลข JCPDS คือ 77-0038 โดยมีโครงสร้างผลึกแบบมอนอกลินิก (monoclinic structure)



รูป 4.12 แสดงรูปแบบการเดี่ยวบนรังสีเอกซ์ของแก้วโพแทสเซียมโซเดียมในโอบอตของแก้วเซรามิกที่เตรียมจากสารตั้งต้นที่มีความบริสุทธิ์ต่างกันโดยมีอัตราส่วนของ KNN:SiO<sub>2</sub> เท่ากับร้อยละ 75:25 โดยโมล (A1, B1 และ C1) และ KNN:SiO<sub>2</sub> เท่ากับร้อยละ 80:20 โดยโมล (C2)

#### 4.2.3 ผลการตรวจสอบสมบัติทางสเปกโทรสโคปี

ผลการตรวจสอบสมบัติทางสเปกโทรสโคปีด้วยเครื่องร้านของชิ้นงานแก้วเซรามิกที่ได้จากการตั้งต้นที่มีบริสุทธิ์และผ่านกระบวนการทางความร้อนที่ช่วงอุณหภูมิที่แตกต่างกัน โดยจะพบแบบของการสั่น (vibration band) ตั้งแต่  $200 - 1000 \text{ cm}^{-1}$  และพบว่าแก้วที่เตรียมได้จะมีพีคของร้านสเปกตรัมเกิดขึ้นในหลายช่วงเลขคู่ (wavenumber) และมีลักษณะที่ไม่แตกต่างกันมาก นักดังที่แสดงในรูปที่ 4.13 พีคของร้านที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่าง  $800 - 900 \text{ cm}^{-1}$  นี้แสดงถึงการที่ในโอบรีมีการจับกันแบบออกตรีดอล ( $\text{NbO}_6$ ) โดยมีออกซิเจนที่ไม่ได้ทำพันธะเหลืออยู่ ส่วนพีคที่เกิดขึ้นในช่วง  $600 - 800 \text{ cm}^{-1}$  จะไม่มีออกซิเจนที่ไม่ทำพันธะเหลืออยู่ในโครงสร้าง จึงไม่มีการบิดเบี้ยว สำหรับความเข้มแสงที่มีความต่างกัน เป็นผลมาความบริสุทธิ์ของสารตั้งต้นโพแทสเซียมโซเดียม ในโอบรีมและอัตราส่วนของโพแทสเซียมโซเดียม ในโอบรีมกับซิลิกาที่แตกต่างกัน



รูป 4.13 แสดงรูปแบบของร้านสเปกตรัมของแก้วเซรามิกที่เตรียมจากการตั้งต้นที่มีความบริสุทธิ์ต่างกันชุด A1 คือ แก้วที่ใช้สารตั้งต้นที่ไม่มีบริสุทธิ์สูง, ชุด C1 คือแก้วที่ใช้สารตั้งต้นที่บริสุทธิ์โดยมีอัตราส่วนของ  $\text{KNN : SiO}_2$  คือร้อยละ 75 : 25 โดยโมลและชุด C2 คือแก้วที่ใช้สารตั้งต้นที่มีบริสุทธิ์โดยมีอัตราส่วนของ  $\text{KNN : SiO}_2$  คือร้อยละ 80 : 20 โดยโมล



#### 4.3 ผลการศึกษาการเตรียมแก้วเซรามิกโพแทสเซียมโซเดียมในโอบอตที่ได้ทั้งจากผ่าน

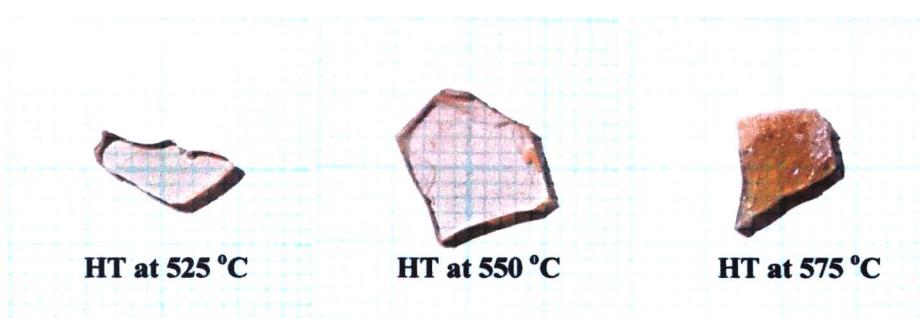
##### กระบวนการทางความร้อน (Heat treatment)

ในขั้นตอนของการทดลองนี้ เป็นส่วนของการปลูกพลีกภายในเนื้อแก้วที่ได้จากการเตรียมในหัวข้อที่ 4.2 โดยการผ่านกระบวนการปลูกพลีกด้วยความร้อน (heat treatment) เพื่อทำให้เกิดพลีกภายในเนื้อแก้วและเผาไหม้เพื่อทำให้พลีกเกิดการเดิน โดย การทดลองนี้ได้เลือกทดลองปลูกพลีกแก้วในช่วงอุณหภูมิที่ทำให้แก้วใสเปลี่ยนเป็นแก้วทุนเพื่อทำการเปรียบเทียบคุณสมบัติต่างๆ ของแก้วที่ใสและไม่ใส อย่างไรก็ตาม การทดลองข้างต้นได้ทำการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางความร้อนหรือ DTA เพื่อทำการศึกษาอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการเกิดพลีก โพแทสเซียมโซเดียม ในโอบอต อย่างสมบูรณ์ โดยไม่มีเฟสอื่นประกอบปломภายใน เนื่องจากใช้ในการปลูกพลีกคือ อุณหภูมิช่วง 500 องศาเซลเซียส ไปจนถึง 650 องศาเซลเซียส อัตราการเพิ่มน้ำหนักของอุณหภูมิคือ 5 องศาเซลเซียส ต่อนาทีและอัตราการลดลงของอุณหภูมิคือ 10 องศาเซลเซียสต่อนาที ระยะเวลาที่ใช้ในการเผาไหม้คือ 4 ชั่วโมง จากนั้นจึงนำชิ้นงานแก้วที่ปลูกพลีกไปทำการตรวจสอบสมบัติทางกายภาพ ตรวจสอบสมบัติทางความร้อนและพัฒนาด้วย DTA และ TG-DSC วิเคราะห์เฟสของค์ประกอบด้วยรังสี-เอกซ์หรือ XRD การตรวจสอบสมบัติทางสเปกตรอสโคปีด้วยเครื่อง Raman spectroscopy การศึกษาโครงสร้างทางจุลภาคด้วยเทคนิค FESEM-EDS จากนั้นจึงนำแก้วเซรามิกที่ได้ไปทดสอบสมบัติทางไฟฟ้าได้แก่ สมบัติ导电性和导热性 และฟอร์โรอิเล็กทริก เป็นต้น

### 4.3.1 ผลของการเตรียมแก้วเซรามิกที่ได้จากการตั้งต้นที่มีความไม่บริสุทธิ์สูง (A)

#### 4.3.1.1 ผลการตรวจสอบลักษณะทางกายภาพ

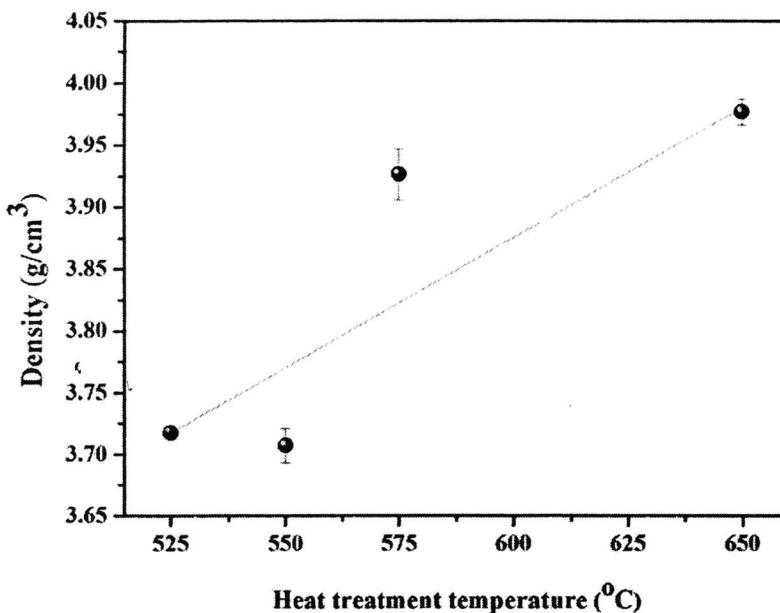
จากการเลือกทดลองใช้สารตั้งต้นที่มีความไม่บริสุทธิ์สูง (ชุด A) ใน การเตรียมแก้วเซรามิก โดยขอใช้สัญลักษณ์คือ A1 พบว่าสามารถสร้างแก้วที่มีความใสและออกสีเหลืองเล็กน้อยได้ หลังจากผ่านกระบวนการทางความร้อน หรือ heat treatment เพื่อทำการปลูกพลักในเนื้อแก้วที่ อุณหภูมิต่างๆ ได้แก่ 525, 550 และ 575 องศาเซลเซียส ด้วยอัตราการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิคือ 5 องศาเซลเซียสต่อนาที และ อัตราการลดลงของอุณหภูมิคือ 10 องศาเซลเซียสต่อนาที ระยะเวลาที่ ใช้ในการเผา เช่น 4 ชั่วโมง พบร่วมกันที่ได้มีความโปร่งแสงที่ลดลง จนกระทั่งทึบในที่สุด สาเหตุที่ความโปร่งแสงของชิ้นงานแก้วลดลงนั้นเป็นผลมาจากการผลักที่เกิดขึ้น มีการเติบโตขึ้นตาม อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นนั่นเอง การกระเจิงของแสงจะเกิดขึ้นได้มากจนกระทั่งแสงไม่สามารถทะลุผ่าน ชิ้นงานได้ในที่สุด ลักษณะของชิ้นงานเป็นไปดังรูปที่ 4.14



รูปที่ 4.14 แสดงลักษณะทางกายภาพของชิ้นงานแก้วเซรามิกที่ได้จากการตั้งต้นที่มีความไม่บริสุทธิ์สูง (A1) และผ่านกระบวนการทางความร้อนที่ช่วงอุณหภูมิที่แตกต่างกัน

นำชิ้นงานที่ได้มาหาความหนาแน่น โดยเทคนิคการแทนที่น้ำหรืออาร์คิเมดีส (Archimedes) พบว่าชิ้นงานที่ได้จะมีแนวโน้มของความหนาแน่นที่เพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิที่ใช้ในการกระบวนการทางความร้อนเพื่อปลูกพลักเพิ่มสูงขึ้น ดังรูปที่ 4.15 ชิ้นงานที่มีความหนาแน่นที่สูงที่สุดคือชิ้นงานที่ผ่านกระบวนการร้อนที่อุณหภูมิ 650 องศาเซลเซียส โดยมีความหนาแน่นเท่ากับ  $3.98 \text{ g/cm}^3$  ส่วนชิ้นงานที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการทางความร้อนและชิ้นงานที่ผ่านกระบวนการทางความร้อนที่อุณหภูมิต่ำกว่าคือ 525, 550 และ 575 องศาเซลเซียส จะมีความหนาแน่นที่น้อยกว่าคือ  $3.60$ ,  $3.72$ ,  $3.71$  และ  $3.93 \text{ g/cm}^3$  สาเหตุของความหนาแน่นที่เพิ่มขึ้นคือการที่ผลักในเนื้อแก้วเติบโตขึ้น

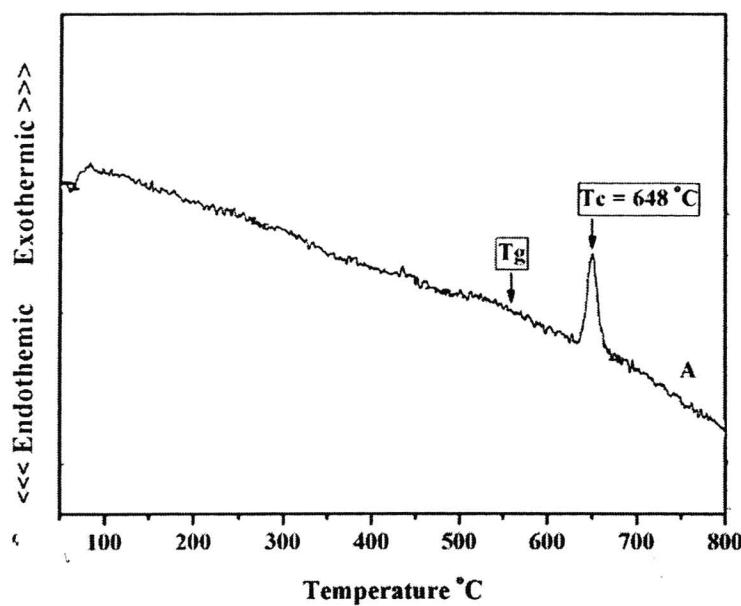
ตามอุณหภูมิการปลูกผลึก จำนวนและขนาดของผลึกที่เพิ่มขึ้น ทำให้โครงสร้างภายในแก้วเซรามิก เกิดเรียงตัวชิดกันจนทำให้แก้วเซรามิกมีความหนาแน่นที่เปลี่ยนแปลงไป



รูปที่ 4.15 แสดงความหนาแน่นของชิ้นงานแก้วเซรามิกที่ได้จากการตั้งต้นที่มีความไม่บริสุทธิ์สูง (A1) และผ่านกระบวนการทางความร้อนที่ช่วยอุณหภูมิที่แตกต่างกัน

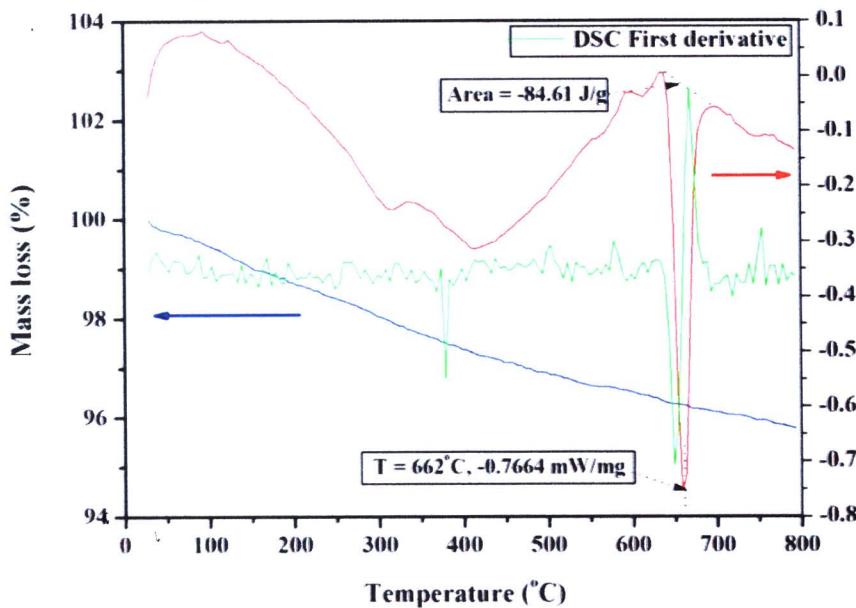
#### 4.3.1.2 ผลการวิเคราะห์ทางความร้อนด้วยเทคนิค DTA และ TG-DSC

จากการวิเคราะห์เชิงความร้อนด้วยเทคนิค DTA โดยมีเงื่อนไขของอุณหภูมิที่ใช้ในการศึกษาคือช่วงอุณหภูมิห้องคือประมาณ 30 องศาเซลเซียส ไปจนถึงที่อุณหภูมิประมาณ 800 องศาเซลเซียส ด้วยอัตราการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิคือ 5 องศาเซลเซียสต่อนาที และใช้ซิลิกา ( $\text{SiO}_2$ ) เป็นตัวเทียบมาตรฐาน ทำให้ทราบถึงรูปแบบการเปลี่ยนแปลงเฟสของแก้วเซรามิกดังรูปที่ 4.16 พบว่าที่อุณหภูมิที่ 648 องศาเซลเซียสเป็นอุณหภูมิที่แสดงการขยายพลัgangานของแก้วเซรามิก พิกที่เกิดขึ้นนี้จะแสดงถึงช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการตกผลึก (crystallization temperature,  $T_c$ ) จะสังเกตเห็นว่าผล XRD ของแก้วนั้นจะแสดงความเป็นผลึกที่อุณหภูมิ 575 องศาเซลเซียส ซึ่งใกล้เคียงกับจุดที่เกิดพิกของกราฟ DTA ส่วนแก้วที่ผ่านการให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 525 - 575 องศาเซลเซียสจะมีลักษณะที่ชุ่น อาจเนื่องมาจากการเกิดการแยกเฟส (phase separation) ในเนื้อแก้วนั้นเอง



รูปที่ 4.16 แสดงผลการวิเคราะห์ทางความร้อนด้วยเทคนิค DTA ของแก้วเซรามิกที่ได้จากสารตั้งต้นที่มีความไม่นิ่งริสุทธิ์สูง (A1)

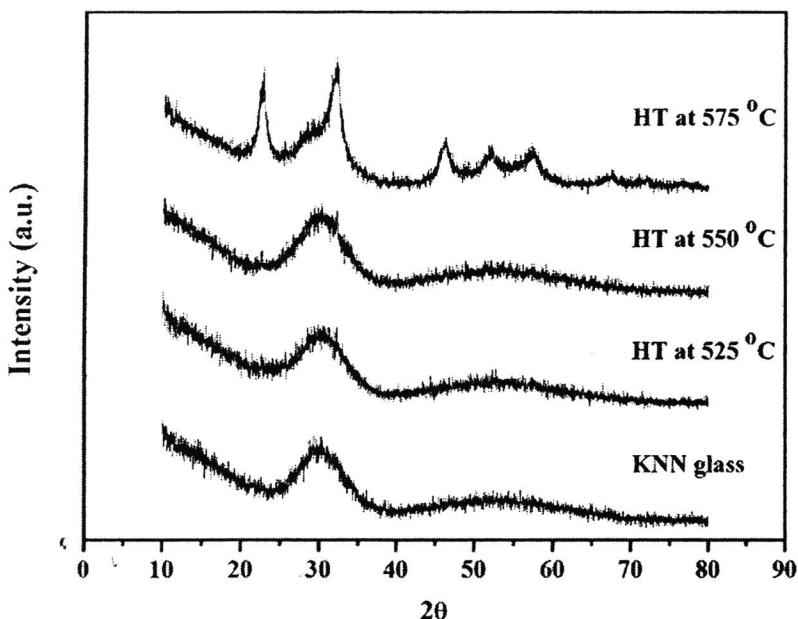
จากการวิเคราะห์ทางความร้อนเชิงพลังงาน TG-DSC เพื่อยืนยันกับผลการศึกษาด้วยเทคนิค DTA เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงเฟสของแก้วเซรามิกโดยมีเงื่อนไขของอุณหภูมิที่ใช้ในการศึกษาคือช่วงอุณหภูมิห้องคือประมาณ 30 องศาเซลเซียส ไปจนถึงที่อุณหภูมิประมาณ 800 องศาเซลเซียส ด้วยอัตราการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิคือ 10 องศาเซลเซียสต่อนาที พบรักษาการเปลี่ยนแปลงของพลังงานได้ดังรูป จากรูป 4.17 ผลการวิเคราะห์ที่ได้จากชุด A1 พนว่าที่อุณหภูมิเท่ากับ 662 องศาเซลเซียส ชิ้นงานจะมีการเปลี่ยนแปลงเฟสเกิดขึ้นและเกิดการขยายความร้อนเท่ากับ  $0.07664 \text{ mW/mg}$  จากราฟจะบอกร่องการสูญเสียของมวลที่เกิดขึ้นซึ่งจะช่วยอธิบายถึงการสลายตัวของชิ้นงานอันเนื่องจากความร้อน พนว่าการสูญเสียของมวลจะเกิดขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไป โดยที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียสพบการสูญเสียของมวลเหลือเพียง 95.8 % จะพนว่าการสูญเสียที่เกิดขึ้นเกิดเป็นจำนวนที่ต่ำเนื่องมาจากการแก้วเซรามิกมีความเสถียรของโครงสร้างสูง แต่การที่ยังเกิดการสูญเสียของมวลเกิดขึ้นเล็กน้อยนี้อาจเป็นผลมาจากการความร้อนที่ให้เข้าไปในอัตราเพิ่มที่สม่ำเสมอจะทำให้เกิดการสั่น (vibrate) ของอะตอม และอะตอมบางส่วนได้หลุดออกไปในสัดส่วนที่เท่ากัน ทำให้การสูญเสียบังเกิดขึ้นเล็กน้อย



รูปที่ 4.17 แสดงผลการวิเคราะห์ทางความร้อนด้วยเทคนิค TG-DSC ของแก้วเซรามิกที่ได้จากสารตั้งต้นที่มีความไม่บริสุทธิ์สูง (A1)

#### 4.3.1.3 ผลการตรวจสอบเฟสของค์ประกอบด้วยเทคนิค XRD

จากการตรวจสอบเฟสของค์ประกอบของผงแก้วที่ได้จากสารตั้งต้นที่มีความไม่บริสุทธิ์สูง หรือชุด A1 นี้ด้วยเทคนิค XRD เป็นดังรูปที่ 4.18 พบว่าชิ้นงานแก้วที่ยังไม่ผ่านกระบวนการทางความร้อน และชิ้นงานที่ผ่านการใช้ความร้อนในช่วงอุณหภูมิ 525 และ 550 องศาเซลเซียส จะแสดงลักษณะความเป็นอสัมฐานส่วนใหญ่ คือไม่มีความเป็นผลึกเกิดขึ้นภายในเนื้อแก้ว ในช่วงอุณหภูมิ 525 และ 550 องศาเซลเซียส จะตรวจพบพื้กของเฟสของค์ประกอบเด็กน้อยประมาณ 2% เท่ากับ 23 และ 32 องศา ที่อุณหภูมิ 575 องศาเซลเซียสปรากฏเฟสของโพแทสเซียมโซเดียมใน-ไอโอเบตอย่างชัดเจน โดยตรวจสอบได้จากการเทียบกับข้อมูล JCPDS พบว่าเฟสที่เกิดขึ้นมีความสอดคล้องกับเฟสของโพแทสเซียมโซเดียมใน-ไอโอเบต ( $K_{0.65}Na_{0.35}NbO_3$ ) หรือหมายเลขอาร์เจนตินา ( $KNaNbO_3$ ) คือ 77-0038 โดยมีโครงสร้างผลึกแบบมอนโคลินิก (monoclinic structure)

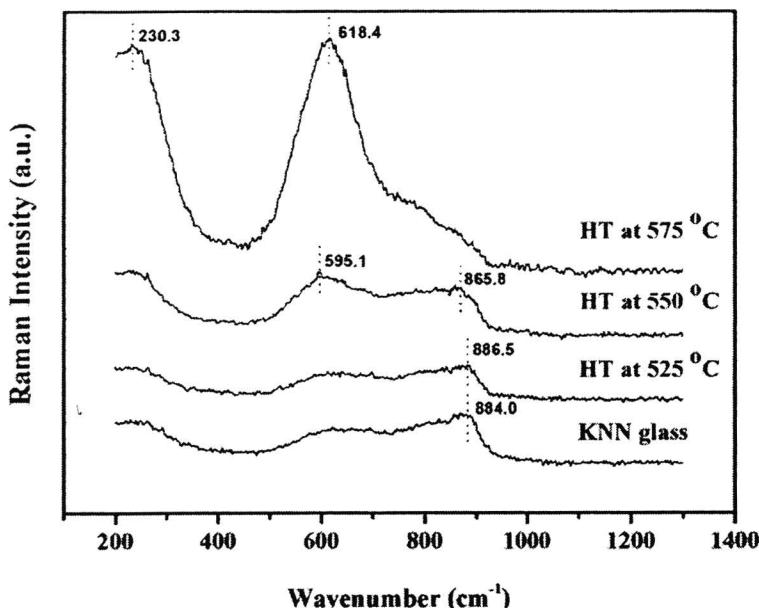


รูปที่ 4.18 แสดงรูปแบบการเลี้ยงเวนรังสีเอกซ์ของแก้วเซรามิกที่ได้จากการตั้งต้นที่มีความไม่บริสุทธิ์สูง (A1) และผ่านกระบวนการทางความร้อนที่ช่วงอุณหภูมิที่แตกต่างกัน

#### 4.3.1.4 ผลการตรวจสอบสมบัติทางスペก troscopy

ผลการตรวจสอบสมบัติทางスペก troscopy ของชิ้นงานแก้วเซรามิกที่ได้จากการตั้งต้นที่มีความไม่บริสุทธิ์สูง (A1) และผ่านกระบวนการทางความร้อนที่ช่วงอุณหภูมิที่แตกต่างกัน โดยจะพนแคนของการสั่น (vibration band) ตั้งแต่  $200 - 1000 \text{ cm}^{-1}$  พบร่วงแก้วที่เตรียมได้จะมีพีคของรمانาสเปกตรัมเกิดขึ้นในคลายช่วงเลขคู่ (wavenumber) และมีลักษณะที่ไม่แตกต่างกันมากนักดังที่แสดงในรูป 4.19 จากการตรวจสอบสมบัติทางスペก troscopy พบว่าพีคของรمانาสเปกตรัมเกิดขึ้นในช่วงระหว่าง  $800 - 900 \text{ cm}^{-1}$  นี้เป็นผลมาจากการที่ในโอบีเยนมีการจับกันแบบออกตรัสีครอล ( $\text{NbO}_6$ ) โดยมีออกซิเจนที่ไม่ได้ทำพันธะเหลืออยู่ โครงสร้าง ณ บริเวณนี้จึงเกิดการบิดเบี้ยวได้มาก ส่วนพีคที่เกิดขึ้นในช่วง  $600 - 800 \text{ cm}^{-1}$  จะไม่มีออกซิเจนที่ไม่ได้ทำพันธะเหลืออยู่ในโครงสร้าง จึงไม่มีการบิดเบี้ยว จากการพจฉาเห็นได้ว่าการบิดเบี้ยวของโครงสร้างเกิดมากเมื่ออุณหภูมิที่ใช้ในการปลุกพลิกต่ำ แก้วจะมีความเป็นอัตโนมัติสูง แต่เมื่ออุณหภูมิในการปลุกพลิกสูงขึ้นการบิดเบี้ยวของโครงสร้างจะเกิดน้อยลง และมีความเป็นผลลัพธ์เพิ่มสูงขึ้น จากราฟพีคที่เกิดขึ้นที่เลขคู่  $230 \text{ cm}^{-1}$  จะเกิดการคัดโดยของพันธะ  $\text{O}-\text{Nb}-\text{O}$  และจะมีการขยายตัวของพันธะ  $\text{O}-\text{Nb}-\text{O}$  ภายในโครงสร้างของในโอบีเยน ออกตรัสีครอลแสดงออกมาดังพีคในช่วง  $618 \text{ cm}^{-1}$  อย่างไรก็ตาม ช่วงบริเวณ  $700 - 800 \text{ cm}^{-1}$  จะ

เกิดการขยายออกของพันธะอย่างสมมาตรของ Si-O-Si เช่นกัน สุดท้ายช่วงบริเวณ  $800 - 900 \text{ cm}^{-1}$  ก็จะเกิดการซึ่มต่อ กันของไนโอลีบีมออกตรารีดครอส



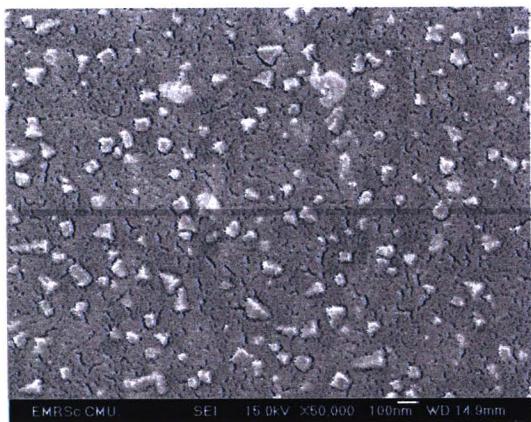
รูปที่ 4.19 แสดงรูปแบบของรaman สเปกตรัมของแก้วเซรามิกที่ได้จากการตั้งต้นที่มีความไม่บริสุทธิ์สูง (A1) และผ่านกระบวนการทางความร้อนที่ช่วงอุณหภูมิที่แตกต่างกัน

#### 4.3.1.5 ผลการศึกษาโครงสร้างทางจุลภาคด้วยเทคนิค FESEM-EDS

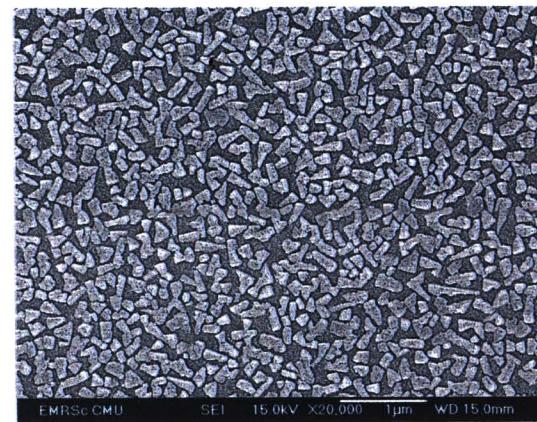
ผลการตรวจสอบลักษณะโครงสร้างทางจุลภาคของชิ้นงานแก้วเซรามิกโพแทสเซียม โซเดียม ในไนโอลีตที่สารตั้งต้นที่มีความไม่บริสุทธิ์สูง (A1) โดยใช้กล้องจุลทรรศน์แบบส่องรากดในโอมค scanning electron (SEI) ได้ผลลัพธ์ที่แสดงในรูปที่ 4.20 ซึ่งจากการถ่ายภาพชิ้นงานแก้วเซรามิกที่ผ่านอุณหภูมิปลูกพลีกในช่วง 525, 550 และ 575 องศาเซลเซียส ด้วยกำลังขยาย 20,000 เท่า พนว่าเกิดผลลัพธ์โซเดียมโพแทสเซียมในไนโอลีตในระดับนาโนเมตรจำนวนมากกระจายอยู่ทั่ว ซึ่งเป็นการแยกเฟสของโซเดียมโพแทสเซียมในไนโอลีตที่มีตัวกล้องชิลิกา และเมื่อทำการขยายภาพไปที่กำลังขยาย 50,000 พนว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเหล่านี้มีรูปทรงเป็นเหลี่ยมนูน (equiaxed crystal) ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจะมีขนาดที่โตขึ้นตามอุณหภูมิที่ใช้ในการปลูกพลีก ที่อุณหภูมิการปลูกพลีก 525 องศาเซลเซียส จะพบว่ามีการกระจายตัวของผลลัพธ์อย่างไม่หนาแน่น และขึ้นหนาแน่น ไม่เท่ากันดังจะเห็นได้จากรูปที่ 4.20 (จ) ที่อุณหภูมิ 575 องศาเซลเซียส ผลการศึกษาธาตุองค์ประกอบด้วยเทคนิค EDS ตรวจพบธาตุองค์ประกอบของแก้วเซรามิกโพแทสเซียมโซเดียมในไนโอลีต คือชาตุ K, Na, Nb, O และ Si ในปริมาณร้อยละ โดยน้ำหนักตามลำดับ ดังที่แสดงในรูป 4.21



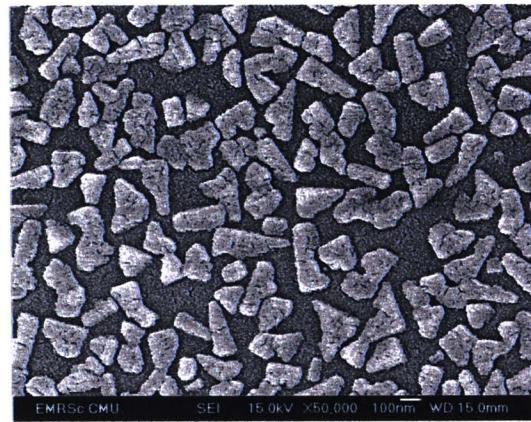
ก. 525 °C (20,000x)



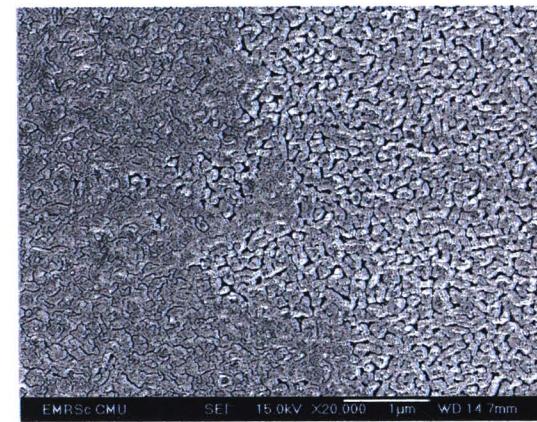
ก. 525 °C (50,000x)



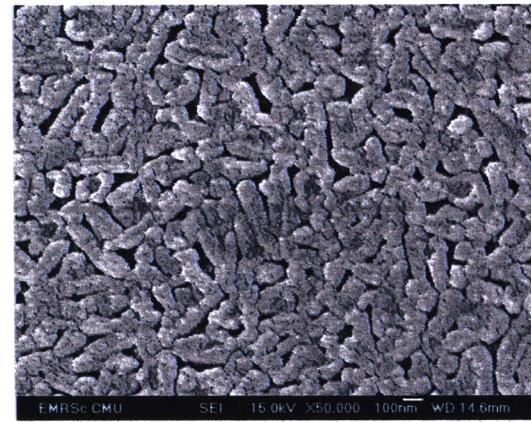
ค. 550 °C (20,000x)



ค. 550 °C (50,000x)

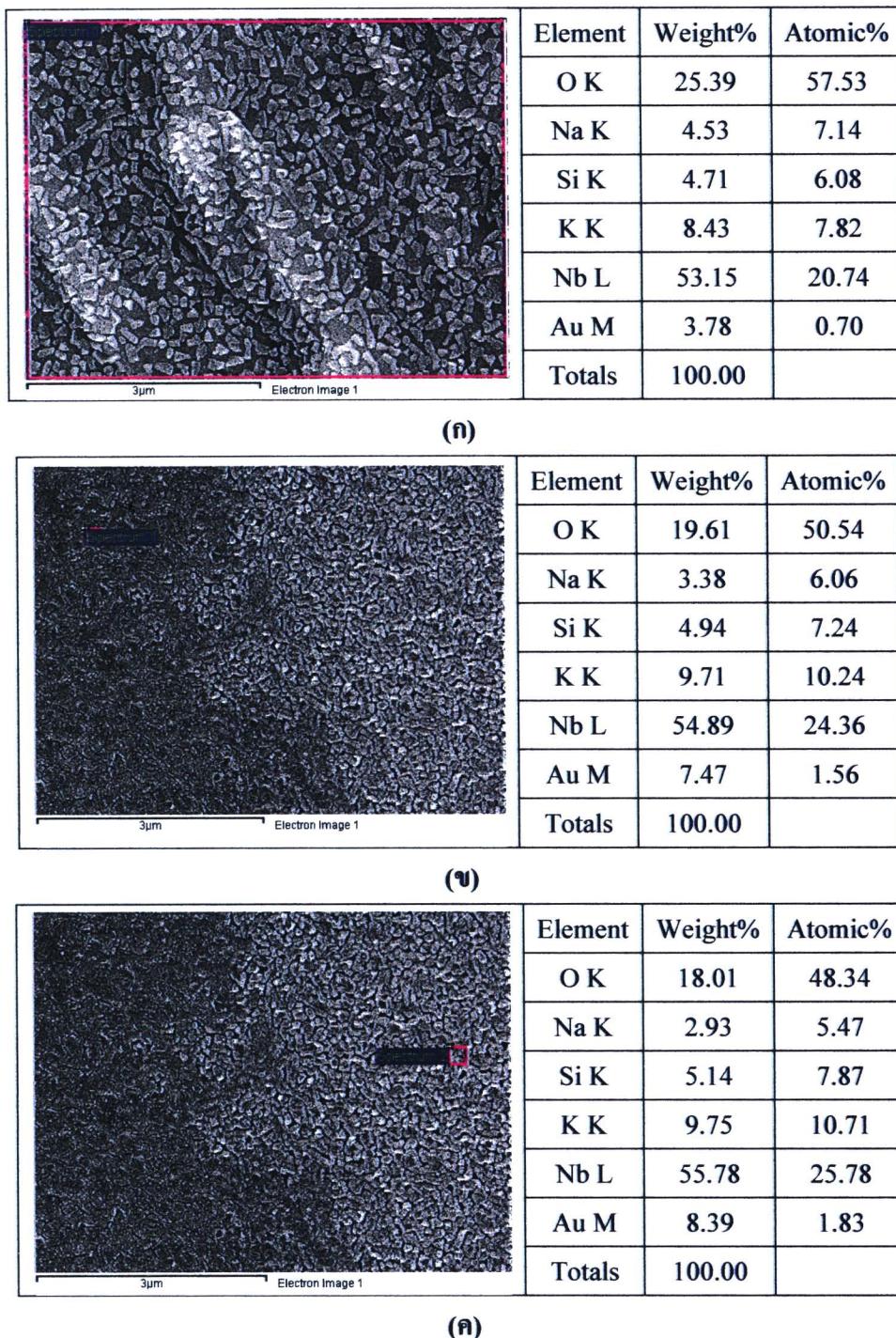


จ. 575 °C (20,000x)



จ. 575 °C (50,000x)

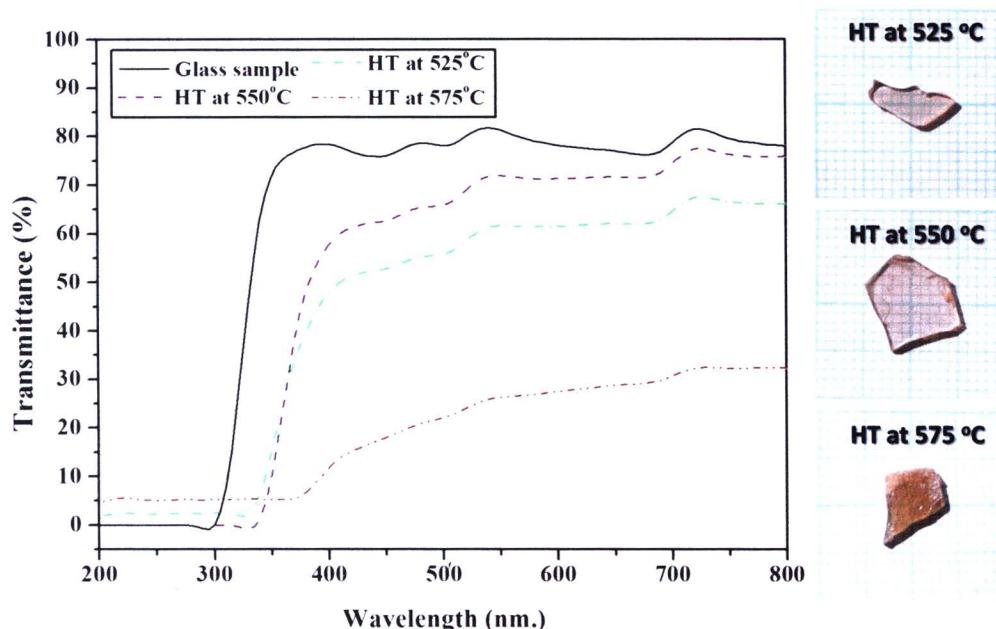
รูปที่ 4.20 แสดงการศึกษาโครงสร้างทางชั้นของชิ้นงานแก้วเซรามิกได้จากสารตั้งต้นที่มีความไม่บริสุทธิ์สูง (A1) และผ่านกระบวนการทางความร้อนที่ช่วงอุณหภูมิที่แตกต่างกัน ด้วยกำลังขยาย 20,000 และ 50,000 เท่า



รูปที่ 4.21 แสดงผลการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค EDS ของชิ้นงานเก้าเซรามิกได้จากการตั้งค่าที่มีความไม่บริสุทธิ์สูง (A1) และผ่านกระบวนการทางความร้อน (ก) ผ่านความร้อนที่อุณหภูมิ 550 องศาเซลเซียส (ข) ผ่านความร้อนที่อุณหภูมิ 575 องศาเซลเซียส (ค) ผ่านความร้อนที่อุณหภูมิ 575 องศาเซลเซียส

#### 4.3.1.6 ผลการตรวจสอบสมบัติเชิงแสงด้วยเครื่องมือ UV-Vis และ refractometer

ผลที่ได้จากการทดลองหาร้อยละการส่องผ่าน (%) Transmittance) ของชิ้นงานแก้วเซรามิกโพแทสเซียมโซเดียม ใน一波ตของสารตั้งต้นที่มีความไม่บริสุทธิ์สูง (A1) โดยผ่านการหลอมเหลวที่อุณหภูมิ 1300 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 15 นาที โดยผ่านความร้อนเพื่อใช้ในการปัลกพลิกในแต่ละช่วงอุณหภูมิ เป็นเวลา นาน 4 ชั่วโมง แสดงดังรูปที่ 4.22 จากรูปจะเห็นว่าชิ้นงานที่ผ่านความร้อนเพื่อปัลกพลิกที่อุณหภูมิ 525 และ 550 องศาเซลเซียส จะมีลักษณะที่โปร่งใส ร้อยละการส่องผ่านของแสงก็จะสูงกว่าชิ้นงานที่ทึบแสง โดยสามารถร้อยละการส่องผ่านคือร้อยละ 60 และ 70 ช่วงความยาวคลื่นที่แสงสามารถทะลุผ่านคือแสงขาว (visible light, 300 - 800 nm.) และทั้งสองชุดยังมีดัชนีหักเหของแสง (refraction index) ที่เท่ากันคือ 1.650 ส่วนชิ้นงานที่ทึบสนิทเกิดขึ้นเมื่ออุณหภูมิในการปัลกพลิกสูงขึ้น สืบเนื่องมาจากพลิกภายใน มีขนาดที่ใหญ่ทำให้เกิดการกระเจิงของแสงมากจนการทะลุผ่านของแสงเกิดขึ้นได้น้อย ดังผลที่ปรากฏจากการวิเคราะห์ด้วย SEM ชิ้นงานที่มีขนาดของพลิกที่เล็กในช่วงนาโนเมตร จะยอมให้แสงผ่านได้โดยการกระเจิงแสงจะเกิดขึ้นน้อย ผลจึงทำให้ร้อยละการส่องผ่านมีค่าที่สูงตามไปด้วย สำหรับร้อยละการส่องผ่านของชิ้นงานที่ทึบแสงนั้น จะมีค่าอยู่ประมาณร้อยละ 30 หรือต่ำกว่า และมีช่วงความยาวคลื่นที่แสงสามารถทะลุผ่านได้คือ 375 – 800 นาโนเมตรเป็นต้นไป และมีดัชนีหักเหแสงคือ 1.655

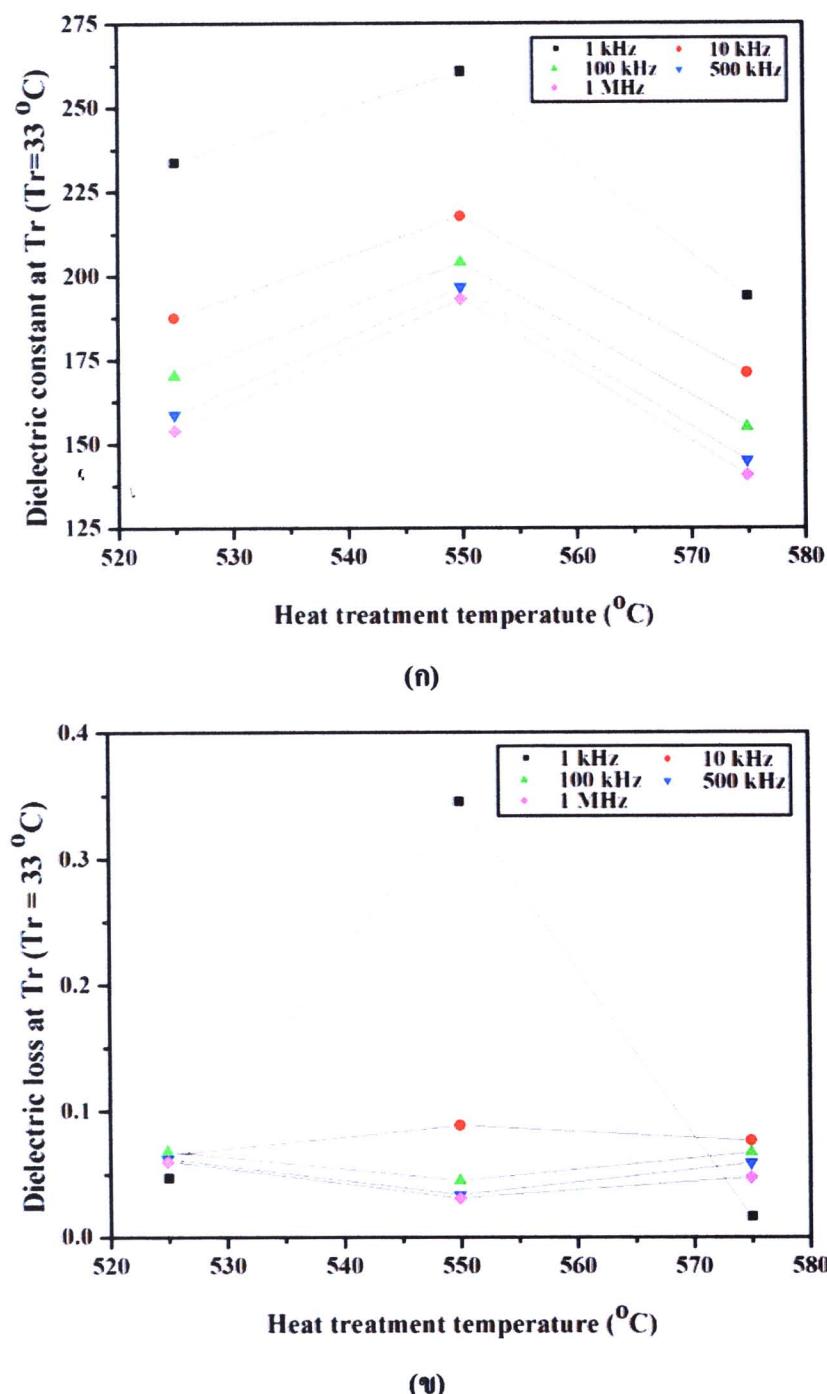


รูปที่ 4.22 แสดงร้อยละการส่องผ่านและดัชนีหักเหแสงของแก้วเซรามิกที่ได้จากสารตั้งต้นที่มีความไม่บริสุทธิ์สูง (A1) และผ่านกระบวนการทางความร้อน

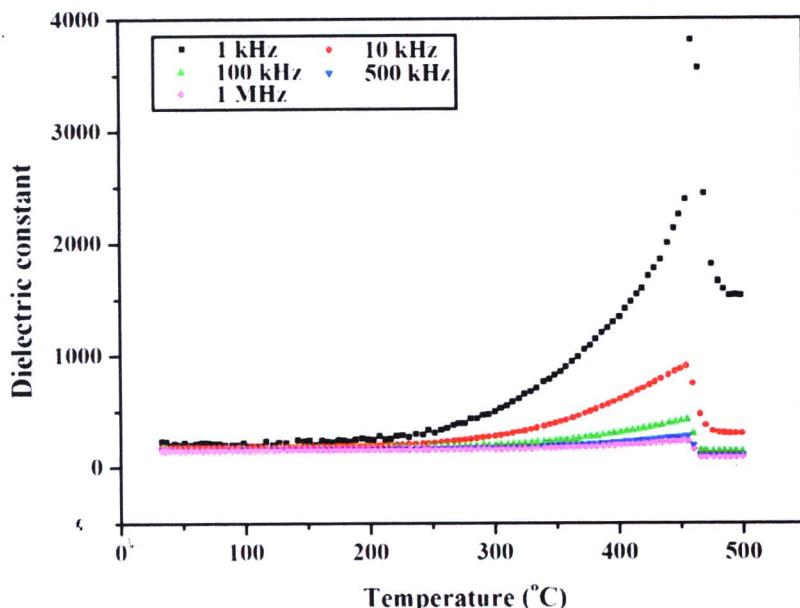
#### 4.3.1.7 ผลการตรวจสอบสมบัติทางไฟฟ้า

##### 1. สมบัติไฟอิเล็กทริก

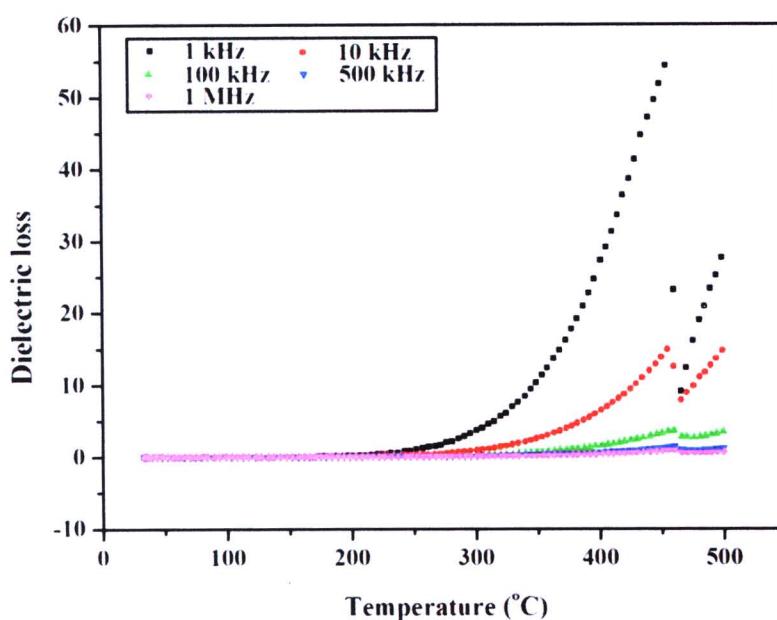
ผลการตรวจสอบค่าคงที่ทางไฟอิเล็กทริก และค่าการสูญเสียไฟอิเล็กทริก ณ อุณหภูมิห้องของชิ้นงานแก้วเซรามิกโพแทสเซียมโซเดียม ในโอเบตที่สร้างจากสารตั้งต้นที่มีความไม่บริสุทธิ์สูง (A1) และผ่านการหลอมเหลวที่อุณหภูมิ 1300 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลานาน 15 นาที โดยผ่านความร้อนเพื่อใช้ในการปลูกผลึกที่อุณหภูมิ 525, 550 และ 575 องศาเซลเซียส เป็นเวลานาน 4 ชั่วโมง แสดงให้เห็นดังรูป 4.23 โดยเลือกความถี่ที่ต่างกันมาใช้ในการวิเคราะห์คือ 1, 10, 100, 500 kHz และ 1 MHz ตามลำดับพบว่าค่าคงที่ไฟอิเล็กทริกและค่าการสูญเสียทางไฟอิเล็กทริกจะมีการเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิที่ใช้ในการปลูกผลึก ที่อุณหภูมิ 525 ถึง 550 องศาเซลเซียส ชิ้นงานแก้วเซรามิกมีแนวโน้มของค่าไฟอิเล็กทริกที่เพิ่มขึ้น และจะลดลงเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นไปที่ 575 องศาเซลเซียส เช่นกันกับค่าการสูญเสียทางไฟอิเล็กทริกจะมีค่าที่ลดลงในช่วงอุณหภูมิ 525 ถึง 550 องศาเซลเซียสและเพิ่มขึ้นที่อุณหภูมิ 575 องศาเซลเซียส ในรูปที่ 4.23 (x) จะพบว่าที่ความถี่ 1 kHz ที่อุณหภูมิ 550 องศาเซลเซียส จะพบว่ามีค่าการสูญเสียไฟอิเล็กทริกที่สูง ซึ่งไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับผลอื่นๆ ที่ความถี่เดียวกัน ทั้งนี้อาจเป็นผลจากการคลาดเคลื่อนของเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ และจากการวัดค่าไฟอิเล็กทริกเทียบกับความถี่ พบว่าค่าทั้งสองจะลดลงตามความถี่ที่เพิ่มขึ้น จากนั้นได้ลองทำการวัดค่าคงที่ทางไฟอิเล็กทริก และค่าการสูญเสียไฟอิเล็กทริกเมื่ออุณหภูมิของชิ้นงานเปลี่ยนแปลงไป ดังที่แสดงในรูปที่ 4.24 จะเห็นได้ว่าในชิ้นงานแก้วเซรามิกโพแทสเซียมโซเดียม ในโอเบตที่ปลูกผลึกที่อุณหภูมิที่แตกต่างกันจะมีค่าไฟอิเล็กทริกที่สูงเพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้น โดยค่าไฟอิเล็กทริกจะมีค่าที่สูงที่สุดในชิ้นงานแก้วเซรามิกที่ปลูกผลึกที่อุณหภูมิ 550 องศาเซลเซียส จากรูปพอจะสรุปคร่าวๆ ได้ว่าอุณหภูมิที่จะเกิดการเปลี่ยนเฟสของแก้ว (glass transition temperature,  $T_g$ ) ในแก้วเซรามิกโพแทสเซียมโซเดียม ในโอเบตที่สร้างจากสารตั้งต้นที่มีความไม่บริสุทธิ์สูง (A1) นี้จะอยู่ในช่วง 450 จนกระทั่ง 500 องศาเซลเซียส



รูปที่ 4.23 แสดงค่าคงที่ไอดิเล็กทริก (ก) และค่าการสูญเสียทางไอดิเล็กทริก (ข) ณ อุณหภูมิห้อง ของแก้วเซรามิกที่ได้จากสารตั้งต้นที่มีความไม่บริสุทธิ์สูง (A1) และผ่านกระบวนการทางความร้อน

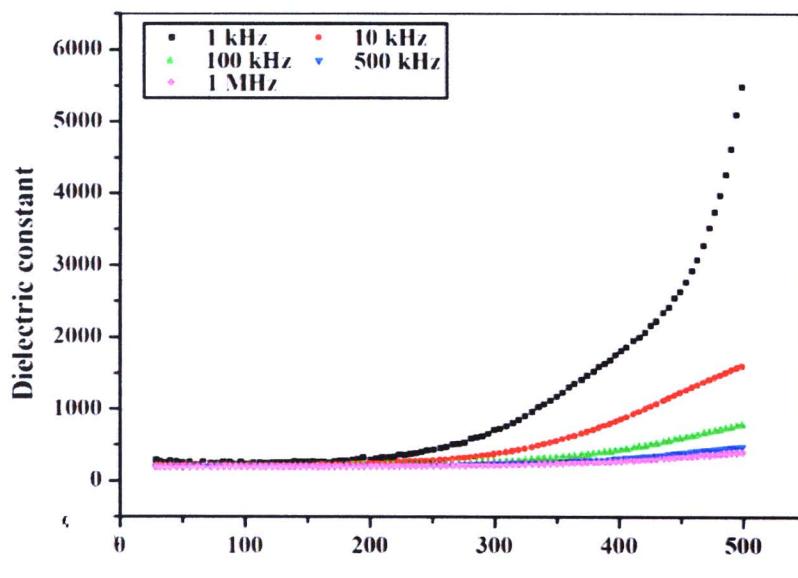


(n)

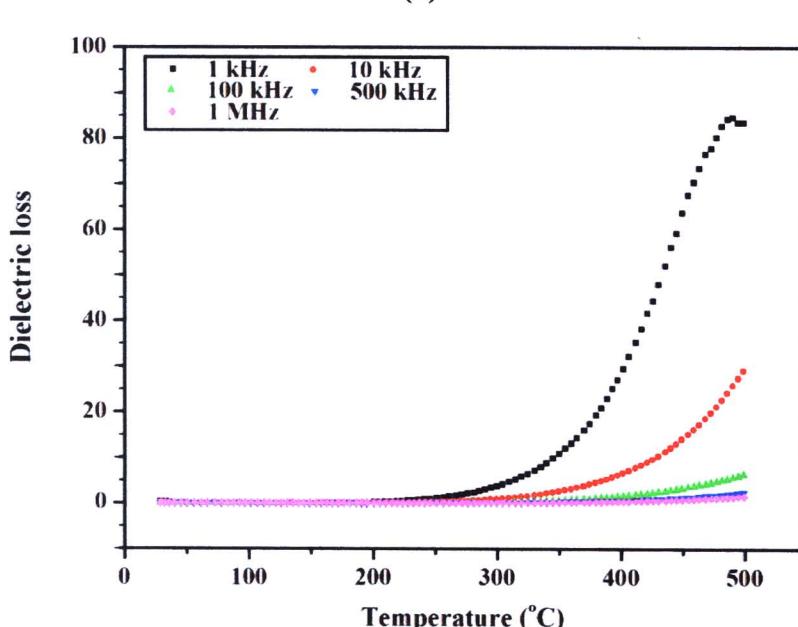


(u)

รูปที่ 4.24 แสดงค่าคงที่ไดอิเล็กทริก (n) และค่าการสูญเสียทางไดอิเล็กทริก (u) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ของแก้วเซรามิกที่ได้จากสารตั้งต้นที่มีความไม่บริสุทธิ์สูง (A1) และผ่านกระบวนการทางความร้อนที่อุณหภูมิ 525 องศาเซลเซียส

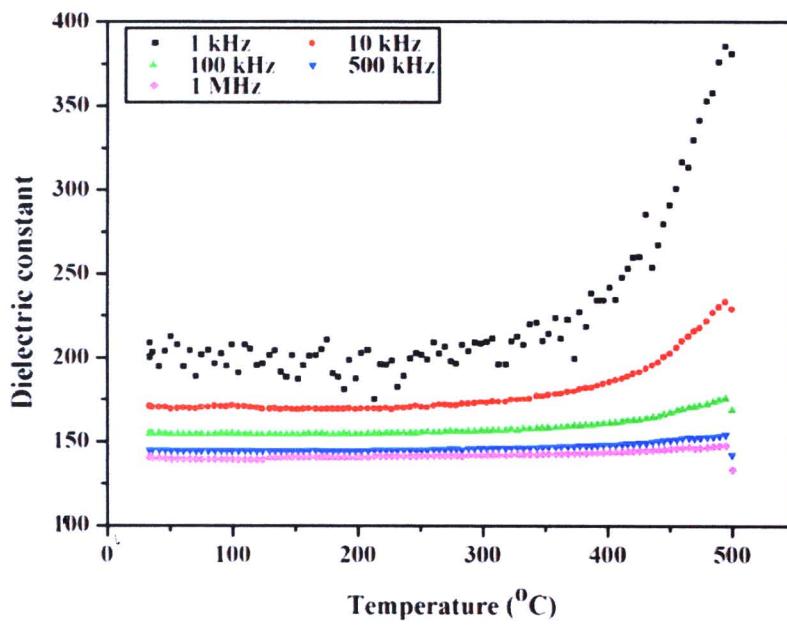


(ก)

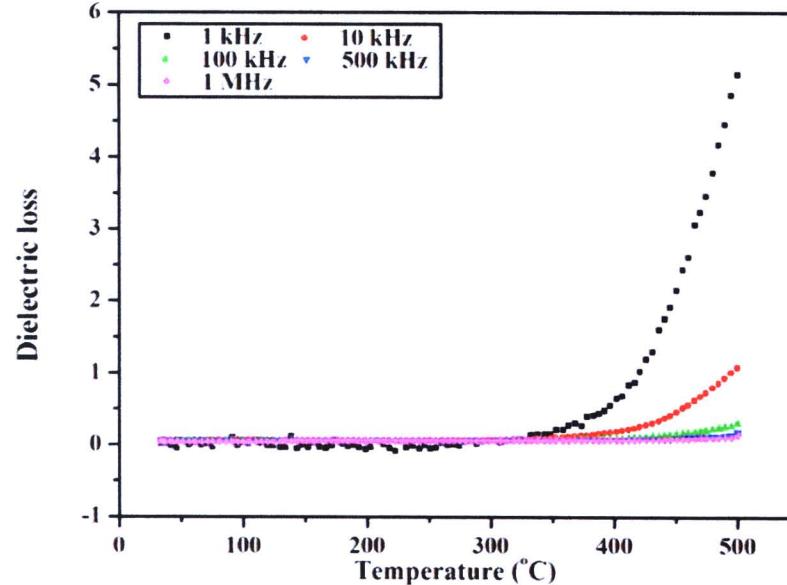


(ห)

รูปที่ 4.24 (ต่อ) แสดงค่าคงที่ไดอิเล็กทริก (ก) และค่าการสูญเสียทางไดอิเล็กทริก (ห) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ของแก้วเซรามิกที่ได้จากสารตั้งต้นที่มีความไม่บริสุทธิ์สูง (A1) และผ่านกระบวนการทางความร้อนที่อุณหภูมิ 550 องศาเซลเซียส



(ก)

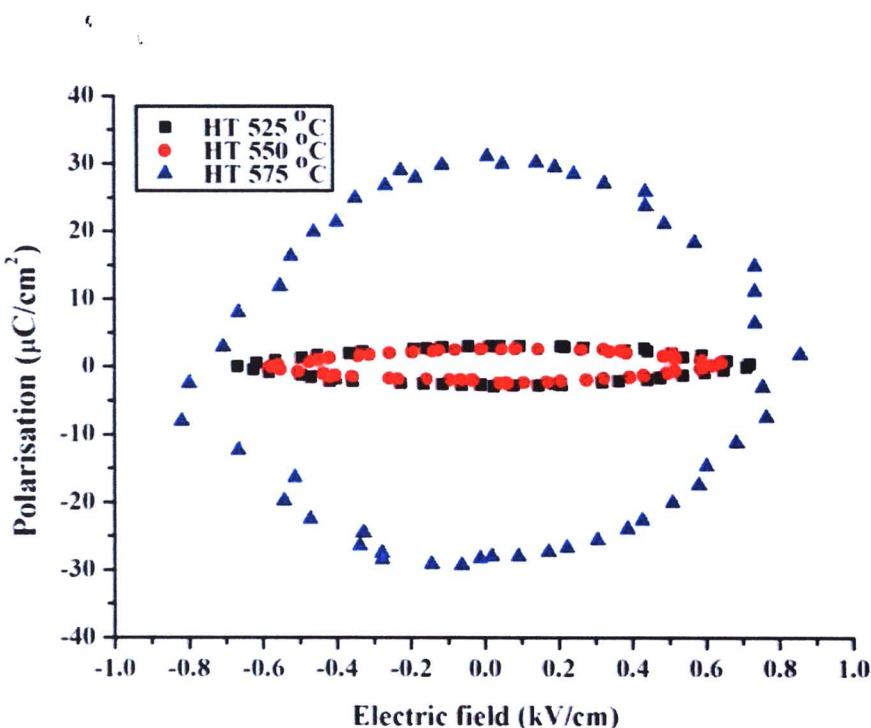


(ห)

รูปที่ 4.24 (ต่อ) แสดงค่าคงที่ไดอิเล็กทริก (ก) และค่าการสูญเสียทางไดอิเล็กทริก (ห) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ของแก้วเซรามิกที่ได้จากการตั้งต้นที่มีความไม่บริสุทธิ์สูง (A1) และผ่านกระบวนการทางความร้อนที่อุณหภูมิ 575 องศาเซลเซียส

## 2. สมบัติเฟอร์โรอิเล็กทริก

ผลการตรวจสอบสมบัติเฟอร์โรอิเล็กทริก ณ อุณหภูมิห้อง ของชิ้นงานแก้วเซรามิก โพแทสเซียม โซเดียม ในโอบตที่สร้างจากสารตั้งต้นที่มีความไม่บริสุทธิ์สูง (A1) ซึ่งผ่านการหลอมเหลวที่อุณหภูมิ 1300 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 15 นาที และผ่านความร้อนเพื่อใช้ในการปลูกผลึกที่อุณหภูมิ 525, 550 และ 575 องศาเซลเซียส เป็นเวลา นาน 4 ชั่วโมง โดยให้ spanning ไฟฟ้าเข้าไป 300 กิโลโวลต์ต่อเซนติเมตร ( $\text{kV/cm}$ ) เป็นระยะเวลา 1000 วินาที แสดงให้เห็นตั้งรูป 4.25 จากรูปวงเสถียรรีซิส (hyteresis loop) แสดงให้เห็นว่าสารชนิดนี้มีค่าการสูญเสีย (lossy capacitor) ที่สูงและไม่พนความเป็นเฟอร์โรอิเล็กทริกที่เด่นชัด

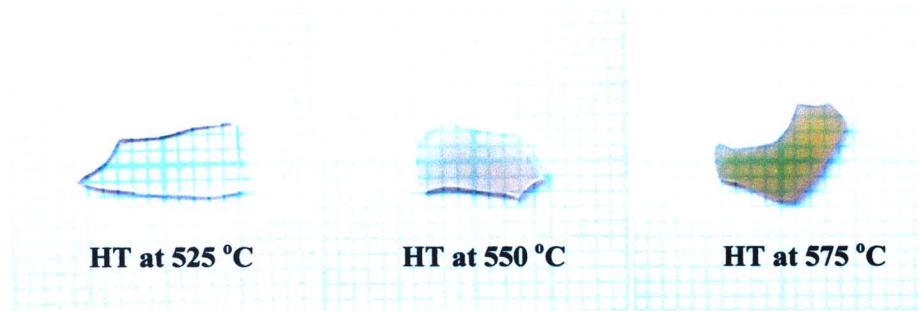


รูปที่ 4.25 แสดงวงเสถียรรีซิสของแก้วเซรามิกที่สร้างจากสารตั้งต้นที่มีความไม่บริสุทธิ์สูง (A1) และผ่านความร้อนเพื่อใช้ในการปลูกผลึกที่อุณหภูมิ 525, 550 และ 575 องศาเซลเซียส เป็นเวลา นาน 4 ชั่วโมง

### 4.3.2 ผลของการเตรียมแก้วเซรามิกที่ได้จากผังตั้งต้นที่มีพื้นของสิ่งเจือปนเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อย (B1)

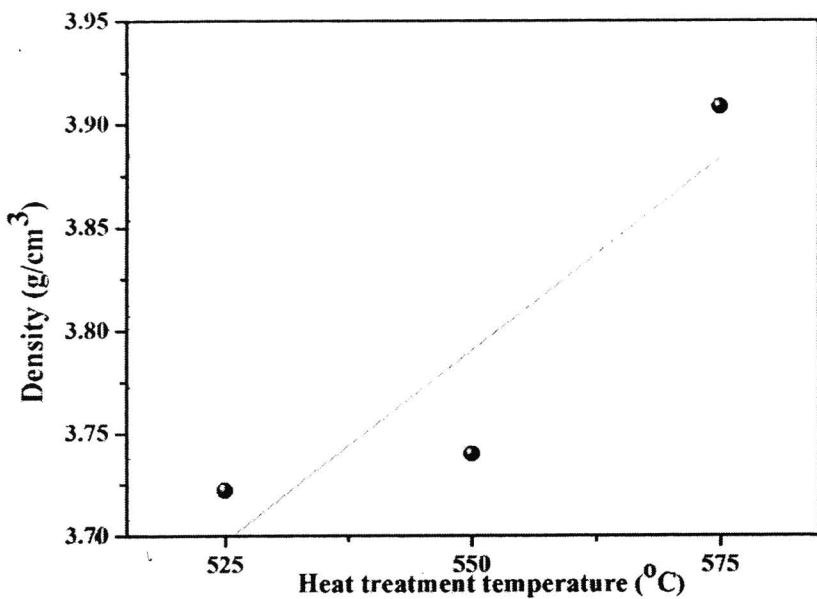
#### 4.3.2.1 ผลการตรวจสอบลักษณะทางกายภาพ

จากการเลือกทดลองใช้สารตั้งต้นที่มีสิ่งเจือปนเพียงเล็กน้อย (ชุด B) ในการเตรียมแก้วเซรามิกโดยขอใช้สัญลักษณ์คือ B1 พบร่วมกันสามารถสร้างแก้วที่มีความใสและอุ่นสีเหลืองเล็กน้อย ได้ค้ำประกันว่าชิ้นงานที่เกิดในชุด A หลังจากผ่านกระบวนการทางความร้อน หรือ heat treatment เพื่อทำการปลูกหลักในเนื้อแก้วที่อุณหภูมิต่างๆ ได้แก่ 525, 550 และ 575 องศาเซลเซียส ด้วยอัตราการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิคือ 5 องศาเซลเซียสต่อนาที และ อัตราการลดลงของอุณหภูมิคือ 10 องศาเซลเซียสต่อนาที ระยะเวลาที่ใช้ในการเผาแห้งคือ 4 ชั่วโมง พบร่วมกันว่าชิ้นงานที่ได้มีความโปร่งแสงที่ลดลง จนกระทั่งทึบในที่สุด แสดงดังรูปที่ 4.26 สาเหตุที่ความโปร่งแสงของชิ้นงานแก้วลดลงนั้น เป็นผลมาจากการปลูกหลักที่เกิดขึ้นเมื่อการเติบโตขึ้นตามอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นนั้นเอง การกระเจิงของแสงจึงเกิดขึ้น ได้มากจนกระทั่งแสงไม่สามารถทะลุผ่านชิ้นงานได้ในที่สุด



รูปที่ 4.26 แสดงลักษณะทางกายภาพของชิ้นงานแก้วเซรามิกที่ได้จากสารตั้งต้นที่มีสิ่งเจือปนเพียงเล็กน้อยและผ่านกระบวนการทางความร้อนที่ช่วงอุณหภูมิที่แตกต่างกัน

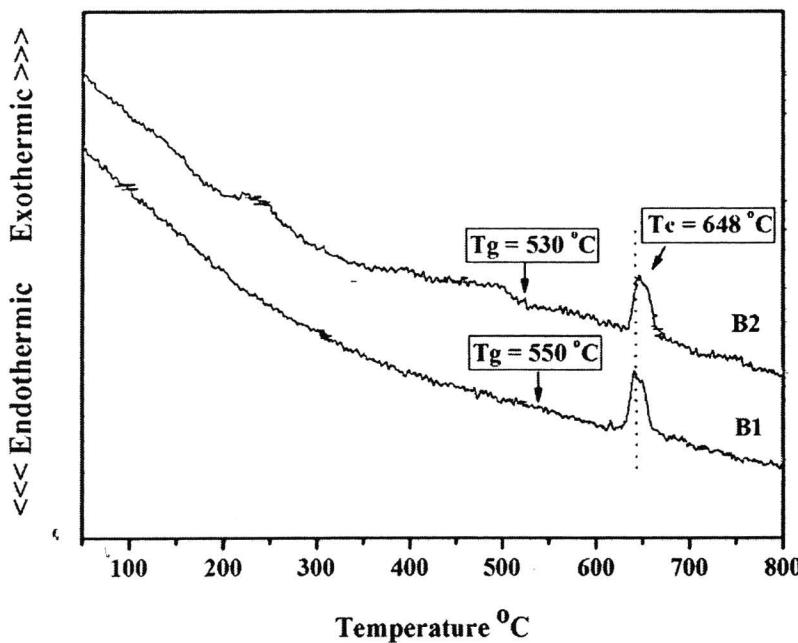
จากการนำชิ้นงานที่ได้มาหาความหนาแน่น โดยเทคนิคการแทนที่น้ำหรือที่เรียกว่า อาร์คิเมดีส (Archimedes) พบร่วมกันว่าชิ้นงานที่ได้จะมีแนวโน้มของความหนาแน่นที่เพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิที่ใช้ในการกระบวนการทางความร้อนเพื่อปลูกหลักเพิ่มสูงขึ้น ดังรูปที่ 4.27 ชิ้นงานที่มีความหนาแน่นที่สูงที่สุดคือชิ้นงานที่ผ่านกระบวนการร้อนที่อุณหภูมิ 575 องศาเซลเซียส โดยมีความหนาแน่นเท่ากับ  $3.91 \text{ g/cm}^3$  และความหนาแน่นที่รองลงมาคือชิ้นงานที่ผ่านการปลูกหลักที่อุณหภูมิ 550 องศาเซลเซียส คือ  $3.74 \text{ g/cm}^3$  และต่ำที่สุดที่อุณหภูมิ 525 องศาเซลเซียส โดยมีความหนาแน่นเท่ากับ  $3.72 \text{ g/cm}^3$



รูปที่ 4.27 แสดงความหนาแน่นของชิ้นงานแก้วเซรามิกที่ได้จากการตั้งต้นที่มีสิ่งจืดปนเพียงเล็กน้อยและผ่านกระบวนการทางความร้อนที่ช่วงอุณหภูมิที่แตกต่างกัน

#### 4.3.2.2 ผลการวิเคราะห์ทางความร้อนด้วยเทคนิค DTA

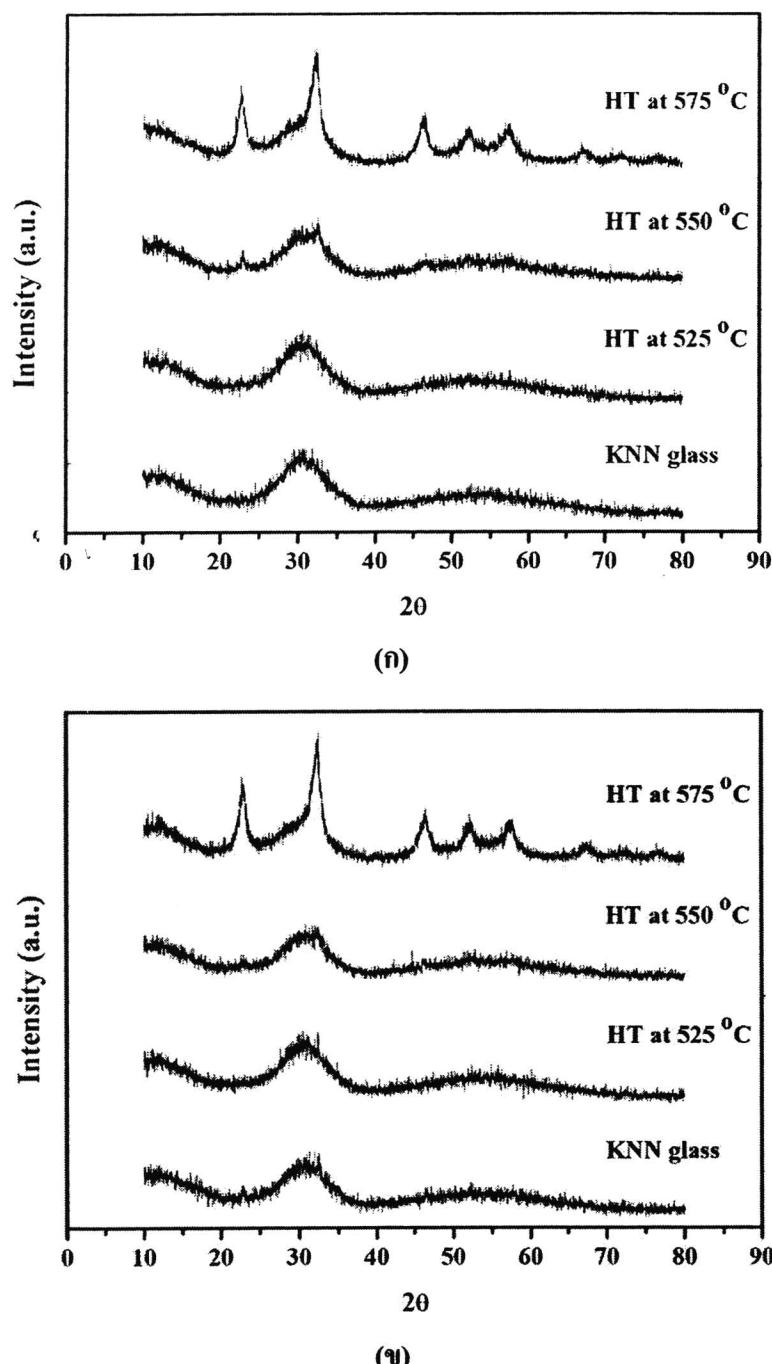
ผลการทดลองโดยการวิเคราะห์เชิงความร้อนด้วยเทคนิค DTA โดยมีเงื่อนไขของอุณหภูมิที่ใช้ในการศึกษาคือช่วงอุณหภูมิห้องคือประมาณ 30 องศาเซลเซียส ไปจนถึงที่อุณหภูมิประมาณ 800 องศาเซลเซียส ด้วยอัตราการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิคือ 5 องศาเซลเซียสต่อนาที และใช้ซิลิกา ( $\text{SiO}_2$ ) เป็นตัวเทียนมาตรฐาน ทำให้ทราบถึงรูปแบบการเปลี่ยนแปลงของแก้วเซรามิกดังรูปที่ 4.28 พบว่าที่อุณหภูมิที่ 648 องศาเซลเซียสเป็นอุณหภูมิที่แสดงการขยายตัวของแก้วเซรามิก พิกที่เกิดขึ้นนี้จะแสดงถึงช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการตกผลึก ( $T_c$ ) จากกราฟอุณหภูมิที่แก้วเซรามิกมีการเปลี่ยนแปลงเฟส ( $T_g$ ) ก็คือที่ช่วงอุณหภูมิเท่ากับ 530 องศาเซลเซียส แก้วเซรามิกที่ผ่านกระบวนการทางความร้อนที่อุณหภูมิ 550 องศาเซลเซียส จะพบว่าแก้วจะเริ่มเข่นขึ้นเล็กน้อยเนื่องจากการแยกเฟส นอกจากใน การทดลองนี้ยังได้ลองเตรียมแก้วขึ้นมาสองชุดจากสารตั้งต้นโพแทสเซียมโซเดียม ในโอบอุ่นที่มีสิ่งแปลกปลอมเล็กน้อยซึ่งเป็นสารชุดเดียวกันแต่แตกต่างกันเพียงแค่การหลอมแก้วซึ่งจะลดอัตราหลอมละลายน้ำหนักเดียวกันแต่แตกต่างกันคือ B1 และ B2 โดยเงื่อนไขของการหลอมยังเหมือนเดิม เพื่อทดสอบว่าชิ้นงานมีความแตกต่างกันหรือไม่ และผลที่ได้จากการวิเคราะห์ทางความร้อนไม่พบร่องรอยแตกต่างกันในชิ้นงานทั้งสองตัว



รูปที่ 4.28 แสดงผลการวิเคราะห์ทางความร้อนด้วยเทคนิค DTA ของแก้วเซรามิกที่มีสิ่งเจือปนเพียงเล็กน้อยและหลอมเหลวกันคนละชุด โดยที่ B1 คือชุดการหลอมครั้งที่ 1 B2 คือชุดการหลอมครั้งที่ 2

#### 4.3.2.3 ผลการตรวจสอบเฟสสองค์ประกอบด้วยเทคนิค XRD

จากการตรวจสอบเฟสสองค์ประกอบของผงแก้วที่ได้จากการตั้งต้นที่มีสิ่งเจือปนเพียงเล็กน้อยเกิดขึ้นในชุด B1 และชุด B2 นี้ด้วยเทคนิค XRD เป็นดังรูป 4.29 พบว่าชิ้นงานแก้วที่ยังไม่ผ่านกระบวนการทางความร้อน และชิ้นงานที่ผ่านการใช้ความร้อนในช่วงอุณหภูมิ 525 และ 550 องศาเซลเซียส จะแสดงลักษณะความเป็นอสัญฐานส่วนใหญ่ คือไม่มีความเป็นผลึกเกิดขึ้นภายในเนื้อแก้ว และในช่วงอุณหภูมิ 525 และ 550 องศาเซลเซียสจะตรวจพบพิกัดของเฟสสองค์ประกอบ เล็กน้อยปรากฏที่มุม  $2\theta$  เท่ากับ 23 และ 32 องศา ที่อุณหภูมิ 575 องศาเซลเซียสปรากฏเฟสของโพแทสเซียมโซเดียมในโอเบตอย่างชัดเจน โดยตรวจสอบได้จากการเทียบกับข้อมูล JCPDS พบว่า เฟสที่เกิดขึ้นมีความสอดคล้องกับเฟสของโพแทสเซียมโซเดียมในโอเบต  $K_{0.65}Na_{0.35}NbO_3$  หรือหมายเลข JCPDS คือ 77-0038 โดยมีโครงสร้างผลึกแบบมอโนคลินิก (monoclinic structure)



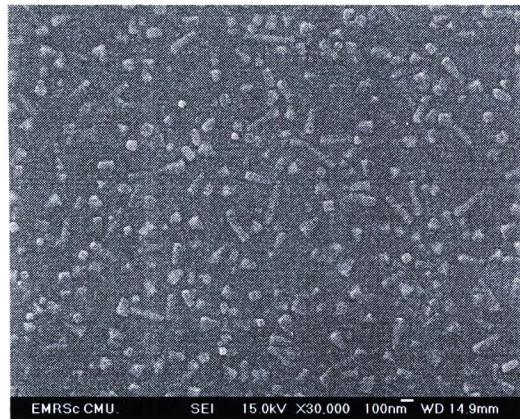
รูปที่ 4.29 แสดงรูปแบบการเดี้ยวนรังสีเอ็กซ์ของแก้วเซรามิกที่มีสิ่งเจือปนเพียงเล็กน้อยโดย หลอมเหลวกันคนละชุด และผ่านการปั๊กผลึกที่อุณหภูมิที่แตกต่างกัน (ก) คือชุดการ หลอมครั้งที่ 1 ; B1 (ข) คือชุดการหลอมครั้งที่ 2 ; B2

#### 4.3.2.4 ผลการศึกษาโครงสร้างทางจุลภาคด้วยเทคนิค FESEM-EDS

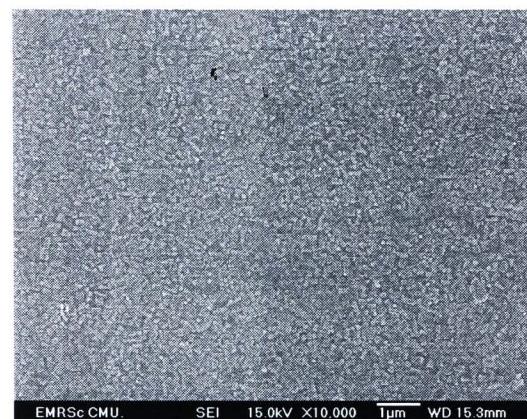
ผลการตรวจสอบลักษณะโครงสร้างทางจุลภาคของชิ้นงานแก้วเซรามิกโพแทสเซียม-โซเดียมในโอบектที่สารตั้งต้นที่มีสิ่งเจือปนเพียงเล็กน้อย และผ่านการหลอมเหลวที่อุณหภูมิ 1300 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลานาน 15 นาที โดยผ่านความร้อนเพื่อใช้ในการปลูกพลีกในแต่ละช่วง อุณหภูมิ เป็นเวลานาน 4 ชั่วโมง โดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดในโหมด scanning electron (SEI) ได้ผลดังที่แสดงในรูปที่ 4.30 ซึ่งจากการถ่ายภาพชิ้นงานแก้วเซรามิกที่ผ่านอุณหภูมิปลูกพลีกในช่วง 525, 550 และ 575 องศาเซลเซียส ด้วยกำลังขยาย 10,000 เท่า พบร่วมกับเกิดพลีกเด็กๆ จำนวนมากกระจายอยู่ทั่วบริเวณเนื้อแก้ว มีทั้งรูปทรงที่เป็นก้อนและทรงกระบอก และเมื่อทำการขยายภาพไปที่กำลังขยาย 30,000 พบร่วมกับพลีกที่เกิดขึ้นเหล่านี้มีรูปทรงเป็นเหลี่ยมนูน (equiaxed crystal) โดยมีความเป็นไปได้ที่พลีกที่เกิดขึ้นจะเป็นทรงกระบอกสี่เหลี่ยม ที่มีการวางแผนตัวทั้งแบบแนวนอนและแบบตั้งทำให้เกิดพลีกที่มีลักษณะคล้ายคิวบิกอยู่ นอกจากนี้พลีกที่เกิดขึ้นจะมีขนาดที่โตขึ้นตามอุณหภูมิที่ใช้ในการปลูกพลีก พลีกที่เกิดในชิ้นงานที่ผ่านอุณหภูมิ 525 องศาเซลเซียส จะพบว่ามีการกระจายตัวไม่หนาแน่นและพลีกนีขนาดเล็กในระดับนาโนเมตร ที่อุณหภูมิ 575 องศาเซลเซียส พบร่วมกับพลีกที่เกิดจะมีการเติบโตเต็มทั่วบริเวณชิ้นงาน และผลการศึกษาราดูองค์ประกอบด้วยเทคนิค EDS ตรวจพบธาตุองค์ประกอบของแก้วเซรามิกโพแทสเซียมโซเดียมในโอบект คือธาตุ K, Na, Nb, O และ Si ดังที่แสดงในรูปที่ 4.31



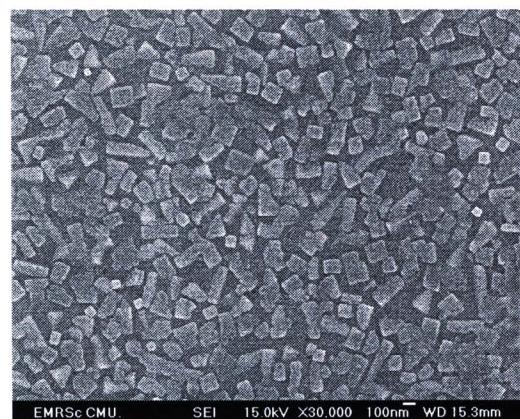
ก. 525 °C (10,000x)



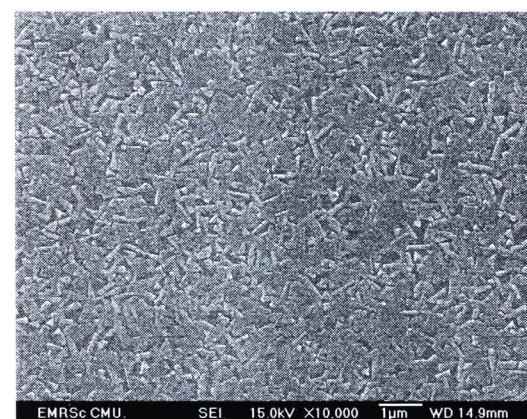
ก. 525 °C (30,000x)



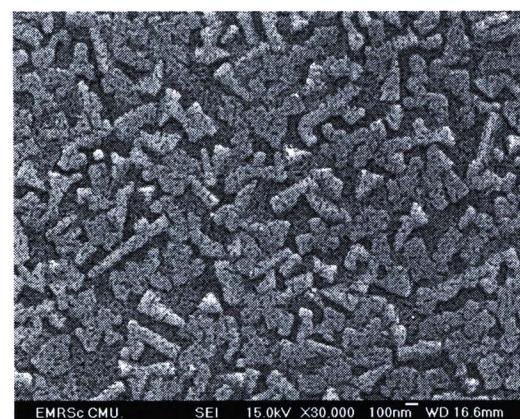
ก. 550 °C (10,000x)



ก. 550 °C (30,000x)

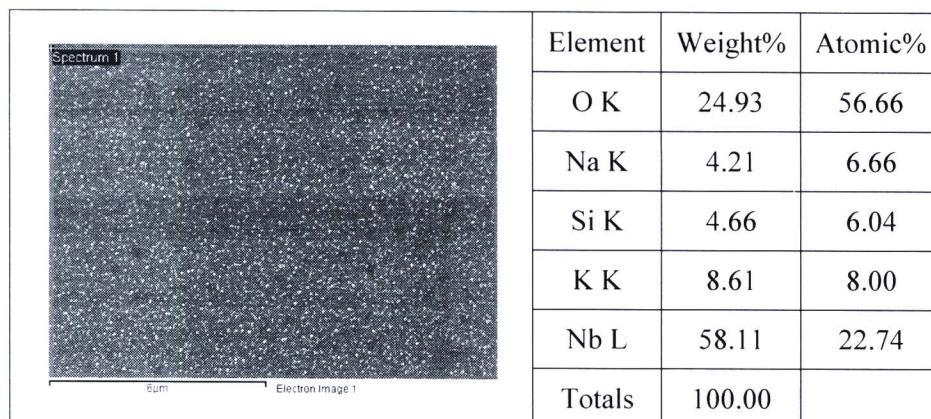


ก. 575 °C (10,000x)

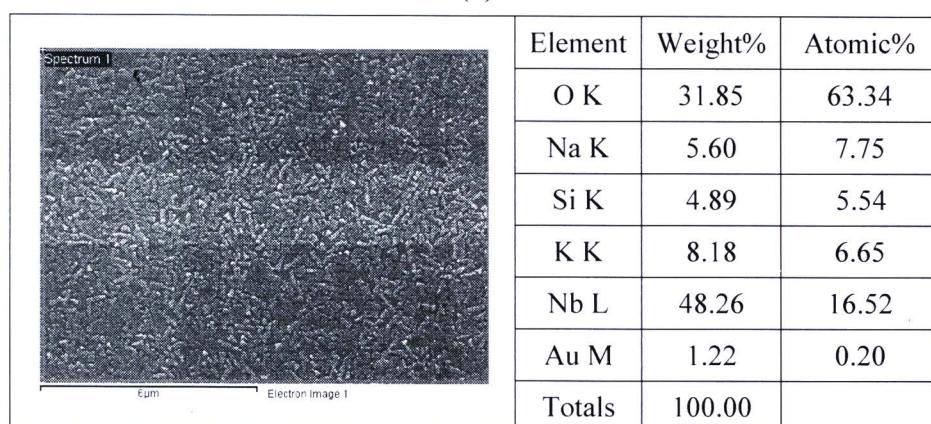


ก. 575 °C (30,000x)

**รูปที่ 4.30** แสดงการศึกษาโครงสร้างทางจุลภาคของชิ้นงานแก้วเซรามิก ได้จากสารตั้งต้นที่มีสิ่งเจือปนเพียงเล็กน้อยและผ่านกระบวนการทางความร้อนที่ช่วงอุณหภูมิที่แตกต่างกัน ด้วยกำลังขยาย 10,000 และ 30,000 เท่า



(ก)



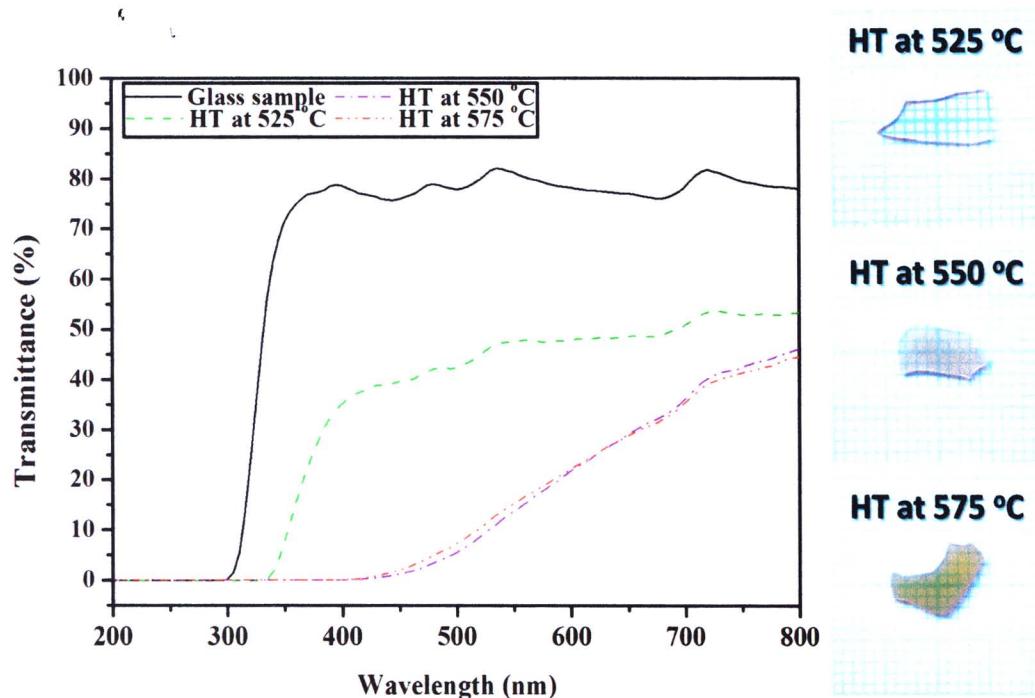
(ข)

รูปที่ 4.31 แสดงผลการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค EDS ของชิ้นงานแก้วเซรามิกได้จากสารตั้งต้นที่มีสิ่งเจือปนเพียงเล็กน้อยและผ่านกระบวนการทางความร้อน (ก) ผ่านความร้อนที่อุณหภูมิ 525 องศาเซลเซียส (ข) ผ่านความร้อนที่อุณหภูมิ 575 องศาเซลเซียส

#### 4.3.2.5 ผลการตรวจสอบสมบัติเชิงแสงด้วยเครื่องมือ UV-Vis และ refractometer

ผลที่ได้จากทดลองหาร้อยละการส่องผ่าน (%) Transmittance) ของชิ้นงานแก้วเซรามิกโพแทสเซียมโซเดียมในโอเบตที่สารตั้งต้นที่มีสิ่งเจือปนเพียงเล็กน้อยและผ่านการหลอมเหลวที่อุณหภูมิ 1300 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 15 นาที โดยผ่านความร้อนเพื่อใช้ในการปัลอกผลึกในแต่ละช่วงอุณหภูมิ เป็นเวลา นาน 4 ชั่วโมง จากรูปที่ 4.32 จะเห็นได้ว่าชิ้นงานที่ผ่านความร้อนเพื่อปัลอกผลึกตั้งแต่อุณหภูมิ 550 และ 575 องศาเซลเซียส จะมีลักษณะผุพุ่นขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับชิ้นงานที่ผ่านความร้อนเพื่อปัลอกผลึกที่อุณหภูมิ 525 องศาเซลเซียสที่จะโปรดังไกว่า สำหรับร้อยละการส่องผ่านของชิ้นงานที่รีบผุพุ่นแสงนั้น จะมีค่าอยู่ประมาณร้อยละ 30-40 และมีช่วงความยาวคลื่นที่แสงสามารถทะลุผ่านได้คือ 450 – 800 นาโนเมตรเป็นต้นไป ในขณะที่แก้วที่ยังไม่ร้อยละการส่องผ่านที่ยอดกว่าคือร้อยละ 40-50 และมีช่วงความยาวคลื่นที่แสงสามารถทะลุผ่านได้ตั้งแต่ 350 –

800 นาโนเมตร ซึ่งเป็นช่วงที่แสงขาว (visible light, 300 - 800 nm.) สามารถผ่านได้ ร้อยละการส่องผ่านของแสงของชิ้นงานจะลดลงเมื่ออุณหภูมิที่ใช้เพิ่มขึ้น ชิ้นงานที่เริ่มมีสีตามจากผลึกภายในชิ้นงานที่มีขนาดที่ใหญ่ขึ้น ทำให้เกิดการกระจายของแสงมากจนการหล่อผ่านของแสงเกิดขึ้นได้น้อย สอดคล้องกับผลที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วย SEM ชิ้นงานที่มีขนาดของผลึกที่เล็กในช่วง nano meter จะยอนให้แสงผ่านได้โดยการกระจายแสงเกิดได้น้อย ผลลัพธ์ทำให้ร้อยละการส่องผ่านมีค่าที่สูงตามไปด้วย สำหรับการผลการศึกษาค่าดัชนีการหักเหแสงของแก้วเซรามิกโพแทสเซียมโซเดียม ในโอบต์ที่สารตั้งต้นที่มีสิ่งเจือปนเพียงเล็กน้อยและผ่านความร้อนในการปลุกผลึกที่อุณหภูมิต่างๆ นี้พบว่ามีค่าที่ไม่แตกต่างกัน โดยมีค่าเท่ากับ 1.650

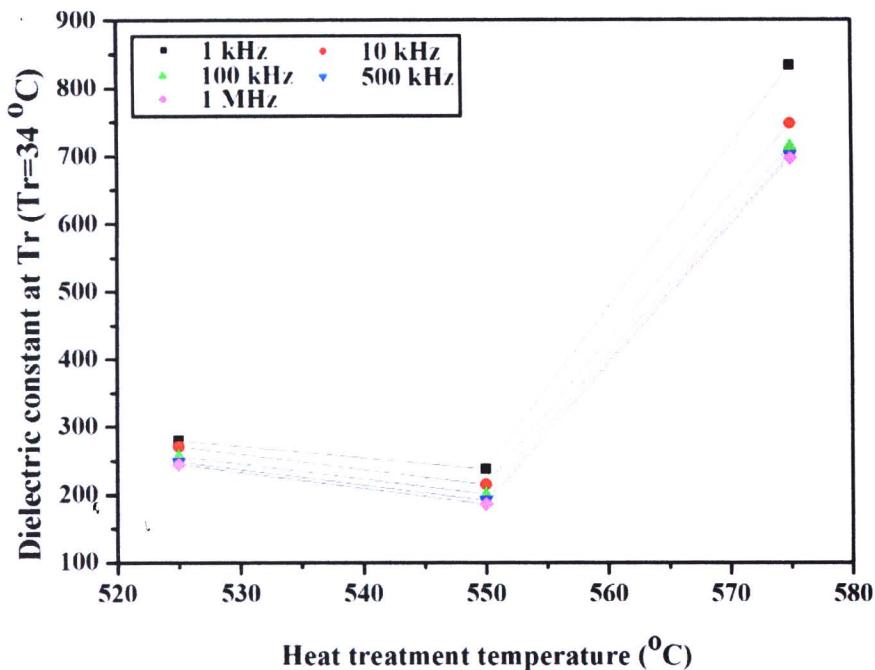


รูปที่ 4.32 แสดงร้อยละการส่องผ่านและค่าดัชนีหักเหแสงของแก้วเซรามิกที่ได้จากการตั้งต้นที่มีสิ่งเจือปนเพียงเล็กน้อย (B2) และผ่านกระบวนการทางความร้อนที่ช่วงอุณหภูมิที่แตกต่างกัน

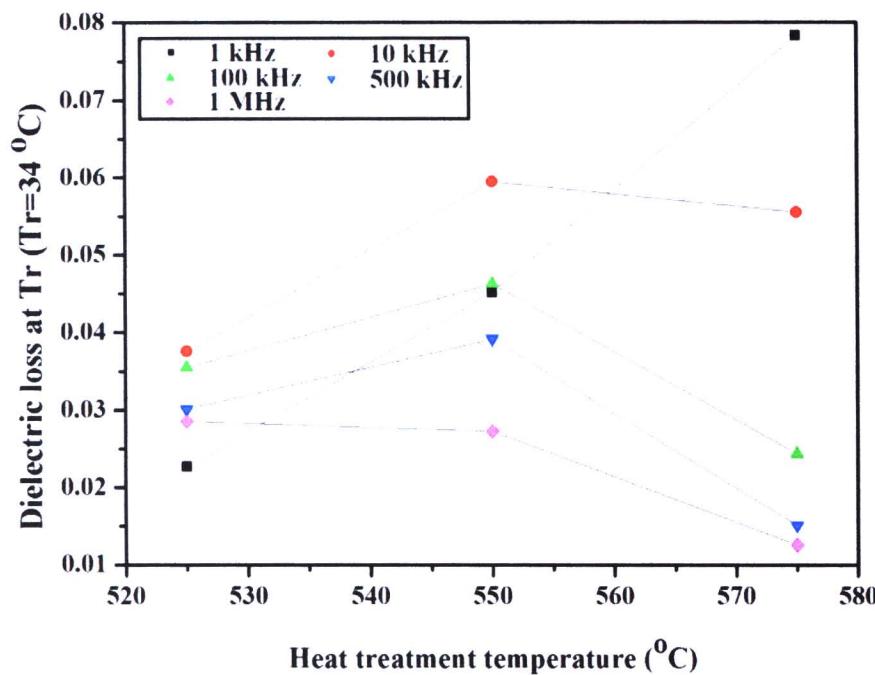
#### 4.3.2.6 ผลการตรวจสอบสมบัติทางไฟฟ้า

##### 1. สมบัติไฟอิเล็กทริก

ผลการตรวจสอบค่าคงที่ทางไฟอิเล็กทริก และค่าการสูญเสียไฟอิเล็กทริก ณ อุณหภูมิห้องของชิ้นงานแก้วเซรามิกโพแทสเซียมโซเดียมในโอเบตที่สร้างจากสารตั้งต้นที่มีสิ่งเจือปนเพียงเล็กน้อยและผ่านการหลอมเหลวที่อุณหภูมิ 1300 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 15 นาที โดยผ่านความร้อนเพื่อใช้ในการปลุกพลิกที่อุณหภูมิ 525, 550 และ 575 องศาเซลเซียส เป็นเวลา นาน 4 ชั่วโมง แสดงให้เห็นดังรูป 4.33 โดยเลือกความถี่ที่ต่างกันมาใช้ในการวิเคราะห์คือ 1, 10, 100, 500 kHz และ 1 MHz ตามลำดับพบว่าค่าคงที่ไฟอิเล็กทริกและค่าการสูญเสียทางไฟอิเล็กทริกจะมีการเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิที่ใช้ในการปลุกพลิก ที่อุณหภูมิ 525 ถึง 550 องศาเซลเซียส ชิ้นงานแก้วเซรามิกมีแนวโน้มของค่าไฟอิเล็กทริกที่ลดลง แต่จะเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นไปที่ 575 องศาเซลเซียส ในขณะที่ค่าการสูญเสียทางไฟอิเล็กทริกจะมีค่าที่เพิ่มขึ้นในช่วงอุณหภูมิ 525 ถึง 550 องศาเซลเซียสและจะลดลงที่อุณหภูมิ 575 องศาเซลเซียส โดยยังได้ทำการวัดค่าไฟอิเล็กทริกเทียบกับความถี่ค่า พบร่วมค่าทั้งสองจะลดลงตามความถี่ที่เพิ่มขึ้น จากนั้นได้ลองทำการวัดค่าคงที่ทางไฟอิเล็กทริก และค่าการสูญเสียไฟอิเล็กทริกเมื่ออุณหภูมิของชิ้นงานเปลี่ยนแปลงไป ดังจะเห็นในรูปที่ 4.34 จะเห็นได้ว่าในชิ้นงานแก้วเซรามิกโพแทสเซียมโซเดียมในโอเบตที่ปลุกพลิกที่อุณหภูมิที่แตกต่างกันจะมีค่าไฟอิเล็กทริกที่สูงเพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้น โดยค่าไฟอิเล็กทริกจะมีค่าที่สูงที่สุดในชิ้นงานแก้วเซรามิกที่ปลุกพลิกที่อุณหภูมิ 525 องศาเซลเซียส โดยมีค่าประมาณ 8,000 จากรูปจะสรุปคร่าวๆ ได้ว่าอุณหภูมิที่จะเกิดการเปลี่ยนเฟสของแก้ว (glass transition temperature,  $T_g$ ) ในแก้วเซรามิกโพแทสเซียมโซเดียมในโอเบตที่สร้างจากสารตั้งต้นที่มีสิ่งเจือปนเพียงเล็กน้อย (B1) นี้จะอยู่ในช่วง 450 จนกระทั่ง 500 องศาเซลเซียส ไปซึ่งผลที่ได้ก็สอดคล้องกับช่วงอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงเฟส ( $T_g$ ) ที่ได้ศึกษาไว้ด้วยเทคนิค DTA คล้ายคลึงกับผลที่ศึกษาได้จากแก้วชุด A1

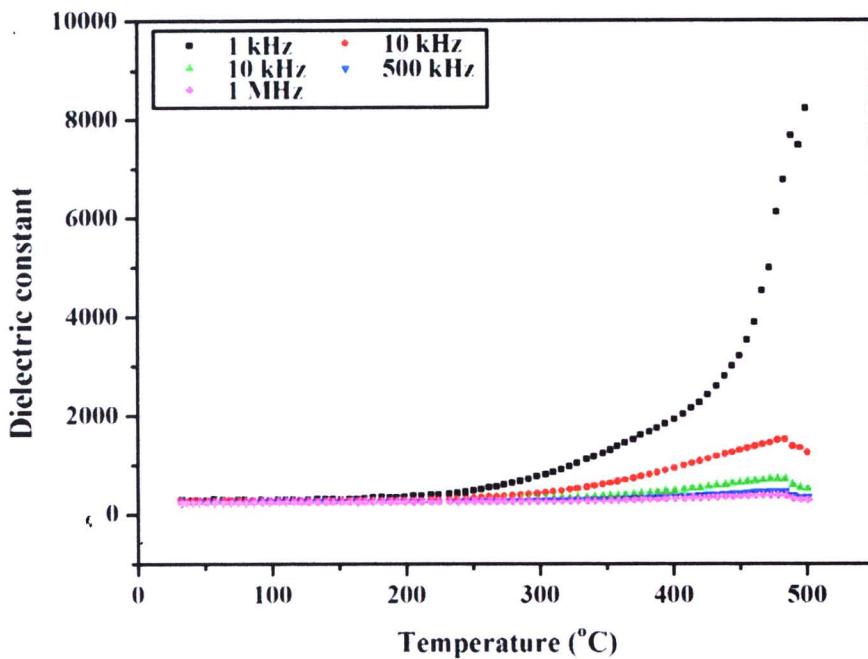


(n)

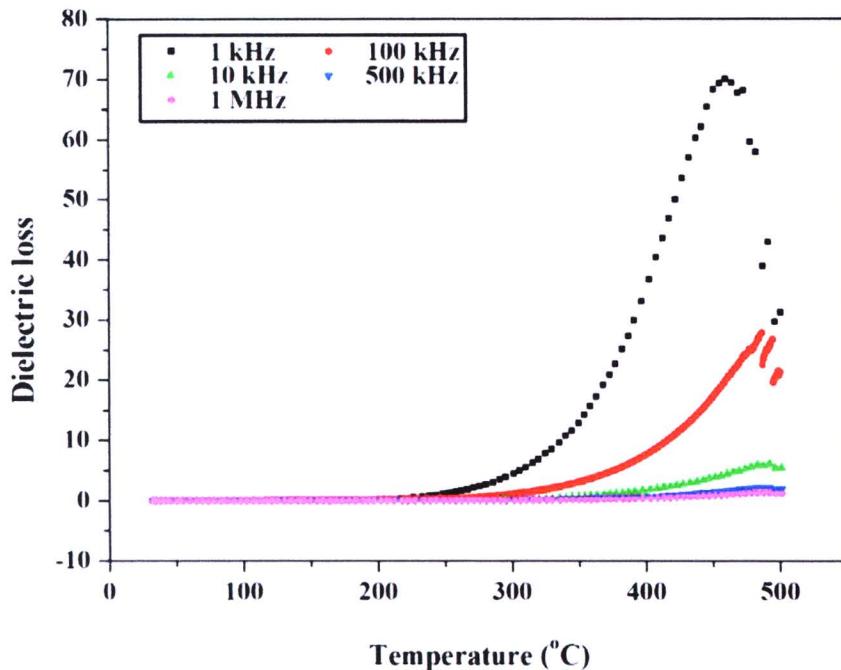


(u)

รูปที่ 4.33 แสดงค่าคงที่ไดอิเล็กทริก (ก) และค่าการสูญเสียทางไดอิเล็กทริก (ข) ณ อุณหภูมิห้องของแก้วเซรามิกที่ได้จากการตั้งต้นที่มีสิ่งเจือปนเพียงเล็กน้อยและผ่านกระบวนการทางความร้อน

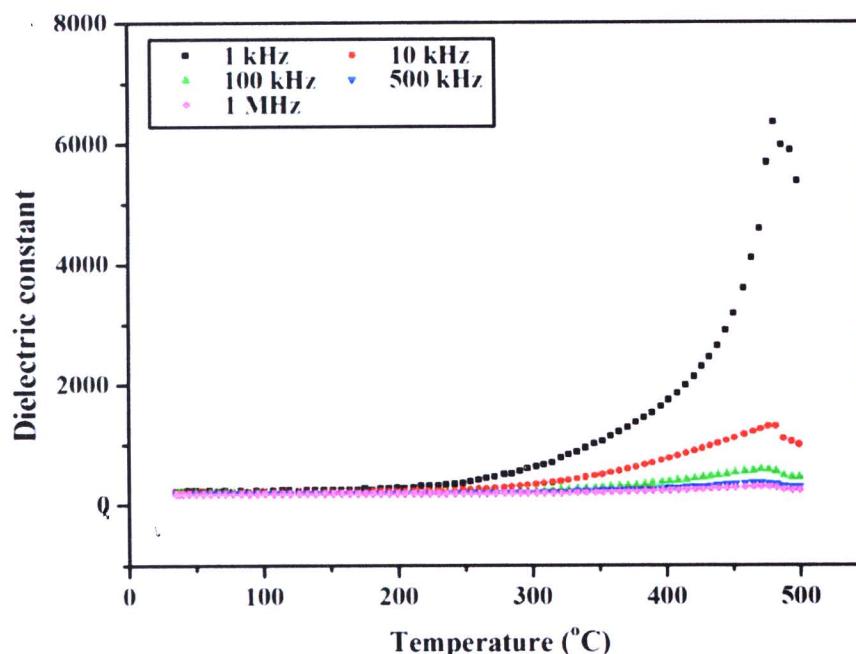


(g)

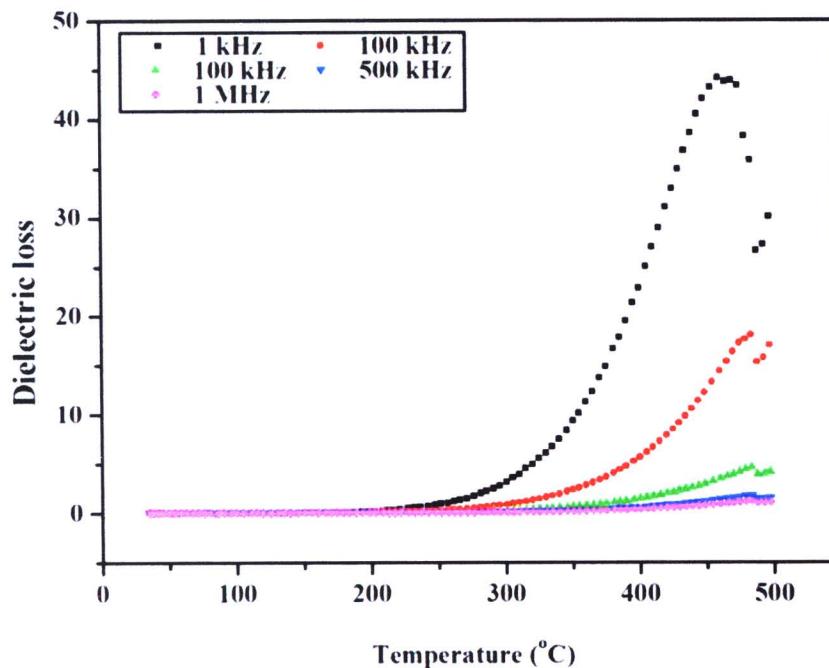


(h)

รูปที่ 4.34 แสดงค่าคงที่ไดอิเล็กทริก (ก) และค่าการสูญเสียทางไดอิเล็กทริก (ห) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ของแก้วเซรามิกที่ได้จากสารตั้งต้นที่มีสิ่งเจือปนเพียงเล็กน้อยและผ่านกระบวนการทางความร้อนที่อุณหภูมิ 525 องศาเซลเซียส

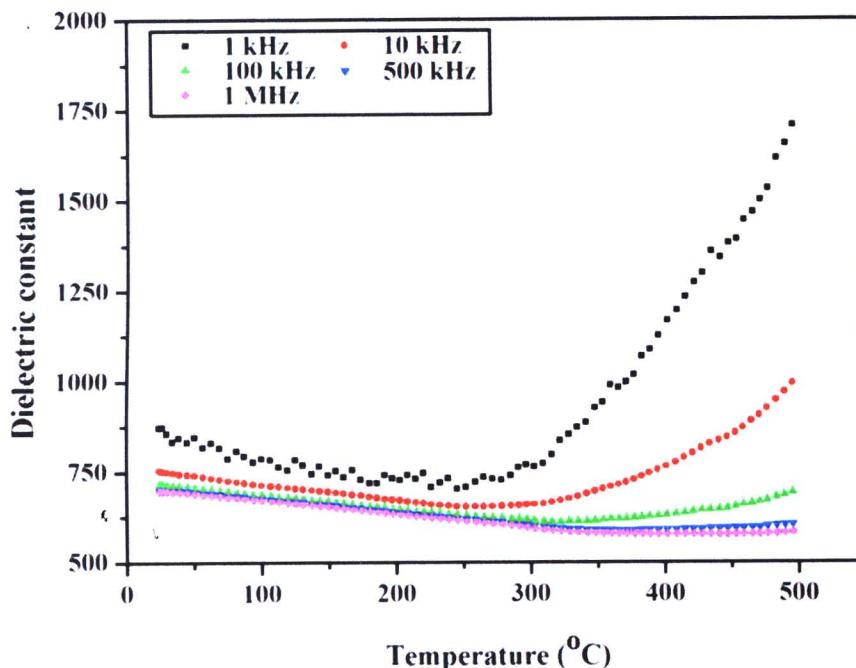


(n)

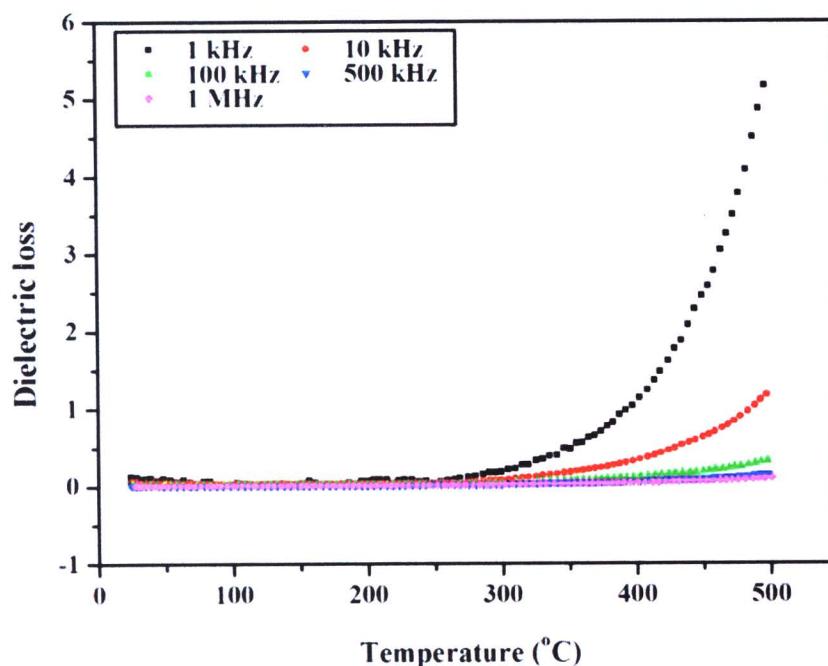


(u)

รูปที่ 4.34 (ต่อ) แสดงค่าคงที่ไอดิเล็กทริก (ก) และค่าการสูญเสียทางไอดิเล็กทริก (ข) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ของแก้วเซรามิกที่ได้จากสารตั้งต้นที่มีสิ่งเจือปนเพียงเล็กน้อยและผ่านกระบวนการทางความร้อนที่อุณหภูมิ 550 องศาเซลเซียส



(ก)

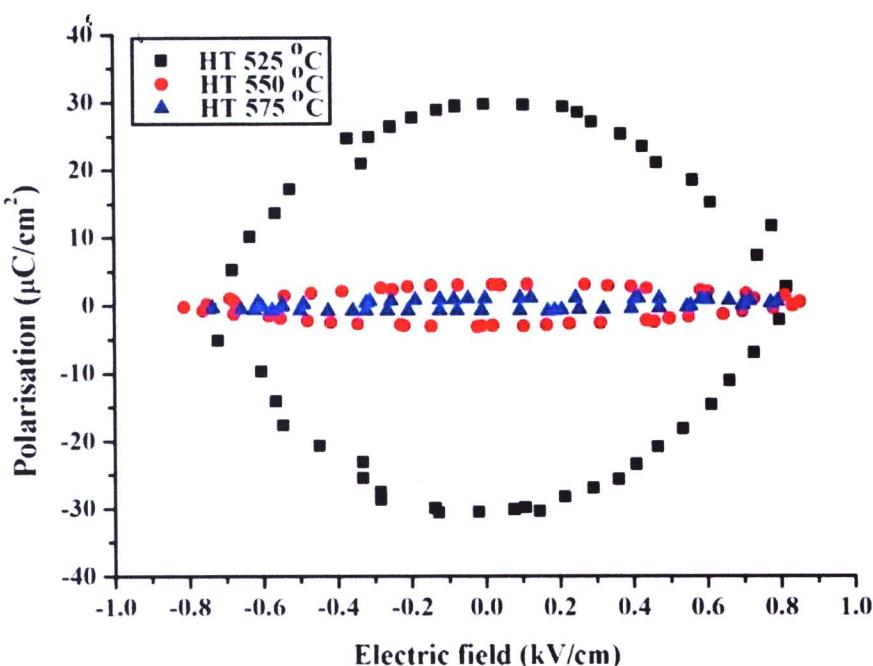


(ก)

รูปที่ 4.34 (ต่อ) แสดงค่าคงที่ไดอิเล็กทริก (ก) และค่าการสูญเสียทางไดอิเล็กทริก (ห) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ของแก้วเซรามิกที่ได้จากการตั้งต้นที่มีสิ่งเจือปนเพียงเล็กน้อย และผ่านกระบวนการทางความร้อนที่อุณหภูมิ 575 องศาเซลเซียส

## 2. สมบัติเฟอร์โรอิเล็กทริก

ผลการตรวจสอบสมบัติเฟอร์โรอิเล็กทริก ณ อุณหภูมิห้อง ของชิ้นงานแก้วเซรามิกโพแทสเซียมโซเดียม ในโอบเดที่สร้างจากสารตั้งต้นที่ไม่บริสุทธิ์ ซึ่งผ่านการหลอมเหลวที่อุณหภูมิ 1300 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 1 ชั่วโมง และผ่านความร้อนเพื่อใช้ในการปัลอกพลีกที่อุณหภูมิ 525, 550 และ 575 องศาเซลเซียส เป็นเวลานาน 4 ชั่วโมง โดยให้สนามไฟฟ้าเข้าไป 300 กิโลโวลต์ต่อเซนติเมตร ( $kV/cm$ ) เป็นระยะเวลา 1000 วินาที แสดงให้เห็นดังรูป 4.35 จากรูป วงชีสเทอเรอซิส (hyteresis loop) แสดงให้เห็นว่าสารชนิดนี้มีค่าการสูญเสีย (lossy capacitor) ที่สูง และไม่พบความเป็นเฟอร์โรอิเล็กทริกที่เด่นชัด คล้ายคลึงกับผลการทดลองที่ได้จากชุด A1



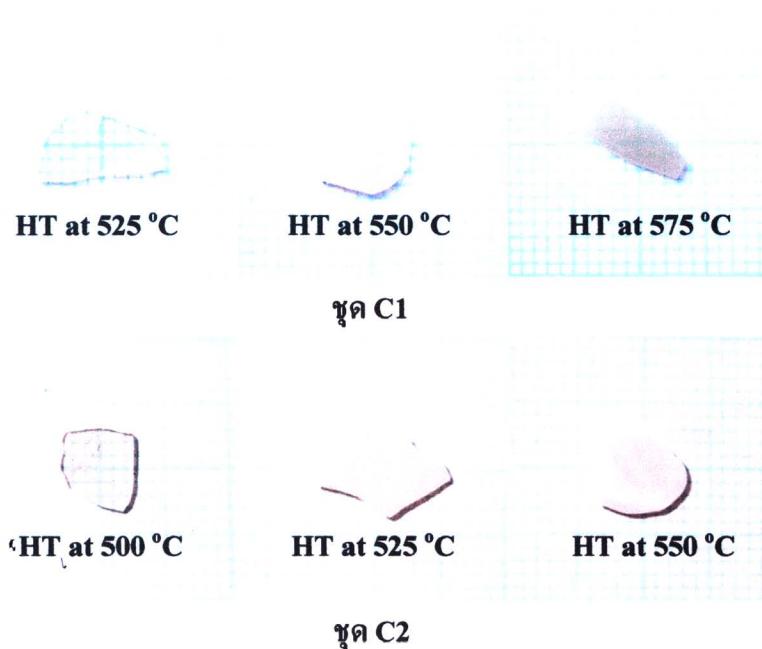
รูปที่ 4.35 แสดงวงชีสเทอเรอซิสของแก้วเซรามิกที่สร้างจากสารตั้งต้นที่มีสิ่งเจือปนเพียงเล็กน้อย และผ่านความร้อนเพื่อใช้ในการปัลอกพลีกที่อุณหภูมิ 525, 550 และ 575 องศาเซลเซียส เป็นเวลานาน 4 ชั่วโมง

### 4.3.3 ผลของการเตรียมแก้วเซรามิกที่ได้จากผงตั้งตันที่มีความบริสุทธิ์สูง (C)

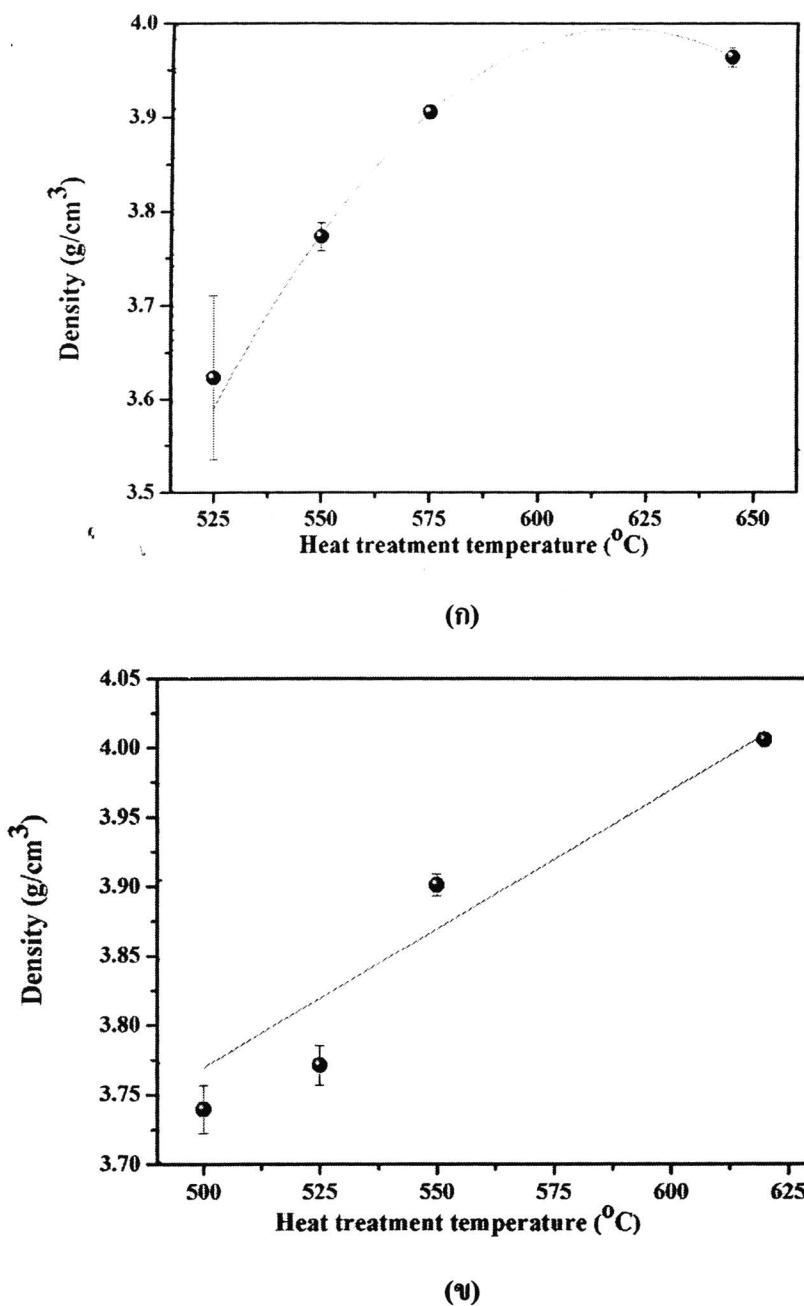
#### 4.3.3.1 ผลการตรวจสอบลักษณะทางกายภาพ

จากการทดลองห้องทึ่งในชุด A และ B ที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าในสารตั้งต้นโพแทสเซียม-โซเดียม ในโอบอेटที่มีสิ่งเจือปนน้อยสามารถสร้างระบบแก้วที่สามารถให้ความโปร่งใสและมีสมบัติทางడิอิเล็กทริกที่น่าสนใจได้ ในการทดลองต่อมา เมื่อสามารถเตรียมสารตั้งต้นโพแทสเซียม-โซเดียม ในโอบอेटที่มีความบริสุทธิ์สูงได้แล้ว จึงนำสารตั้งตันดังกล่าวมาสร้างระบบแก้วซิลิเกต (แทนสัญลักษณ์ด้วย C) โดยศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงปริมาณของโพแทสเซียม-โซเดียม ในโอบอेट โดยสามารถแบ่งระบบในการทดลองนี้ออกเป็นสองระบบคือระบบแก้วที่มีโพแทสเซียมโซเดียม ในโอบอे�ตร้อยละ 75 โดยโนล (ชุด C1) และระบบแก้วที่มีโพแทสเซียม-โซเดียม ในโอบอे�ตร้อยละ 80 โดยโนล (ชุด C2) ดังรูปที่ 4.36 ใน การเตรียมแก้วเซรามิกพบว่า สามารถสร้างแก้วที่มีความใสและออกสีเหลืองเล็กน้อยได้ หลังจากผ่านกระบวนการทางความร้อน หรือ heat treatment เพื่อทำการปลูกพลักในเนื้อแก้วที่อุณหภูมิต่างๆ ด้วยอัตราการเพิ่มขึ้นของ อุณหภูมิคือ 5 องศาเซลเซียสต่อนาทีและอัตราการลดลงของอุณหภูมิคือ 10 องศาเซลเซียสต่อนาที ระยะเวลาที่ใช้ในการเผาเซ็คคือ 4 ชั่วโมง พนวจชิ้นงานที่ได้มีความโปร่งแสงที่ลดลง จนกระทั่งที่ในที่สุด สามารถเพลิดเพลินที่เกิดขึ้นจากการเติบโตขึ้นตามอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นนั่นเอง การกระเจิงของ แสงจึงเกิดขึ้นได้มากจนกระทั่งแสงไม่สามารถทะลุผ่านชิ้นงานได้อันเป็นเหตุผลเช่นเดียวกันกับ ชิ้นงานชุด A และชุด B

เมื่อนำชิ้นงานมาหาความหนาแน่น โดยเทคนิคการแทนที่น้ำหรือที่เรียกว่าาร์คิมีดีส (Archimedes) พนวจชิ้นงานที่ได้จะมีแนวโน้มของความหนาแน่นที่เพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิที่ใช้ใน กระบวนการทางความร้อนเพื่อปลูกพลักเพิ่มสูงขึ้น ดังรูปที่ 4.37 ชุด C1 (ก) ชิ้นงานที่มีความ หนาแน่นที่สูงที่สุดคือชิ้นงานที่ผ่านกระบวนการร้อนที่อุณหภูมิ 645 องศาเซลเซียส โดยมีความหนาแน่น เท่ากับ  $3.96 \text{ g/cm}^3$  ส่วนชิ้นงานที่ผ่านกระบวนการร้อนที่ช่วงอุณหภูมิ 575, 550 และ 525 องศาเซลเซียส จะมีความหนาแน่นที่ลดลงตามลำดับคือ 3.91, 3.77 และ  $3.62 \text{ g/cm}^3$  และชุด C2 (ข) ชิ้นงานที่มี ความหนาแน่นที่สูงที่สุดคือชิ้นงานที่ผ่านกระบวนการร้อนที่อุณหภูมิ 620 องศาเซลเซียส โดยมีความ หนาแน่นเท่ากับ  $4.01 \text{ g/cm}^3$  ส่วนชิ้นงานที่ผ่านกระบวนการร้อนที่ช่วงอุณหภูมิ 550, 525 และ 500 องศา- เซลเซียส จะมีความหนาแน่นที่ลดลงคือ  $3.90$ ,  $3.77$  และ  $3.74 \text{ g/cm}^3$  ตามลำดับ



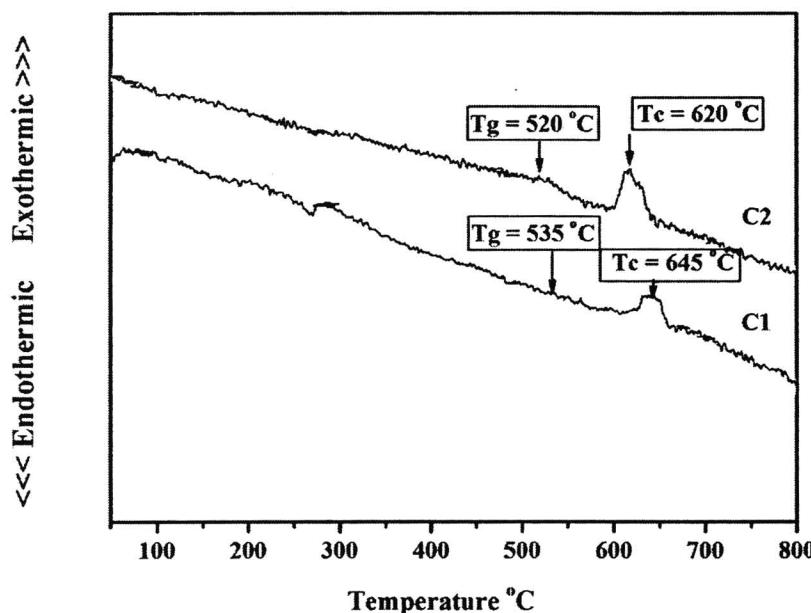
**รูปที่ 4.36** แสดงลักษณะทางกายภาพของชิ้นงานแก้วเซรามิกที่ได้จากสารตั้งต้นที่บริสุทธิ์และผ่านกระบวนการทางความร้อนที่ช่วงอุณหภูมิที่แตกต่างกัน ชุด C1 คือระบบแก้วที่มีโพแทสเซียมโซเดียมในโอเบตร้อยละ 75 โดยโมล และชุด C2 คือระบบแก้วที่มีโพแทสเซียมโซเดียมในโอเบตร้อยละ 80 โดยโมล



รูปที่ 4.37 แสดงความหนาแน่นของชิ้นงานแก้วเซรามิกที่ได้จากการตั้งค่าที่บริสุทธิ์และผ่านกระบวนการทางความร้อนที่ช่วงอุณหภูมิที่แตกต่างกัน (ก) ระบบแก้วที่มีโพแทสเซียม-โซเดียมในไอโอบาตร้อยละ 75 โดยโมล (C1) (ข) ระบบแก้วที่มีโพแทสเซียมโซเดียมในไอโอบาตร้อยละ 80 โดยโมล (C2)

#### 4.3.3.2 ผลการวิเคราะห์ทางความร้อนด้วยเทคนิค DTA และ TG-DSC

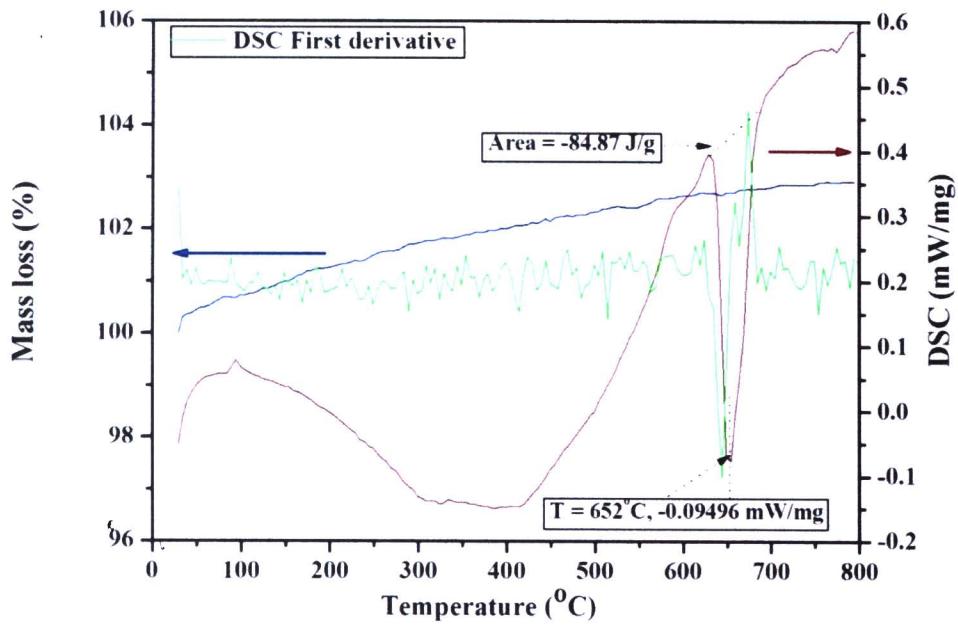
จากการวิเคราะห์เชิงความร้อนด้วยเทคนิค DTA โดยมีเงื่อนไขของอุณหภูมิที่ใช้ในการศึกษาคือช่วงอุณหภูมิห้องคือประมาณ 30 องศาเซลเซียส ไปจนถึงที่อุณหภูมิประมาณ 800 องศาเซลเซียส ด้วยอัตราการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิคือ 5 องศาเซลเซียสต่อนาที และใช้ซิลิกา ( $\text{SiO}_2$ ) เป็นตัวเทียบมาตรฐาน ทำให้ทราบถึงรูปแบบการเปลี่ยนแปลงเฟสของแก้วเซรามิกดังรูปที่ 4.38 ในแก้วเซรามิกชุด C1 และ C2 จะมีจุดที่แสดงการขยายพัลงงานของแก้วเซรามิกอยู่ที่อุณหภูมิที่ 645 และ 620 องศาเซลเซียสตามลำดับ พิกัดที่เกิดขึ้นแสดงถึงช่วงอุณหภูมิที่แก้วเกิดการแตกผลึก ( $T_c$ ) จากกราฟ อุณหภูมิที่เกิดการเปลี่ยนเฟสภายในแก้วเซรามิก ชุด C1 และ C2 ก็คือที่ช่วงอุณหภูมิเท่ากับ 535 และ 520 องศาเซลเซียส สอดคล้องกับลักษณะชิ้นงานแก้วเซรามิกทั้งชุด C1 และ C2 คือจะเริ่มบุบเมื่อให้ความร้อนเพื่อปลูกผลึกที่อุณหภูมิ 550 และ 525 องศาเซลเซียส เนื่องจากมีผลึกเกิดขึ้นภายในชิ้นงานแล้วนั่นเอง



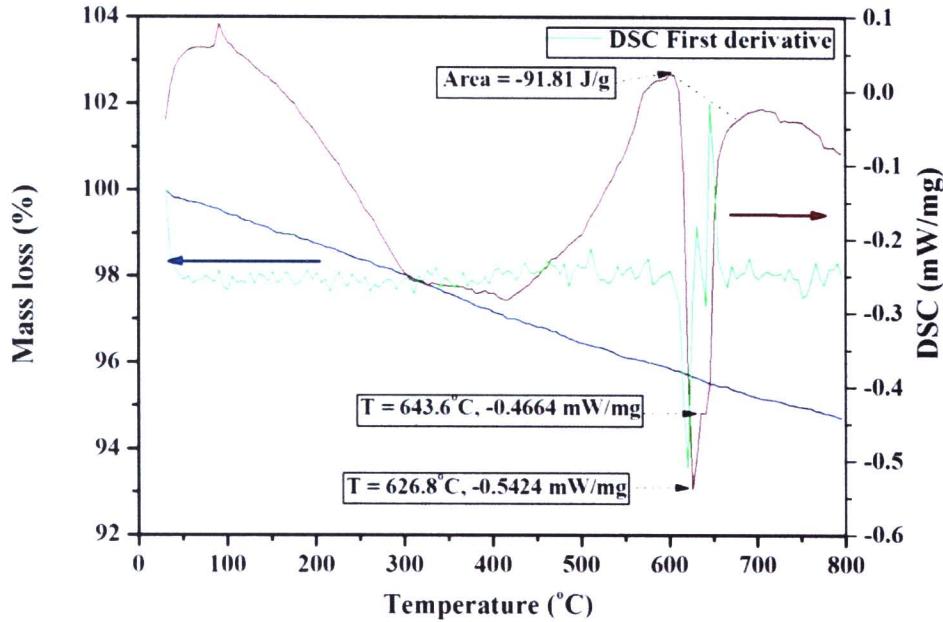
รูปที่ 4.38 แสดงผลการวิเคราะห์ทางความร้อนด้วยเทคนิค DTA ของแก้วเซรามิกชุด C1 และชุด C2 ที่ได้จากการตั้งต้นที่บริสุทธิ์สูง

จากการวิเคราะห์ทางความร้อนเชิงพัลงงาน TG-DSC เพื่อยืนยันกับผลการศึกษาด้วยเทคนิค DTA เป็นการดูการเปลี่ยนแปลงเฟสของแก้วเซรามิกโดยมีเงื่อนไขของอุณหภูมิที่ใช้ในการศึกษาคือช่วงอุณหภูมิห้องคือประมาณ 30 องศาเซลเซียส ไปจนถึงที่อุณหภูมิประมาณ 800

องค่าเซลเซียส ด้วยอัตราการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิคือ 10 องค่าเซลเซียสต่อนาที พนลักษณะการเปลี่ยนแปลงของพลังงานได้ดังรูป 4.39 (ก) และ (ข) จากรูปที่ 4.39 (ก) เป็นผลการวิเคราะห์ที่ได้จากชุด C1 หรือระบบแก้วเซรามิกที่มีโพแทสเซียมโซเดียมในโอบอต้อยละ 75 โดยโนล จากราฟพบว่าที่อุณหภูมิเท่ากับ 652 องค่าเซลเซียส ชิ้นงานจะมีการเปลี่ยนแปลงเฟสเกิดขึ้นและเกิดการขยายความร้อนเท่ากับ  $0.09496 \text{ mW/mg}$  ผลการสูญเสียของมวลมีลักษณะที่เพิ่มขึ้นอาจเกิดจากความผิดพลาดของเครื่อง เนื่องจากมวลไม่สามารถเพิ่มขึ้นได้ ส่วนรูปที่ 4.40 (ข) เป็นผลการวิเคราะห์ที่ได้จากชุด C2 หรือระบบแก้วเซรามิกที่มีโพแทสเซียมโซเดียมในโอบอต้อยละ 80 โดยโนล พบว่ามีการเปลี่ยนเฟสเป็นสองชนิดดังจะเห็นได้จากราฟว่าจุดแรกที่ชิ้นงานเกิดการเปลี่ยนเฟสคือที่อุณหภูมิเท่ากับ 626.8 องค่าเซลเซียส และจุดที่สองคือที่ 643.6 องค่าโดยเกิดลักษณะของการถูกความร้อนเท่ากับ  $0.5424$  และ  $0.4664 \text{ mW/mg}$  ตามลำดับ สำหรับพื้นที่เกิดขึ้นที่อุณหภูมิประมาณ 110 องค่าเซลเซียสนั้นเกิดขึ้นมาจากชิ้นงานมีการถูกความร้อนเนื่องมาจากการชื้นภายใน จากราฟการสูญเสียของมวล มวลของชิ้นงานในชุด C2 จะเกิดแบบค่อยเป็นค่อยไป เมื่อถึงอุณหภูมิ 800 องค่าเซลเซียสจะพบว่ามีการสูญเสียของมวลเพียง  $94.5\%$  ลดลงเพียงเล็กน้อยเนื่องจากอะตอมบางส่วนได้หลุดออกไปในสัดส่วนที่เท่าๆ กัน



(n)

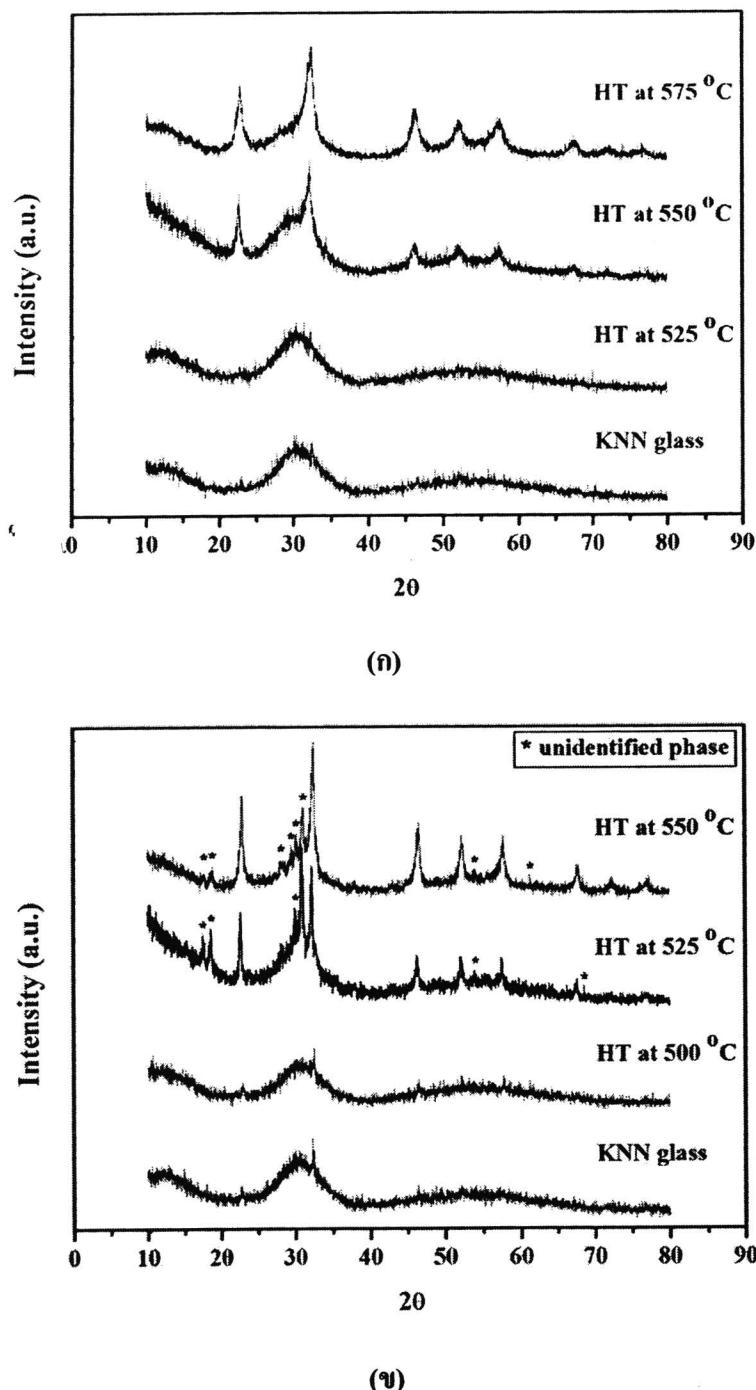


(u)

รูปที่ 4.39 (ก) แสดงผลการวิเคราะห์เชิงพลังงานด้วยเทคนิค TG-DSC ของแก้วเซรามิกที่ได้จากการตั้งต้นบริสุทธิ์ชุด C1 (ข) แสดงผลการวิเคราะห์เชิงพลังงานด้วยเทคนิค TG-DSC ของแก้วเซรามิกที่ได้จากการตั้งต้นบริสุทธิ์ชุด C2

#### **4.3.3.3 ผลการตรวจสอบเฟสองค์ประกอบด้วยเทคนิค XRD**

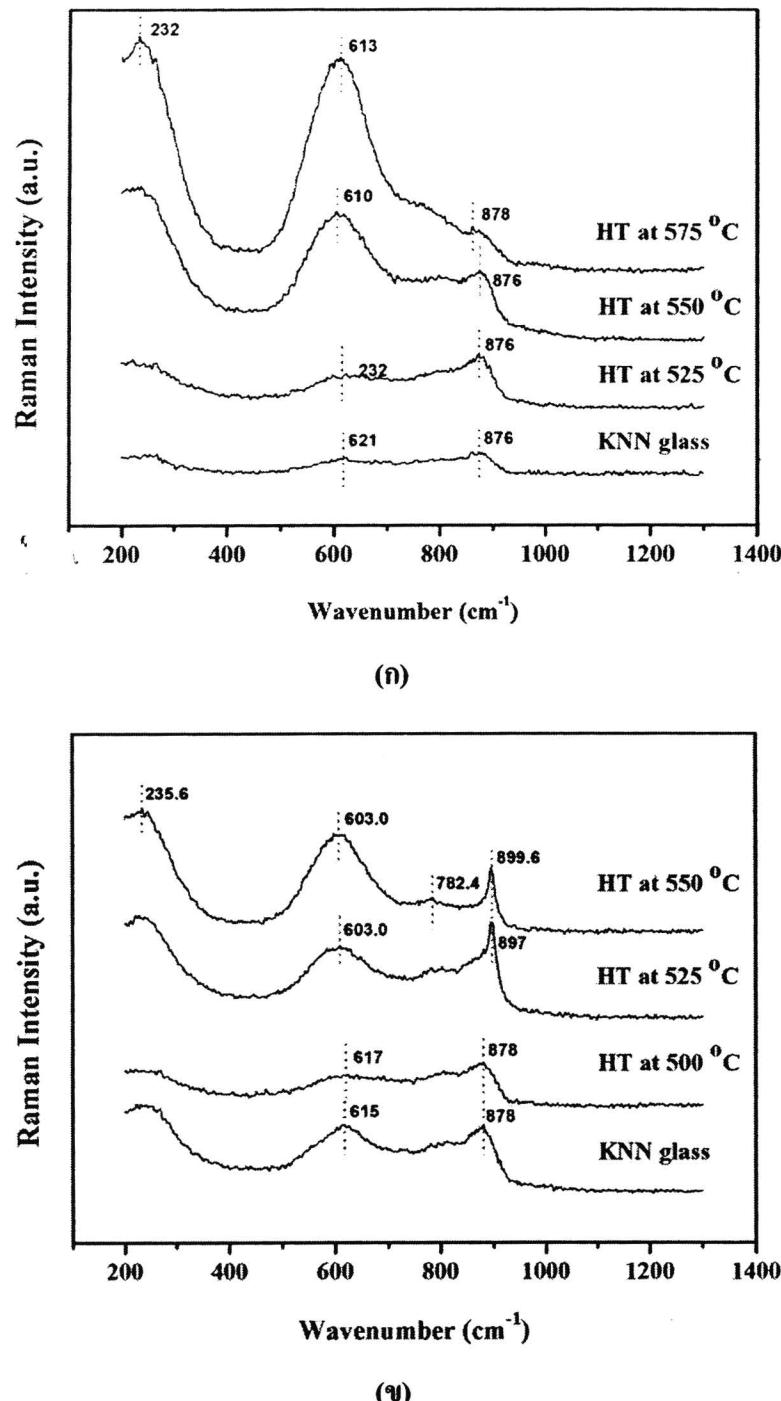
จากการตรวจสอบเฟสองค์ประกอบของผงแก้วที่ได้จากการตั้งต้นที่บริสุทธิ์ หรือชุด C1 และ C2 นี้ด้วยเทคนิค XRD เป็นดังรูป 4.40 ในชุด C1 (ก) หรือระบบแก้วเซรามิกที่มีโพแทสเซียมโซเดียมในโอเบต ร้อยละ 75 โดยโนลนั้นพบว่ามีความคล้ายคลึงกับชิ้นงานแก้วเซรามิกชุด A1 และ B1 คือชิ้นงานแก้วที่ยังไม่ผ่านกระบวนการทางความร้อน และชิ้นงานที่ผ่านการใช้ความร้อนในช่วงอุณหภูมิ 525 และ 550 องศาเซลเซียส จะแสดงลักษณะความเป็นอสัมฐานส่วนใหญ่ คือไม่มีความเป็นผลึกเกิดขึ้นภายในเนื้อแก้ว ในช่วงอุณหภูมิ 525 และ 550 องศาเซลเซียส จะตรวจพบพิคของเฟสองค์ประกอบเล็กน้อยปรากฏที่มุม 2θ เท่ากับ 23 และ 32 องศา ที่อุณหภูมิ 575 องศาเซลเซียส ปรากฏเฟสของโพแทสเซียมโซเดียมในโอเบต ชุด JCPDS พบว่าเฟสที่เกิดขึ้นมีความสอดคล้องกับเฟสของโพแทสเซียมโซเดียมในโอเบต  $K_{0.65}Na_{0.35}NbO_3$  หรือ หมายเลข JCPDS คือ 77-0038 โดยมีโครงสร้างผลึกแบบ monoclinic structure ในชุด C2 (ข) หรือระบบแก้วเซรามิกที่มีโพแทสเซียมโซเดียมในโอเบต ร้อยละ 80 โดยโนลนั้นพบว่าเกิดพิคที่ไม่สามารถระบุได้ (unidentified phase) เกิดขึ้นตั้งแต่อุณหภูมิ 525 องศาเซลเซียสเป็นต้นมา ซึ่งเกิดพร้อมกับเฟสของโพแทสเซียมโซเดียมในโอเบต ซึ่งอาจเกิดจากการทำพันธะของเฟสอื่น อาทิ Na – Si หรือ K – Si ที่จับกัน



รูปที่ 4.40 แสดงรูปแบบการเดี่ยวนนรังสีเอ็กซ์ของแก้วเซรามิกที่ได้จากการตั้งค่าน้ำมันริสุทธิ์และผ่านกระบวนการทางความร้อนที่ช่วงอุณหภูมิที่แตกต่างกัน ชุด C1 (ก) คือระบบแก้วที่มีโพแทสเซียมโซเดียมในโอบต ร้อยละ 75 โดยโมล และชุด C2 (ข) คือระบบแก้วที่มีโพแทสเซียมโซเดียมในโอบต ร้อยละ 80 โดยโมล

#### 4.3.3.4 ผลการตรวจสอบสมบัติทางสเปกโทรสโคปี

ผลการตรวจสอบสมบัติทางสเปกโทรสโคปีด้วยเครื่องรaman (Raman spectroscopy) ของชิ้นงานแก้วเซรามิกที่ได้จากการตั้งต้นที่บริสุทธิ์และผ่านกระบวนการทางความร้อนที่ช่วงอุณหภูมิที่แตกต่างกัน โดยจะพนแplanของการสั่น (vibration band) ตั้งแต่  $200 - 1000 \text{ cm}^{-1}$  พนว่าแก้วที่เตรียมได้จะมีพีคของรamanสเปกตรัมเกิดขึ้นในคลาบรอยช่วงเลขคู่ (wavenumber) และมีลักษณะที่ไม่แตกต่างกันมากนักดังที่แสดงในรูปที่ 4.41 ในรูป 4.41 (ก) แสดงผลการตรวจสอบสมบัติทางสเปกโทรสโคปีของแก้วชุด C1 พนว่าที่เลขคู่นี้เท่ากับ  $230 \text{ cm}^{-1}$  จะเกิดการคัดโคงของพันธะ O-Nb-O ในช่วง  $618 \text{ cm}^{-1}$  และถึงการทำพันธะระหว่างโพแทสเซียมโซเดียมในโอเบตภายในโครงสร้างของไนโอลีบิมออกตรารอยที่มีการจับกันของพันธะซึ่งจะเกิดการยืดตัวออกของ O-Nb-O อย่างไรก็ตาม ช่วงบริเวณ  $700 - 800 \text{ cm}^{-1}$  จะแสดงการยืดตัวอย่างสมมาตรของ Si-O-Si เช่นกัน สุดท้ายช่วงบริเวณ  $800 - 900 \text{ cm}^{-1}$  จะแสดงให้เห็นการเชื่อมต่อ กันของไนโอลีบิมออกตรารอย การเกิดพีคของรamanในช่วงระหว่าง  $800 - 900 \text{ cm}^{-1}$  จะแสดงถึงพันธะของไนโอลีบิมออกตรารอย ( $\text{NbO}_6$ ) ที่มีออกซิเจน (non-bridging oxygen) ที่ไม่ได้ทำพันธะอยู่ จึงเกิดบิดเบี้ยวของโครงสร้างมาก ส่วนพีคที่เกิดขึ้น ณ  $600 - 800 \text{ cm}^{-1}$  จะไม่มีออกซิเจนที่ไม่ได้ทำพันธะอยู่ในโครงสร้าง จึงไม่มีการบิดเบี้ยว จากการไฟฟ้าเห็นได้ว่าการบิดเบี้ยวของโครงสร้างเกิดมาก เมื่ออุณหภูมิที่ใช้ในการปลุกพลิกต่ำ แก้วจะมีความเป็นอัลตราสูง แต่เมื่ออุณหภูมิในการปลุกพลิกสูงขึ้นการบิดเบี้ยวของโครงสร้างจะเกิดน้อยลงและมีความเป็นพลิกเพิ่มสูงขึ้น สำหรับรูปที่ 4.41 (ข) จะแสดงผลการตรวจสอบสมบัติทางสเปกโทรสโคปีของแก้วชุด C2 พนว่าในชุด C2 ไม่มีความแตกต่างกับชุด C1 มากนัก แต่ในช่วงเลขคู่นี้เท่ากับ  $890 \text{ cm}^{-1}$  จะพบการเกิดพันธะใหม่สอดคล้องกับผลที่ได้จากเทคนิค XRD ซึ่งพบเฟสที่ยังไม่สามารถระบุได้ จากการวิเคราะห์พีคที่สูงขึ้นเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นนี้อาจเป็นผลมาจากการบิดเบี้ยวของโครงสร้างในไนโอลีบิมออกตรารอย เพราะเกิดออกซิเจนที่ไม่ได้ทำพันธะด้วยจำนวนมาก เกิดเป็นเฟสใหม่ภายในแก้วเซรามิกโพแทสเซียมโซเดียมในโอเบต

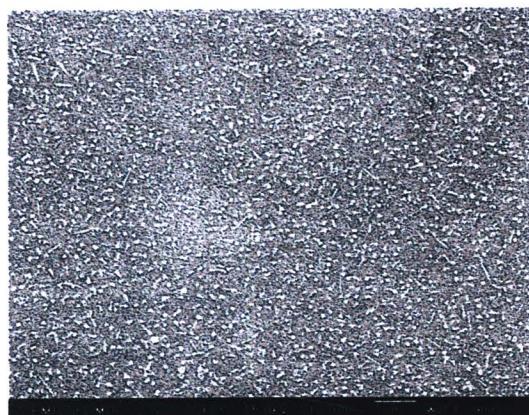
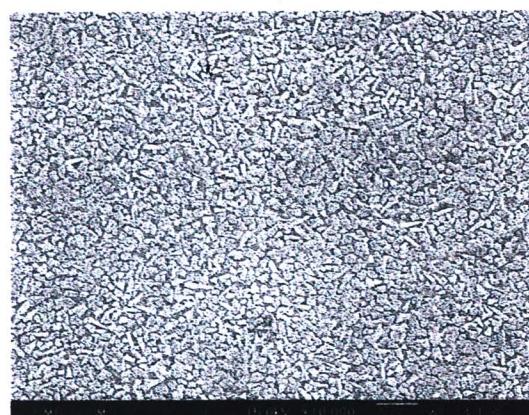
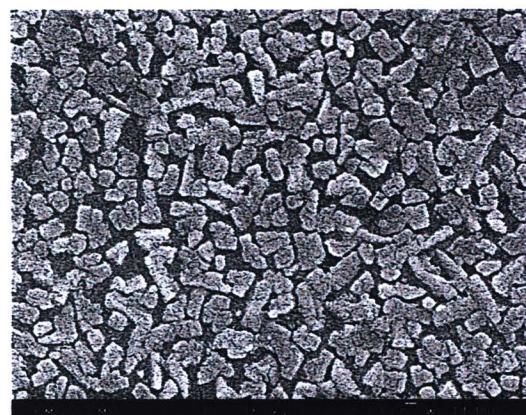


**รูปที่ 4.41** แสดงรูปแบบของรaman สเปกตรัมของแก้วเซรามิกชุด C1 ที่ได้จากการตั้งค่าที่บริสุทธิ์ และผ่านกระบวนการทางความร้อนที่ช่วงอุณหภูมิที่แตกต่างกัน ชุด C1 (ก) คือระบบแก้วที่มีโพแทสเซียมโซเดียม ในโอมเบอร์อยู่ 75 โดยโมล และชุด C2 (ข) คือระบบแก้วที่มีโพแทสเซียมโซเดียม ในโอมเบอร์อยู่ 80 โดยโมล

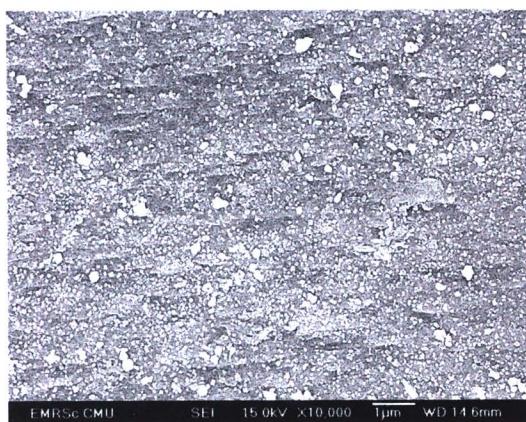


#### 4.3.3.5 ผลการศึกษาโครงสร้างทางอุลกาคด้วยเทคนิค FESEM-EDS

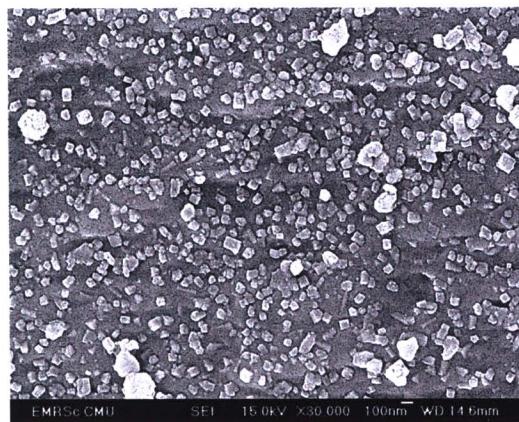
ผลการตรวจสอบลักษณะโครงสร้างทางอุลกาคของชิ้นงานแก้วเซรามิกโพแทสเซียม-โซเดียมในโอบอตที่สารตั้งต้นที่ไม่บริสุทธิ์ และผ่านการหลอมเหลวที่อุณหภูมิ 1300 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลานาน 15 นาที โดยผ่านความร้อนเพื่อใช้ในการปัลกพลีกในแต่ละช่วงอุณหภูมิ เป็นเวลานาน 4 ชั่วโมง โดยใช้กล้องจุลทรรศน์แบบส่องกราดในโหมด scanning electron (SEI) ได้ผลดังที่แสดงในรูปที่ 4.42 (ก) และ (ข) ซึ่งจากการถ่ายภาพชิ้นงานแก้วเซรามิกที่ผ่านอุณหภูมิปัลกพลีกต่างๆ ทั้งสองชุด ด้วยกำลังขยาย 20,000 เท่า พบร่วมกับผลลัพธ์เด็กๆ จำนวนมากกระจายอยู่ทั่วบริเวณเนื้อแก้ว และเมื่อทำการขยายภาพไปที่กำลังขยาย 50,000 พบร่วมกับผลลัพธ์เด็กขึ้นเหล่านี้มีรูปทรงเป็นเหลี่ยมนูม (equiaxial crystal) ผลลัพธ์เด็กขึ้นจะมีขนาดที่โตขึ้นตามอุณหภูมิที่ใช้ในการปัลกพลีก พลีกที่เกิดในชิ้นงานที่ผ่านอุณหภูมิปัลกพลีกต่างๆ สุดจะพบว่ามีการกระจายตัวไม่หนาแน่นและพลีกมีขนาดเล็กในระดับนาโนเมตร ที่อุณหภูมิปัลกพลีกที่สูงที่สุดจะพบว่าผลลัพธ์เด็กที่เกิดเดินโดยเด่นทั่วบริเวณชิ้นงาน ผลการศึกษาธาตุองค์ประกอบด้วยเทคนิค EDS ตรวจพบธาตุองค์ประกอบของแก้วเซรามิกโพแทสเซียมโซเดียมในโอบอต คือธาตุ K, Na, Nb, O และ Si ในปริมาณร้อยละที่ไม่แตกต่างกันมากนักในแต่ละชุดการให้ความร้อนเพื่อปัลกพลีกตามลำดับ ดังที่แสดงในรูป 4.43

ก.  $525\text{ }^{\circ}\text{C}$  (10,000x)ก.  $525\text{ }^{\circ}\text{C}$  (30,000x)ก.  $550\text{ }^{\circ}\text{C}$  (10,000x)ก.  $550\text{ }^{\circ}\text{C}$  (30,000x)ก.  $575\text{ }^{\circ}\text{C}$  (10,000x)ก.  $575\text{ }^{\circ}\text{C}$  (30,000x)

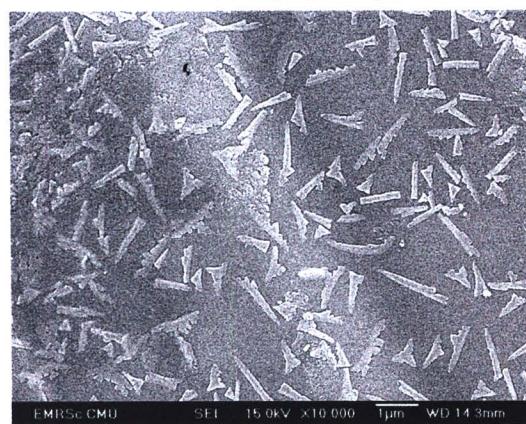
**รูปที่ 4.42** แสดงการศึกษาโครงสร้างทางจุลภาคของชิ้นงานแก้วเซรามิกชุด C1 ได้จากการตั้งต้นที่บริสุทธิ์และผ่านกระบวนการทางความร้อนที่ช่วงอุณหภูมิที่แตกต่างกัน ด้วยกำลังขยาย 10,000 และ 30,000 เท่า



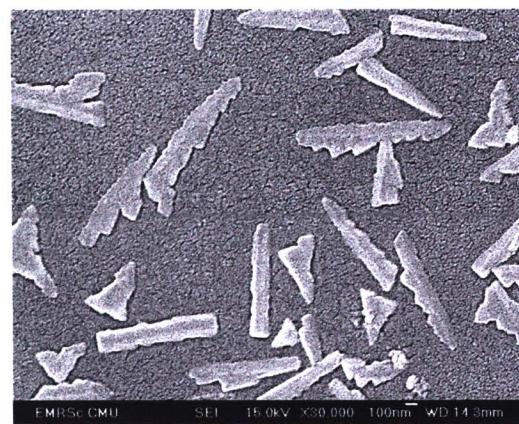
ก. 525 °C (10,000x)



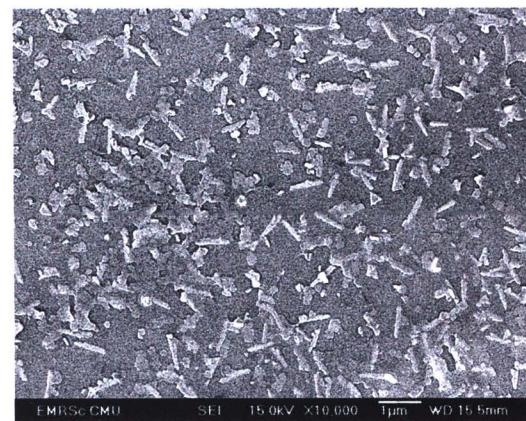
ก. 525 °C (30,000x)



ก. 550 °C (10,000x)



ก. 550 °C (30,000x)

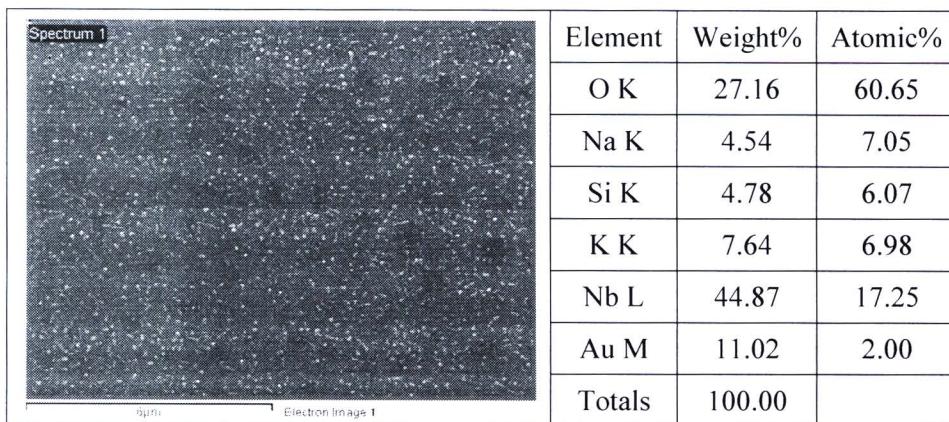


ก. 575 °C (10,000x)

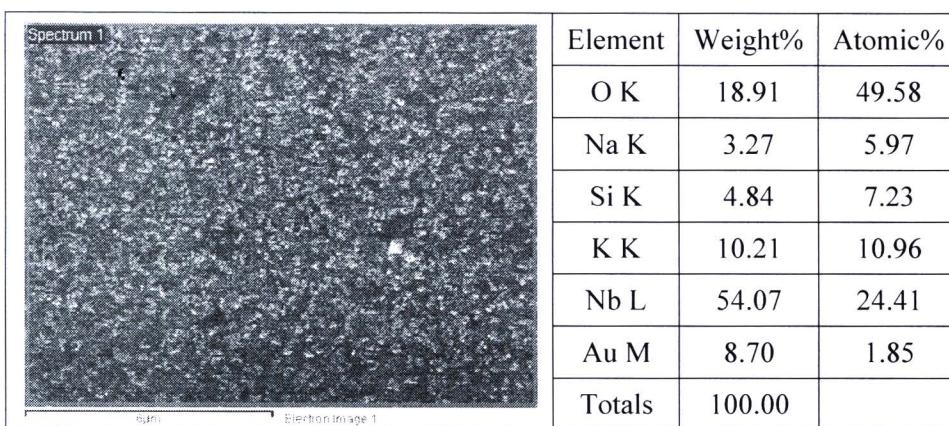


ก. 575 °C (30,000x)

**รูปที่ 4.42 (ต่อ) และการศึกษาโครงสร้างทางชุลภาคของชิ้นงานแก้วเซรามิกซุ่ด C2 ได้จากการตั้งต้นที่บริสุทธิ์และผ่านกระบวนการทางความร้อนที่ช่วงอุณหภูมิที่แตกต่างกัน ด้วยกำลังขยาย 10,000 และ 30,000 เท่า**

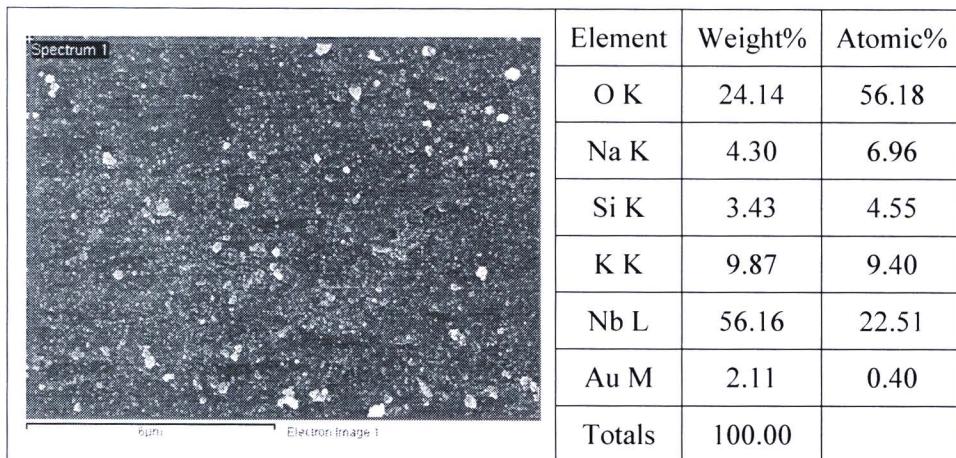


(ก)

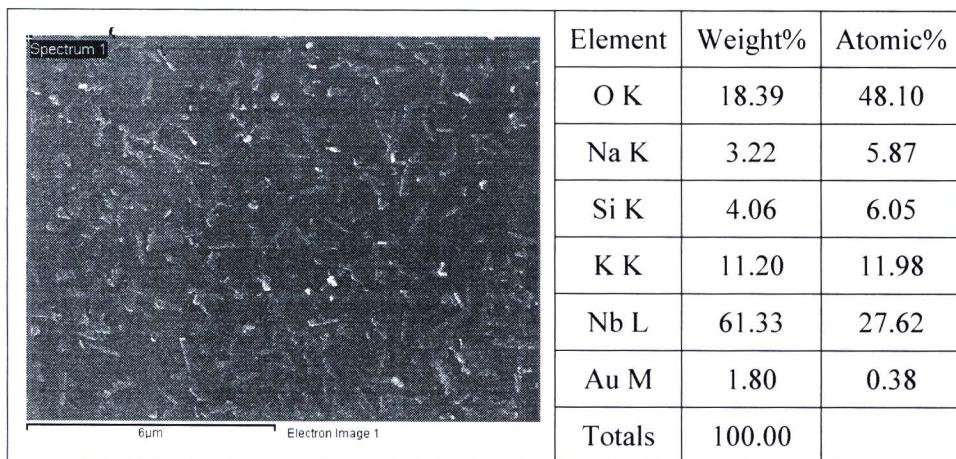


(ก)

**รูปที่ 4.43** แสดงผลการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค EDS ของชิ้นงานแก้วเซรามิกชุด C1 ได้จากสารตั้งต้นบริสุทธิ์และผ่านกระบวนการทางความร้อน (ก) ผ่านความร้อนที่อุณหภูมิ 525 องศาเซลเซียส (ข) ผ่านความร้อนที่อุณหภูมิ 575 องศาเซลเซียส



(ก)



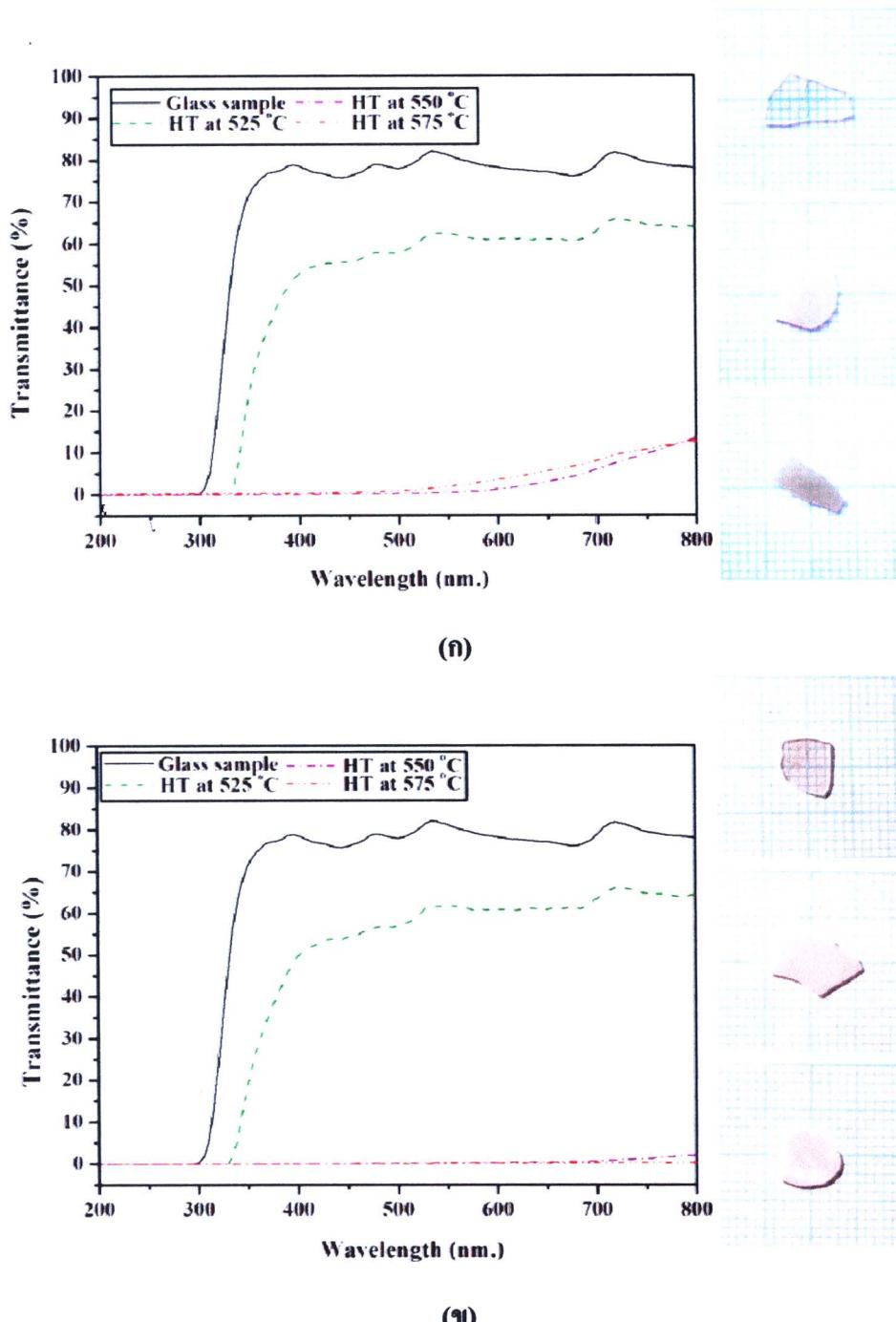
(ข)

**รูปที่ 4.43 (ต่อ)** แสดงผลการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค EDS ของชิ้นงานแก้วเซรามิกชุด C2 ได้จากการตั้งต้นบริสุทธิ์และผ่านกระบวนการทางความร้อน (ก) ผ่านความร้อนที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส (ข) ผ่านความร้อนที่อุณหภูมิ 550 องศาเซลเซียส

#### 4.3.3.6 ผลการตรวจสอบสมบัติเชิงแสงด้วยเครื่องมือ UV-Vis และ Refractometer

ผลที่ได้จากการทดลองหาเปอร์เซ็นต์การส่องผ่าน (% Transmittance) ของชิ้นงานแก้วเซรามิกโพแทสเซียมโซเดียม ในโอเบตที่สารตั้งต้นที่ไม่บริสุทธิ์ และผ่านการหลอมเหลวที่อุณหภูมิ 1300 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 15 นาที โดยผ่านความร้อนเพื่อใช้ในการปัลอกพลีกในแต่ละช่วง อุณหภูมิ เป็นเวลา นาน 4 ชั่วโมง จากรูปที่ 4.44 ทั้งชุด C1 และ C2 จะเห็นว่าชิ้นงานที่ผ่านความร้อน เพื่อปัลอกพลีกที่อุณหภูมิต่ำจะมีลักษณะที่โปร่งใสกว่าที่อุณหภูมิสูง ทำให้มีเปอร์เซ็นต์การส่องผ่าน ของแสงก็จะสูงกว่าชิ้นงานที่ทึบแสง โดยสามารถมีเปอร์เซ็นต์การส่องผ่านคือ 60 เปอร์เซ็นต์ ช่วง ความยาวคลื่นที่แสงสามารถทะลุผ่านคือแสงขาว (visible light, 300 - 800 nm.) ตั้งแต่ 330 นาโนเมตร ส่วนชิ้นงานที่ทึบแสงเกิดขึ้นเมื่ออุณหภูมิในการปัลอกพลีกสูงขึ้น ที่เป็นเช่นนี้สืบเนื่องมาจากการ พลีกภายในชิ้นงานมีขนาดที่ใหญ่ทำให้เกิดการกระเจิงของแสงมากจนการทะลุผ่านของแสงเกิดขึ้น ได้น้อย ดังผลที่ปรากฏจากการวิเคราะห์ด้วย SEM ชิ้นงานที่มีขนาดของผลึกที่เล็กในช่วงนาโนเมตร จะยอมให้แสงผ่านได้โดยการกระเจิงแสงเกิดได้น้อย ผลจึงทำให้เปอร์เซ็นต์การส่องผ่านมี ค่าที่สูงตามไปด้วย สำหรับเปอร์เซ็นต์การส่องผ่านของชิ้นงานที่ทึบแสงนั้น จะมีค่าเพียง 10 เปอร์เซ็นต์ และมีช่วงความยาวคลื่นที่แสงสามารถทะลุผ่านได้ที่ 500 - 600 นาโนเมตรเป็นต้นไป

สำหรับค่าดัชนีการหักเหของแสงในแก้วทั้งสองชุดมีค่าที่ไม่แตกต่างกันมากนัก ในแก้วชุด C1 ที่ผ่านการให้ความร้อนเพื่อปัลอกพลีกที่อุณหภูมิ 525, 550 และ 575 องศาเซลเซียสนั้น มีค่าดัชนี หักเหเท่ากับ 1.655, 1.655 และ 1.64 และในแก้วชุด C2 ที่ผ่านการให้ความร้อนเพื่อปัลอกพลีกที่ อุณหภูมิ 500, 525 และ 550 องศาเซลเซียสนั้น มีค่าดัชนีหักเหเท่ากับ 1.66, 1.66 และ 1.65 ตามลำดับ

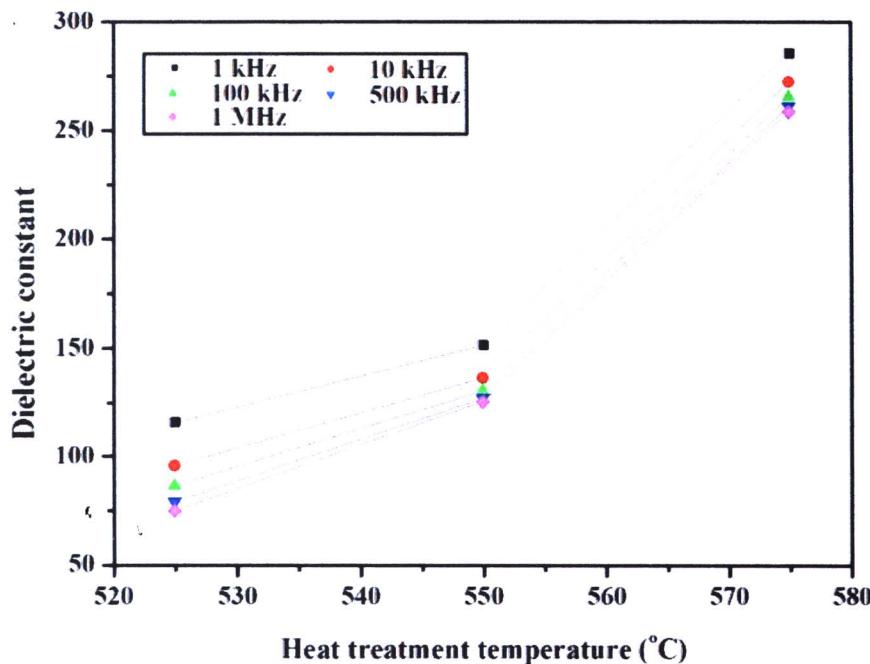


รูปที่ 4.44 แสดงถึงผลของการทดสอบของชิ้นงานแก้วเซรามิกเปรียบเทียบค่าความสามารถในการส่องผ่านที่ได้จากการตั้งค่าที่ไม่บรรลุที่และผ่านกระบวนการทางความร้อน ชุด C1 (ก) คือระบบแก้วที่มีโพแทสเซียมโซเดียม ในโอเบตอร์อยู่ 75 โคลยโนล และชุด C2 (u) คือระบบแก้วที่มีโพแทสเซียมโซเดียม ในโอเบตอร์อยู่ 80 โคลยโนล

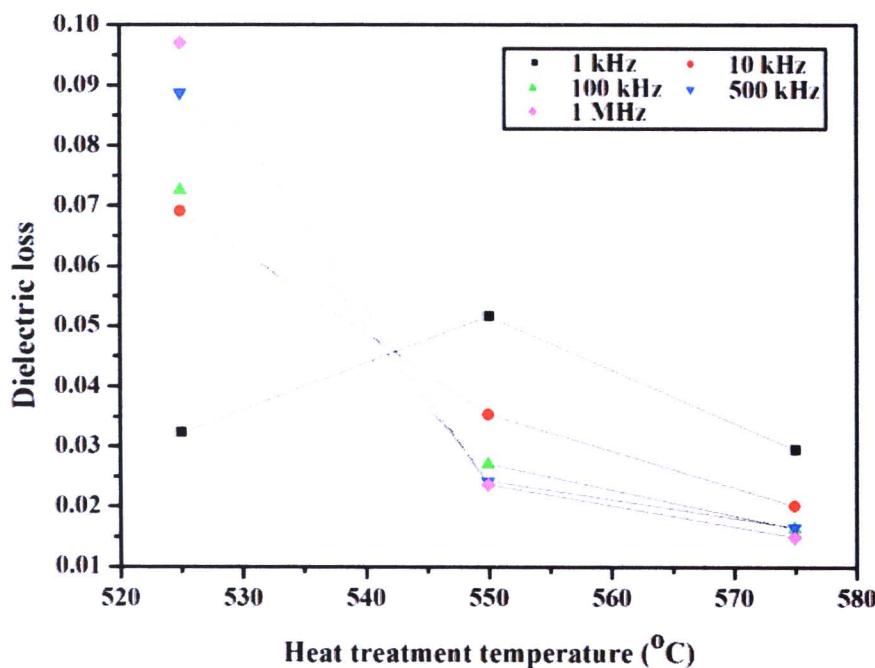
### 4.3.3.7 ผลการตรวจสอบสมบัติทางไฟฟ้า

#### 1. สมบัติไดอิเล็กทริก

ผลการตรวจสอบค่าคงที่ทาง ไดอิเล็กทริก และค่าการสูญเสีย ไดอิเล็กทริก ณ อุณหภูมิห้อง ของชิ้นงานแก้วเซรามิกโพแทสเซียม โซเดียม ในโอบектที่สร้างจากสารตั้งต้นที่ไม่บริสุทธิ์ และผ่าน การหลอมเหลวที่อุณหภูมิ 1300 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 1 ชั่วโมง โดยผ่านความร้อนเพื่อ ใช้ในการปลุกพลีกที่อุณหภูมิ 525, 550 และ 575 องศาเซลเซียส เป็นเวลา นาน 4 ชั่วโมง แสดงให้เห็นดังรูป 4.45 โดยเดือดความถี่ที่ต่างกันมาใช้ในการวิเคราะห์คือ 1, 10, 100, 500 kHz และ 1 MHz ตามลำดับพบว่าค่าคงที่ไดอิเล็กทริกและค่าการสูญเสียทาง ไดอิเล็กทริกจะมีการเปลี่ยนแปลง ตามอุณหภูมิที่ใช้ในการปลุกพลีก ชิ้นงานแก้วเซรามิกมีแนวโน้มของค่า ไดอิเล็กทริกที่เพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้น กลับกันกับค่าการสูญเสียทาง ไดอิเล็กทริกจะมีค่าที่ลดลง โดยยังได้ทำการวัดค่า ไดอิเล็กทริกเทียบกับความถี่ค่า พนว่าค่าทั้งสองจะลดลงตามความถี่ที่เพิ่มขึ้น จากนั้นได้ลองทำการวัดค่าคงที่ทาง ไดอิเล็กทริก และค่าการสูญเสีย ไดอิเล็กทริกเมื่ออุณหภูมิของชิ้นงานเปลี่ยนแปลง ไป ดังจะเห็นในรูป 4.46 จะเห็นได้ว่าในชิ้นงานแก้วเซรามิกโพแทสเซียม โซเดียม ในโอบектที่ปลุกพลีกที่อุณหภูมิที่แตกต่างกันจะมีค่า ไดอิเล็กทริกที่สูงเพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้น โดยค่า ไดอิเล็กทริกจะมีค่าที่สูงที่สุดในชิ้นงานแก้วเซรามิกชุด C2 ที่ปลุกพลีกที่อุณหภูมิ 575 องศาเซลเซียส โดยมีค่าที่สูงถึง 300,000 และแต่ละชุดการทดลองจะมีค่าของค่าการสูญเสียทาง ไดอิเล็กทริก ที่สูงประมาณ 15 - 20

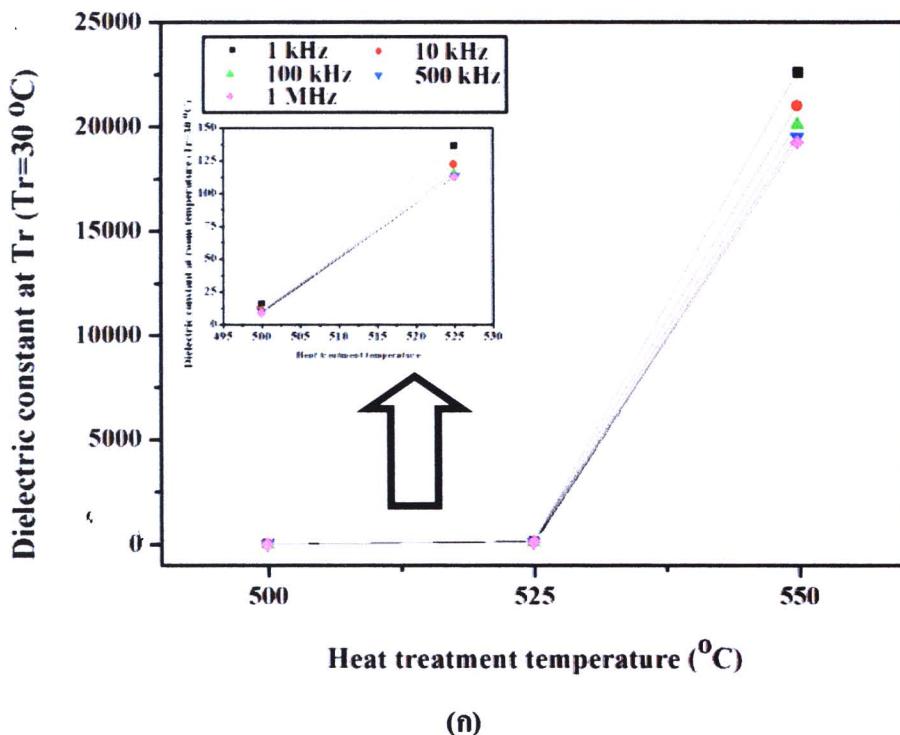


(ก)

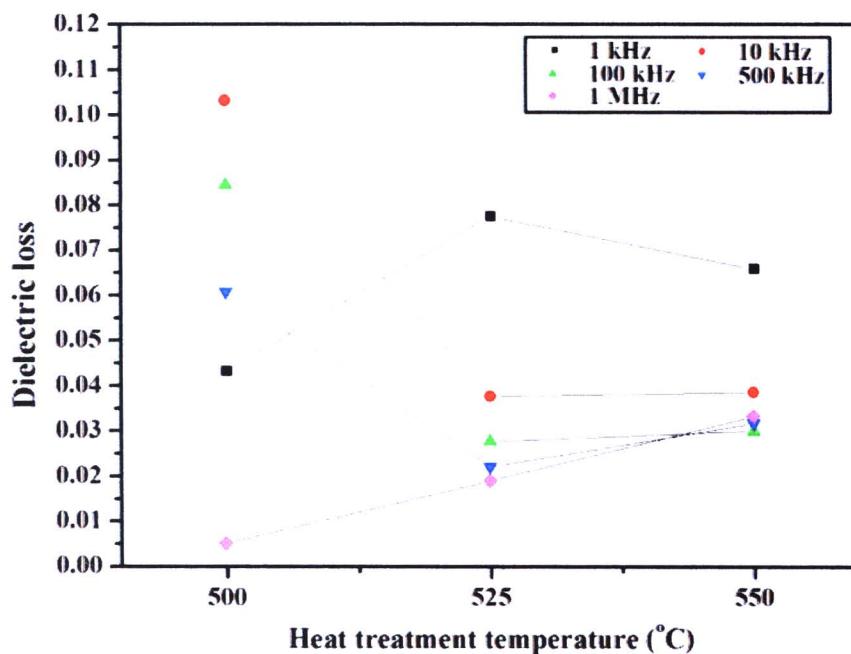


(ข)

รูปที่ 4.45 แสดงค่าคงที่ไดอิเล็กทริก (ก) และค่าการสูญเสียทางไดอิเล็กทริก (ข) ณ อุณหภูมิห้องของแก้วเซรามิกชุด C1 ที่ได้จากการตั้งต้นที่บริสุทธิ์และผ่านกระบวนการทางความร้อน

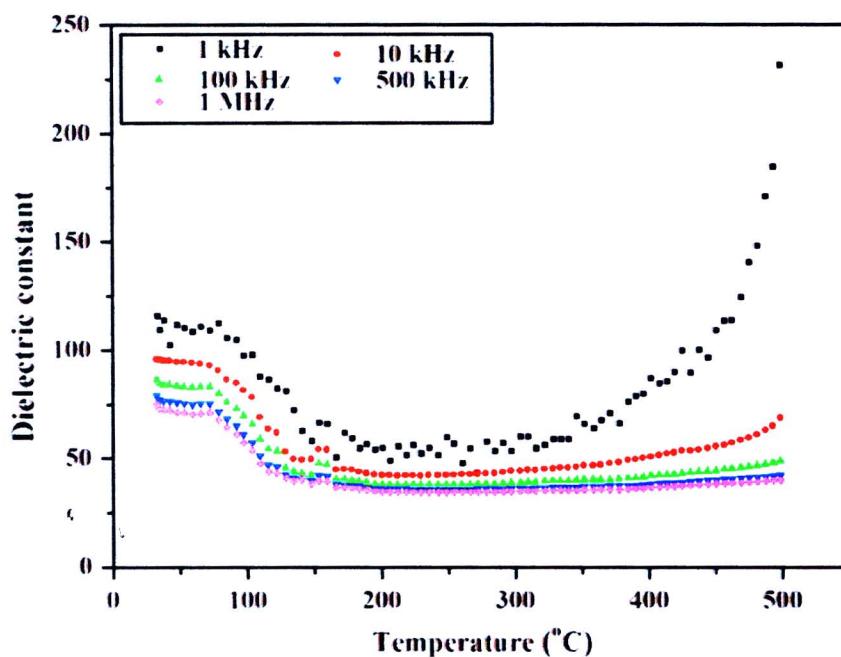


(n)

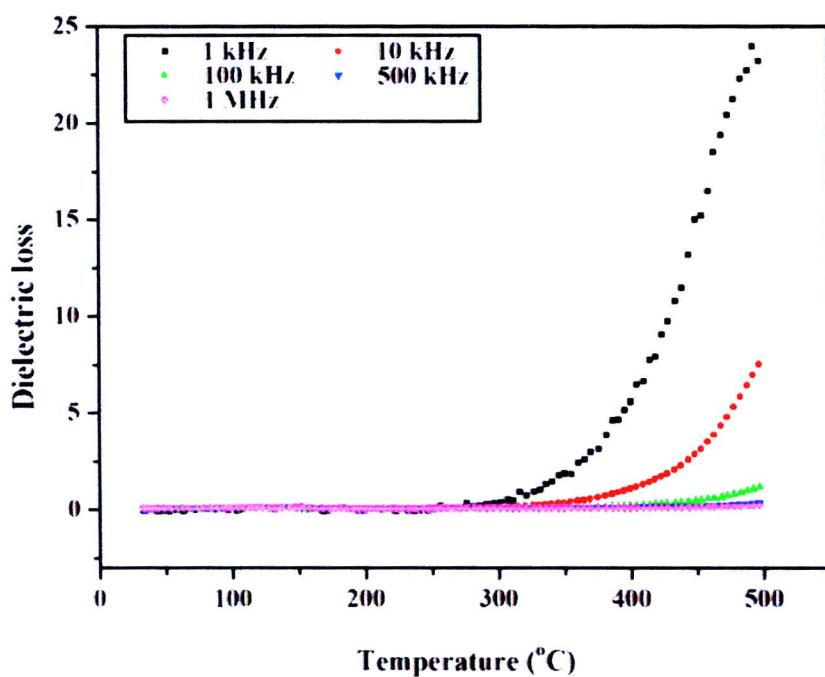


(u)

รูปที่ 4.45 (ต่อ) แสดงค่าคงที่ไดอิเล็กทริก (ก) และค่าการสูญเสียทางไดอิเล็กทริก (ข) ณ อุณหภูมิห้อง ของแก้วเซรามิกชุด C2 ที่ได้จากการตั้งค่าที่บริสุทธิ์และผ่านกระบวนการทางความร้อน

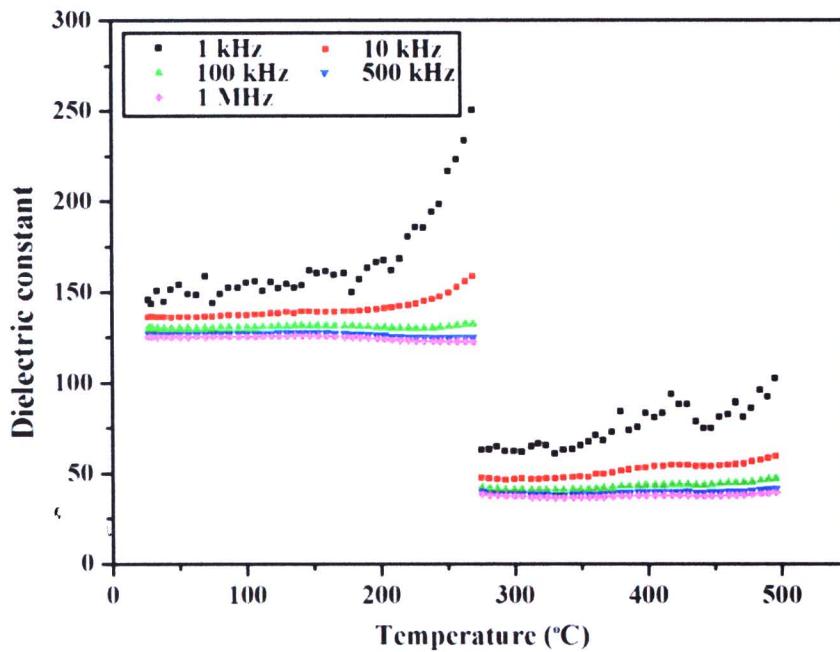


(ก)

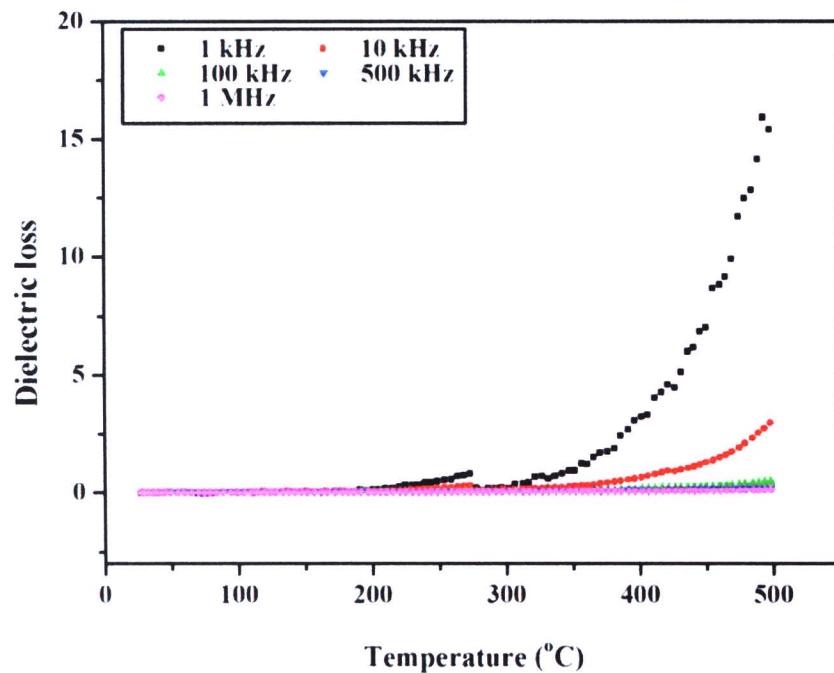


(ข)

รูปที่ 4.46 แสดงค่าคงที่ไดอิเล็กทริก (ก) และค่าการสูญเสียทางไดอิเล็กทริก (ข) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ของแก้วเซรามิกชุด C1 ที่ได้จากการตั้งต้นที่บริสุทธิ์และผ่านกระบวนการทางความร้อนที่อุณหภูมิ 525 องศาเซลเซียส

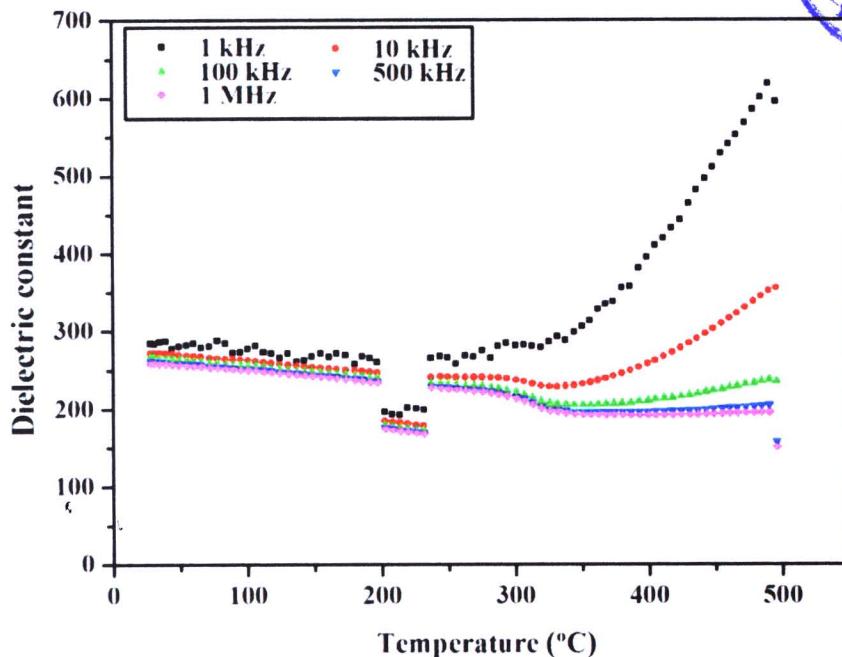


(ก)

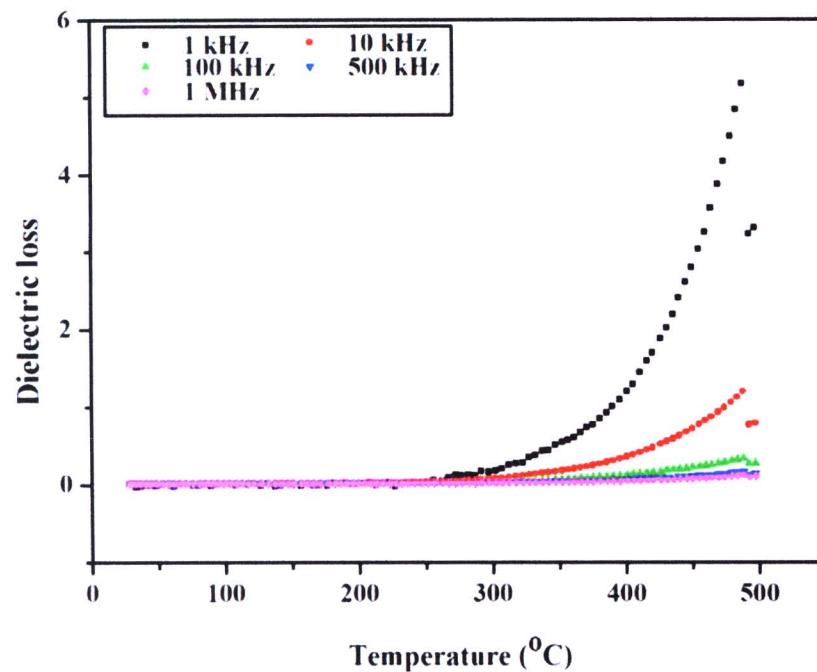


(ข)

รูปที่ 4.46 (ต่อ) แสดงค่าคงที่ไดอิเล็กทริก (ก) และค่าการสูญเสียทางไดอิเล็กทริก (ข) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ของแก้วเซรามิกชุด C1 ที่ได้จากสารตั้งต้นที่บริสุทธิ์และผ่านกระบวนการทางความร้อนที่อุณหภูมิ 550 องศาเซลเซียส

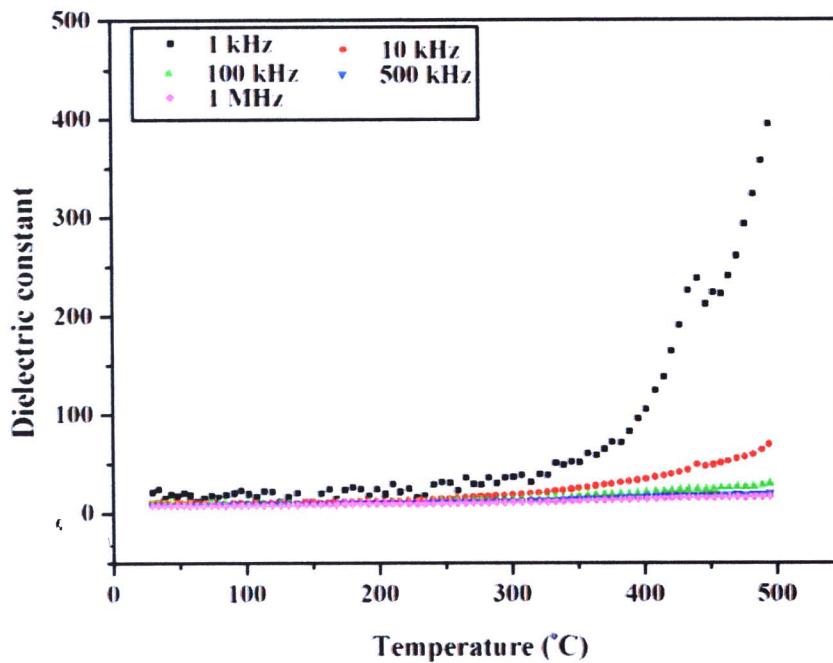


(ก)

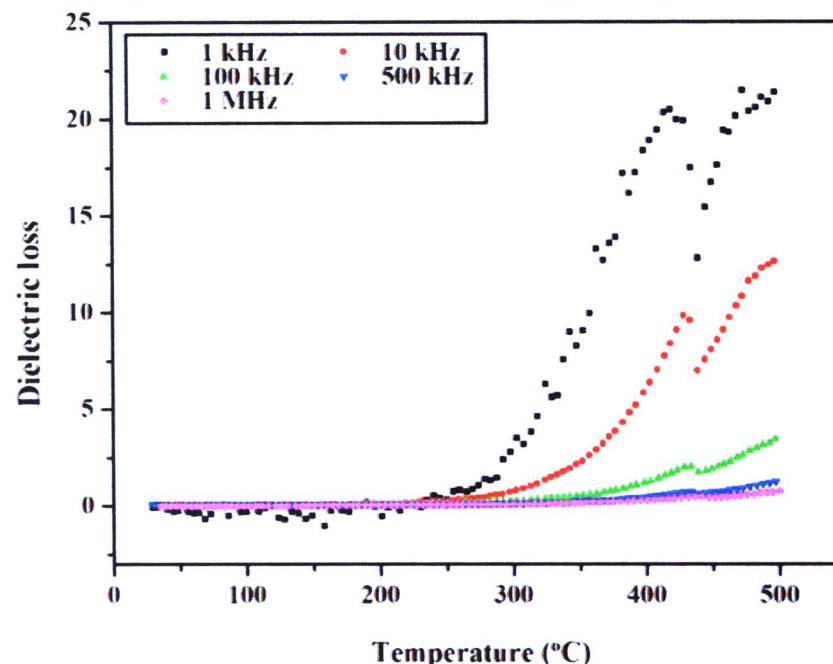


(ก)

รูปที่ 4.46 (ต่อ) แสดงค่าคงที่ไดโอดีคิทริก (ก) และค่าการสูญเสียทางไดโอดีคิทริก (ก) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ของแก้วเซรามิกชุด C1 ที่ได้จากสารตั้งต้นไนเบอริสูทช์และผ่านกระบวนการทางความร้อนที่อุณหภูมิ 575 องศาเซลเซียส

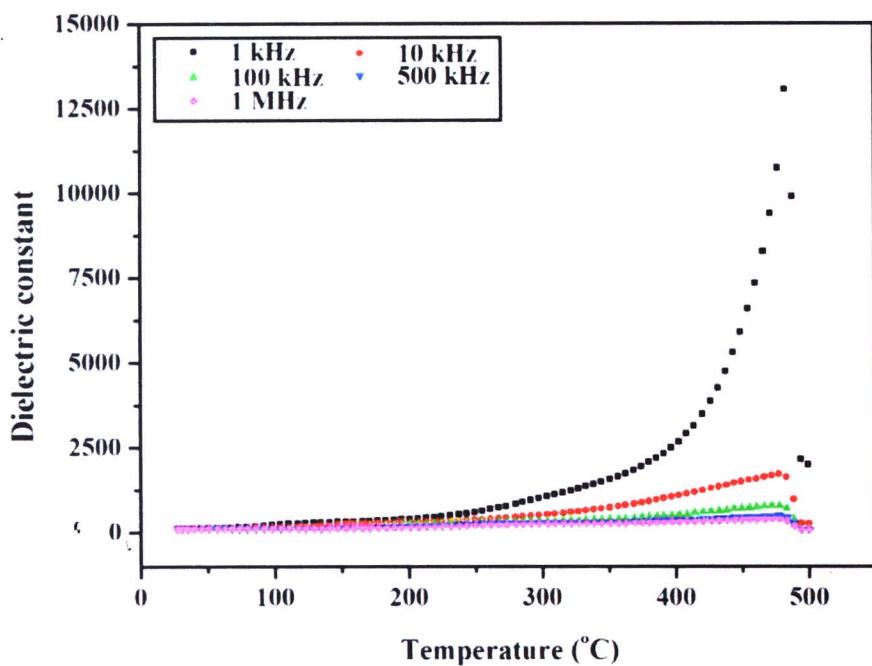


(g)

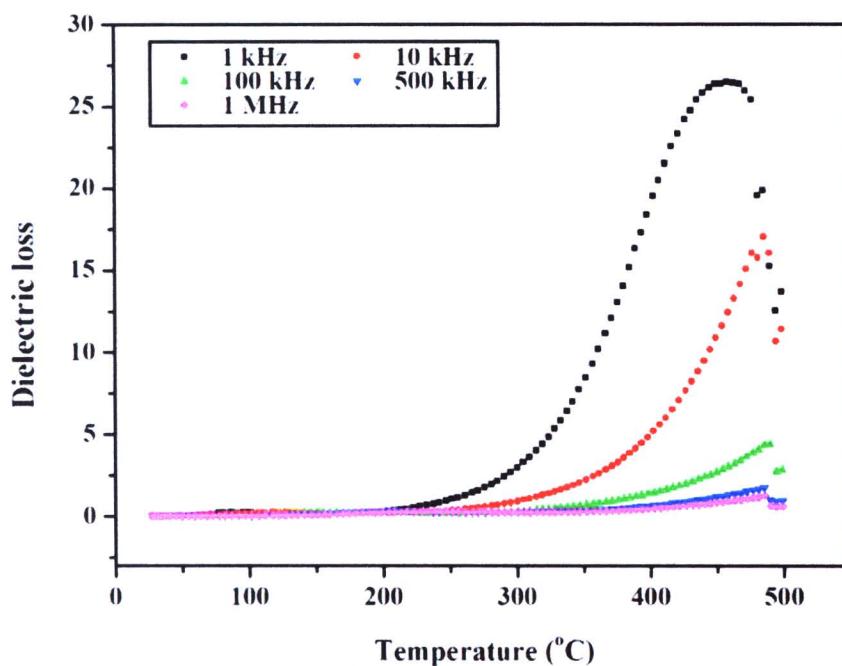


(h)

รูปที่ 4.46 (ต่อ) แสดงค่าคงที่ไดอิเล็กทริก (ก) และค่าการสูญเสียทางไดอิเล็กทริก (ห) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ของแก้วเซรามิกชุด C2 ที่ได้จากการตั้งค่าน้ำ份ที่บริสุทธิ์และผ่านกระบวนการทางความร้อนที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส

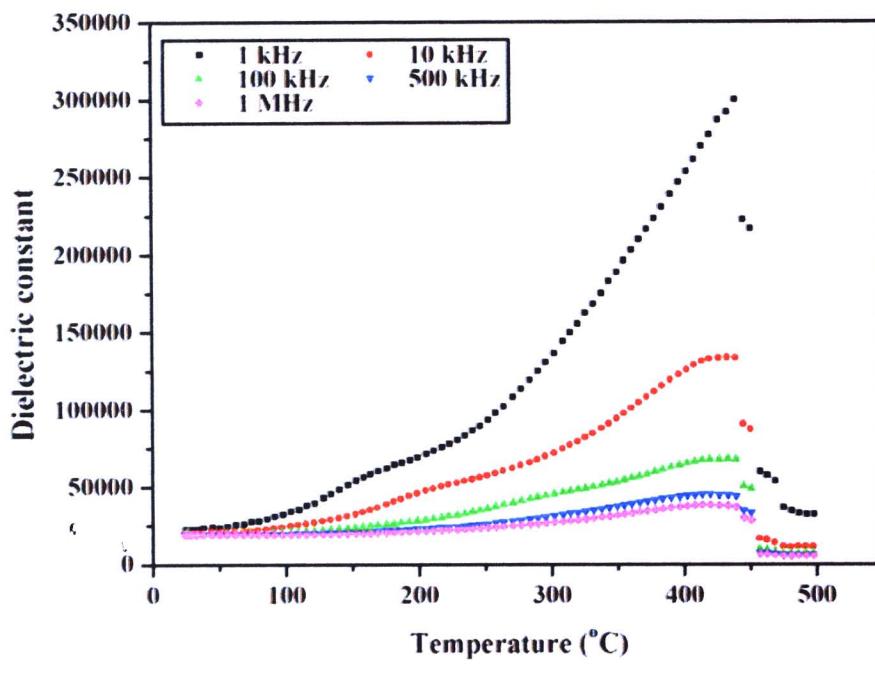


(n)

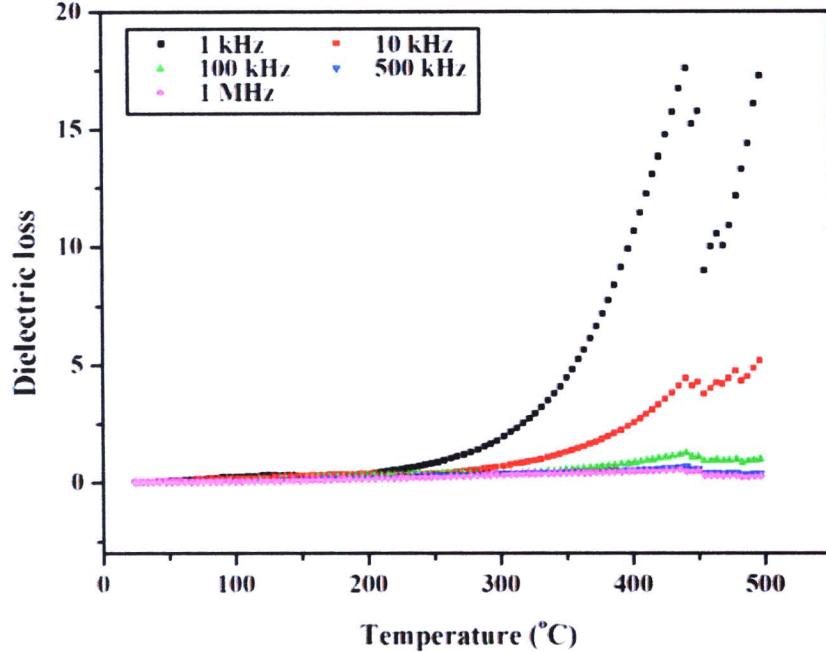


(u)

รูปที่ 4.46 (ต่อ) แสดงค่าคงที่ไดโอลีกทริก (ก) และค่าการสูญเสียทางไดโอลีกทริก (ข) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ของแก้วเซรามิกชุด C2 ที่ได้จากสารตั้งต้นที่บริสุทธิ์และผ่านกระบวนการทางความร้อนที่อุณหภูมิ 525 องศาเซลเซียส



(g)

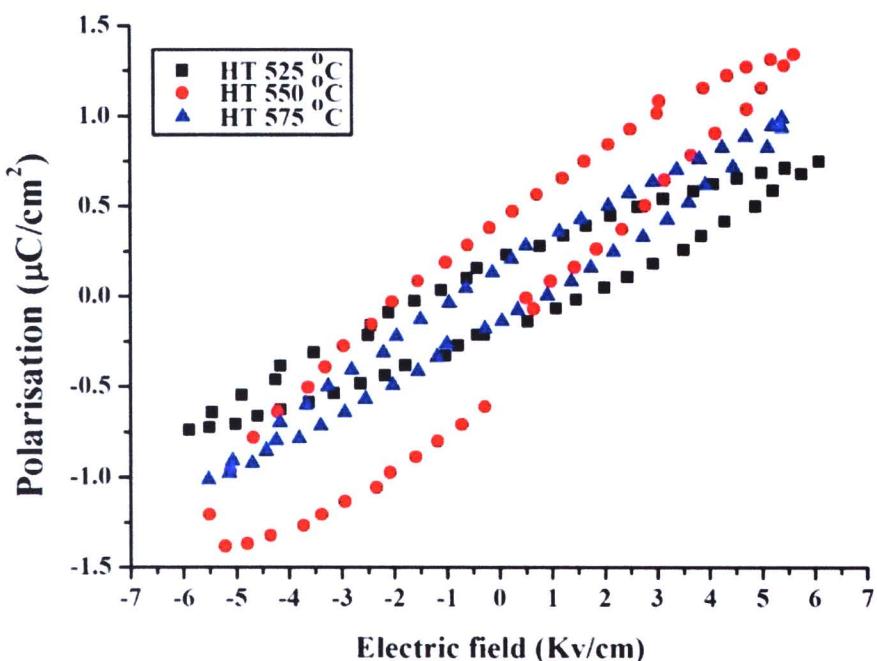


(h)

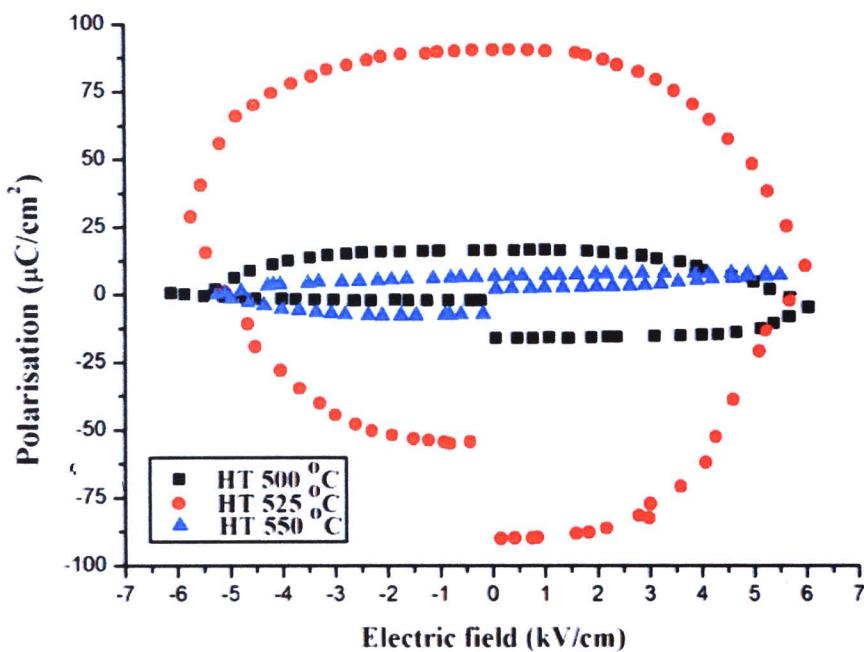
รูปที่ 4.46 (ต่อ) แสดงค่าคงที่ไดอิเล็กทริก (ก) และค่าการสูญเสียทางไดอิเล็กทริก (ข) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ของแก้วเซรามิกชุด C2 ที่ได้จากการตั้งต้นที่บริสุทธิ์และผ่านกระบวนการทางความร้อนที่อุณหภูมิ 550 องศาเซลเซียส

## 2. สมบัติเฟร์โรอิเล็กทริก

ผลการตรวจสอบสมบัติเฟร์โรอิเล็กทริก ณ อุณหภูมิห้อง ของชิ้นงานแก้วเซรามิกโพแทสเซียมโซเดียม ในโอบเดที่สร้างจากสารตั้งต้นที่บริสุทธิ์ ซึ่งผ่านการหลอมเหลวที่อุณหภูมิ 1300 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 15 นาที และผ่านความร้อนเพื่อใช้ในการปัจกพลีกที่อุณหภูมิต่างๆ กันเป็นเวลานาน 4 ชั่วโมง โดยให้สนามไฟฟ้าเข้าไป 300 กิโลโวลต์ต่อเซนติเมตร ( $\text{kV/cm}$ ) เป็นระยะเวลา 1000 วินาที แสดงให้เห็นดังรูปที่ 4.47 จากรูปวงชีสเทอร์ริซีส (hyteresis loop) ของแก้วเซรามิกที่ถูกทดสอบพบว่าค่าโพลาไรเรชันที่ได้มีค่าที่ไม่สูง ในชุด C1 มีค่าโพลาไรเรชันสูงสุดในชุดที่ให้อุณหภูมิปัจกพลีกเข้าไปเท่ากับ 550 องศาเซลเซียส โดยมีค่าเพียง  $1.3 \mu\text{C}/\text{cm}^2$  ในชุด C2 มีค่าโพลาไรเรชันสูงสุดในชุดที่ให้อุณหภูมิปัจกพลีกเข้าไปเท่ากับ 525 องศาเซลเซียส จำกัดหมายความว่าชีสเทอร์ริซีสแสดงให้เห็นว่าแก้วชุดนี้ยังคงมีค่าการสูญเสีย (lossy capacitor) ที่สูงและไม่พนความเป็นเฟร์โรอิเล็กทริกที่เด่นชัด



รูปที่ 4.47 แสดงวงชีสเทอร์ริซีสของแก้วเซรามิกที่สร้างจากสารตั้งต้นที่บริสุทธิ์ชุด C1 และผ่านความร้อนเพื่อใช้ในการปัจกพลีกที่อุณหภูมิต่างๆ เป็นเวลานาน 4 ชั่วโมง



รูปที่ 4.47 (ต่อ) แสดงวงวีสเทอร์ริสของแก้วเซรามิกที่สร้างจากสารตั้งต้นที่บริสุทธิ์ชุด C2 และผ่านความร้อนเพื่อใช้ในการปั๊กผลึกที่อุณหภูมิต่างๆ เป็นเวลานาน 4 ชั่วโมง